

การทำโมดูเลชันของความเข้มแสงบนระนาบภาพสำหรับการสร้างเซนเซอร์ ระดับไมครอน : การตรวจวัดคลื่นอัลตราโซนิค

โดย

ชญาณิศา สุขเกษม



วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

> บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2564



APPLICATION OF IMAGE PLANE INTENSITY MODULATION FOR

MICROSCOPIC SCALE SENSOR FABRICATION:

AN OPTICAL BASED ULTRASOIC DETECTION



CHAYANISA SUKKASEM



A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT

OF THE REQUIREMENTS FOR

THE DEGREE OF MASTER OF ENGINEERING IN BIOMEDICAL ENGINEERING

COLLEGE OF BIOMEDICAL ENGINEERING

GRADUATE SCHOOL, RANGSIT UNIVERSITY ACADEMIC YEAR 2021

วิทยานิพนธ์เรื่อง

การทำโมดูเลชันของความเข้มแสงบนระนาบภาพสำหรับการสร้างเซนเซอร์ระดับไมครอน : การตรวจวัดคลื่นอัลตราโซนิค

คร.พิชญ์สิณี สุวรรณแพทย์ กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

บัณฑิตวิทยาลัยรับรองแล้ว

(ผศ. ร.ต. หญิง ดร.วรรณี ศุขสาตร) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 21 กรกฎาคม 2564 Thesis entitled

APPLICATION OF IMAGE PLANE INTENSITY MODULATION FOR MICROSCOPIC SCALE SENSOR FABRICATION: AN OPTICAL BASED ULTRASONIC DETECTION

by

CHAYANISA SUKKASEM

was submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Engineering in Biomedical Engineering

> Rangsit University Academic Year 2021

Supanit Porntheeraphat, Ph.D. Examination Committee Chairperson

Assoc. Prof. Manus Sangworasil, Ph.D. Member Assoc. Prof. Nuntachai Thongpance Member

Assoc. Prof. Suejit Pechprasarn, Ph.D. Member and Advisor

> Phitsini Suvarnaphaet, Ph.D. Member and Co-Advisor

Approved by Graduate School

(Asst. Prof. Plt. Off. Vannee Sooksatra, D.Eng.)

Dean of Graduate School

July 21, 2021

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้เป็นอย่างดีเนื่องมาจากได้รับความอนุเคราะห์จาก รศ. คร.สื่อ จิตต์ เพีชร์ประสาร อาจารย์ที่ปรึกษา และ คร. พิชญ์สิฉี สุวรรณแพทย์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่ให้ ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ และคอยให้คำปรึกษาแนะนำเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และขอขอบคุณศูนย์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) หน่วยสังเคราะห์ภาพระดับนาโน (The Center of Nanoimaging) และศูนย์นาโนโฟโตนิกส์ (Nanophononics Research Centre) มหาวิทยาลัยเซินเจิ้น ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยเป็นอย่าง สูง รวมถึงขอขอบคุณสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) ที่ให้ทุนสนับสนุนระหว่างการทำวิจัย



6105647	:	ชญาณิศา สุขเกษม
ชื่อวิทยานิพนธ์	:	การทำโมดูเลชันของความเข้มแสงบนระนาบภาพสำหรับการสร้าง
		เซนเซอร์ระดับไมครอน: การตรวจวัดคลื่นอัลตราโซนิค
หลักสูตร	:	วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
อาจารย์ที่ปรึกษา	:	รศ. คร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	:	คร.พิชญ์สิณี สุวรรณแพทย์

บทคัดย่อ

งานวิจัยหัวข้อเรื่อง การทำโมดูเลชันของความเข้มแสงบนระนาบภาพสำหรับการสร้าง เซนเซอร์ระดับไมครอนเพื่อใช้สำหรับการตรวจวัคคลื่นอัลตราโซนิค มีวัตถุประสงค์ในการ ออกแบบและพัฒนาระบบการฉายภาพในกระบวนการ โฟโตลิโทกราฟีโดยการใช้อุปกรณ์กระจก ู่ ขนาดไมครอนแบบดิจิทัลและใช้วิธีการทำโมดเลชั้นของความเข้มแสงบนระนาบภาพในการสร้าง ้ถวคลายต้นแบบเพื่อสร้างแม่พิมพ์เกรตติง ที่มีขนาดคาบและสัดส่วนของเกรตติงจากผลการศึกษา ทางทฤษฎีของการออกแบบลักษณะของเกรตติงบนพี่ดีเอ็มเอส ในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัด คลื่นอัลตราซาวค์ที่มีความถี่ 1 MHz จากผลการจำลองทางทฤษฎีประกอบด้วย การจำลองผลการ เปลี่ยนแปลงความหนาของพีดีเอ็มเอสเมื่อถูกกดด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ และการจำลองผลเชิงแสงของ การตรวจวัคกลื่นอัลตราซาวค์ที่มีตัวรับรู้เป็นพี่ดีเอ็มเอส เมื่อนำไปวิเคราะห์และเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพกับพีดีเอ็มเอสแบบเรียบ พบว่าพีดีเอ็มเอสแบบเกรตติ้งมีความไวในการตอบสนอง เท่ากับ 3.46 × 10⁻⁷ Pa⁻¹ ประสิทธิภาพสูงกว่าพี<mark>่คีเ</mark>อ็มเอสแบบเรียบ 4.76 เท่า มีค่าความเป็นเซนเซอร์ที่ ้ดี 1.10 × 10⁻⁶ Pa^{-1} ดีกว่าแบบเรียบ 1.17 เท่า และช่วงในการตอบสนองกว้างกว่า 3.55 เท่า เมื่อขึ้นรูป แม่พิมพ์เกรตติงบนแผ่นรองรับที่เคลือบสารไวแสงแบบฟิล์มโดยใช้การฉายแสงด้วยระบบการทำโม ดูเลชั่นของความเข้มแสงบนระนาบภาพ พบว่า มีความคลาดเคลื่อนของการสร้างเกรตติงมีรูปร่างและ ้งนาดความถูกต้องตามต้นแบบ เท่ากับ 5.42% และมีความคลาดเคลื่อนของลวดลายที่เกิดจากการเอียง ของระบบแสงเท่ากับ 3.20% และระบบสามารถทำซ้ำในการสร้างลวดลายได้ นอกจากการสร้าง เกรตติงแล้วระบบฉายภาพสามารถนำไปออกแบบและสร้างลวดลายอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องสร้างมาส์ก

แสง ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาและงบประมาณในการสร้างลวดลายที่มีขนาดระดับไมครอนได้ (วิทยานิพนธ์มีจำนวนทั้งสิ้น 117 หน้า)

คำสำคัญ: โฟโตลิโทกราฟีแบบไม่ใช้มาส์กแสง, การตรวจวัคคลื่นอัลตราซาวค์, การสร้างลวคลาย

ระดับใมครอน	
ลายมือชื่อนักศึกษา	

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

6105647	:	Chayanisa Sukkasem
Thesis Title	:	Application of Image Plane Intensity Modulation for Microscopic
		Scale Sensor Fabrication: An Optical based Ultrasonic Detection
Program	:	Master of Engineering in Biomedical Engineering
Thesis Advisor	:	Assoc. Prof. Suejit Pechprasarn, Ph.D.
Thesis Co-Advisor	:	Phitsini Suvarnaphaet, Ph.D.

Abstract

The research entitled Application of Image Plane Intensity Modulation for Microscopic Scale Sensor Fabrication: An Optical based Ultrasound Detection aims to design and implement the image plane intensity modulation system for microfabrication in photolithography process using a digital micromirror device (DMD) to project the master pattern of grating structure. The grating structure focusing on grating period and grating fill factor has been studied the theoretical framework to enhance the performance of optical ultrasonic detection using polydimethylsiloxane (PDMS) material. Herein, the simulation of the PDMS thickness changes under the ultrasound compression at 1-MHz frequency was reported and the optical ultrasonic detection that used the PDMS grating as a receptor was analyzed. The results showed that the PDMS grating provided the sensitivity of 3.46×10^{-7} Pa⁻¹ to detect ultrasound which was greater than conventional thin film by 4.76 times. The figure of merit was $1.10 \times 10^{-6} \text{ Pa}^{-1}$ enhanced by 1.17 times and the detectable range was wider by 3.55 times. In photolithography process, the grating patterns were fabricated in an application of image plane intensity modulation system using the negative dry film photoresist. The fabricated gratings were controlled as the theoretical design having 5.42% of error in features 3.20% of error in optical aberration. This system has been promised excellent repeatable in microfabrication without photomask and provided time-saving and cost-effective in the photolithography process.

(Total 117 pages)

Keywords: Maskless photolithography, Ultrasound detection, Microfabrication

Student's Signature	Thesis Advisor's Signature
	Thesis Co-Advisor's Signature

สารบัญ

		หน้า
กิตติกรรมป	ระกาศ	ก
บทคัดย่อภา	ษาไทย	ข
บทคัดย่อภา	ษาอังกฤษ	ค
สารบัญ		3
สารบัญตาร	19	ช
สารบัญรูป		պ
บทที่ 1	บทนำ	1
	1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
	1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย	3
	1.3 คำถามการวิจัย / สมมติฐานการวิจัย	4
	1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย	4
	1.5 นิยามศัพท์	6
- 4		
บทที่ 2	ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง / ทฤษฏิทิเกี่ยวข้อง	8
	2.1 โฟโตลโทกราฟ	8
	2.2 ระเบียบวริไฟในตเอล์เมนต Rongs	23
	2.3 ทฤษฎีเชิงแสง	26
	2.4 การตรวจวัดคลินอัลตราซาวด์	33
	2.5 พอลิไคเมทิลซิโลเซน	40
4		
บทที่ 3	ระเบียบวิธีการวิจัย	43
	3.1 ตารางแผนการดำเนินงาน	43
	3.2 การออกแบบและจัคเรียงทางเดินแสงของระบบการทำโมดูเลชั่นของ	44
	ความเข้มแสงบนระนาบภาพสำหรับการฉายภาพในกระบวนการโฟโตลิ	
	โทกราฟี	

٩

สารบัญ (ต่อ)

			หน้า
	3.3 การ	จำลองผลเชิงทฤษฎีของการตรวจวัดคลื่นอัลตราซาวค์ที่ใช้ตัวรับรู้	50
	เป็นพิดีเ	อ็มเอสแบบเรียบและพีคีเอ็มเอสแบบเกรตติง	
	3.4 การ	ขึ้นรูปลวคลายด้วยกระบวนการโฟโตลิโทกราฟี	54
	3.5 การ	วิเคราะห์กุณภาพลวคลายเกรตติงที่ขึ้นรูปด้วยกระบวนการ โฟโต	56
	ลิโทกร	พี	
บทที่ 4	ผลการวิ	วิจัย	59
	4.1 ៧តា	าารออกแบบแล <mark>ะ จัดเร</mark> ียงทางเดินแสงของระบบการทำโมคูเลชัน	59
	ของคว	ามเข้มแสงบนระนาบภาพสำหรับการฉายภาพในกระบวนการ	
	โฟโตล <i>ิ</i>	โทกราฟี	
	4.2 Mất	าารจำลองผลเชิงทฤษฎีของการตรวจวัคกลื่นอัลตราซาวค์ค้วยการ	61
	ใช้ตัวรับ	มรู้พิดีเอ็มเอสแบบเรียบและพิดีเอ็มเอสแบบเกรตติง	
	4.3 ៧តា	าารเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการตรวจวัดคลื่นอัลตราซาวด์	70
	โดยใช้ต่	กัวรับรู้เป็นพี่ดีเอ็มเอสแบบเรียบและพี่ดีเอ็มเอสแบบเกรตติง	
	4.4 NG	การวิเ <mark>คราะห์กุณภาพลวคลายเกรตติงที่ขึ้นรูปด้วยกระบวนการ</mark>	73
	โฟโตล <u>ิ</u>	โทกราฟี 	
		E Paris and sit	
บทที่ 5	สรุปผล	และข้อเสนอแนะ หลุด หณาร	76
	5.1 สรุา	ไผลการวิจัย	76
	5.2 ข้อเ	สนอแนะ	77
บรรณานุก	รม		78
ภาคผนวก			88
ภาค	ผนวก ก	สิทธิบัตร กล้องจุลทรรศน์สำหรับการฉายภาพในระบบ	88
		ต้นแบบโฟโตลิโทกราฟีแบบไม่ใช้มาสก์แสงโดยอาศัยอุปกรณ์	
		กระจกไมครอนคิจิทัลเพื่อสร้างถวคถายในระคับไมครอน	

สารบัญ (ต่อ)

		หน้า
ภาคผนวก ข	สิทธิบัตร อุปกรณ์แสงสาหรับตรวจวัคคลื่นเสียงความถี่สูงค้วย	104
	โครงสร้างเกรตติงระดับไมครอนบนวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นโดย	
	อาศัยกลื่นเสียงที่ผิวและการแทรกสอดแบบเฟอร์บี-พาร์ โรท์	
ประวัติผู้วิจัย		117
ประวัติผู้วิจัย	อาศัยกลิ่นเสียงที่ผิวและการแทรกสอดแบบเฟอร์บี-พาร์ โรท์	1



สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่		
2.1	แสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติทั่วไปของสารไวแสงชนิดบวกและ	20
	สารไวแสงชนิดลบ	
3.1	แผนการดำเนินงาน	43
3.2	แสดงคุณสมบัติของอุปกรณ์กระจกขนาดใมครอนแบบดิจิทัล	46
3.3	แสดงคุณสมบัติเลนส์ใกล้วัตถุในระบบการทำโมดูเลชันของแสงบน	47
	ระนาบภาพ	
3.4	แสดงคุณสมบัติและลักษณะของกล้องคืเอสแอลอาร์ ยี่ห้อ Canon รุ่น	48
	EOS 50D	
3.5	แสดงพารามิเตอร์ที่ใช้การจำลองผลเชิงทฤษฎี	49
3.6	แสดงคุณสม <mark>บัติของสาร</mark> ไวแสงชนิคฟิล์ม รุ่น ETERTEC HT-115T DRY	54
	FILM PHOTORESIST	
4.1	แสดงขนาด <mark>ลวดลายที่ขึ้น</mark> รูปด้วยกระบวนการโฟโตลิโทกราฟีและฉาย	60
	แสงที่เวลาต่าง ๆ	
4.2	แสดงการเปรียบเท <mark>ี</mark> ยบกวามกว้าง กวามยาวและระยะช่องของลวดลาย	74
	เกรตติง	
4.3	แสดงความกลาดเกลื่อนของลวดลายที่เกิดจากการเอียงของระบบแสง รางสิ <i>ด</i> Rong Rong Rong Rong Rong Rong Rong Rong	75

สารบัญรูป

รูปที่		
1.1	แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย	5
2.1	แสดงลักษณะและส่วนประกอบของระบบโฟโตลิโทกราฟี	9
2.2	แสดงลักษณะของระบบโฟโตลิโทกราฟีรูปแบบต่าง ๆ	11
2.3	แสดงลักษณะการทำงานของระบ <mark>บส</mark> เต็ปและฉายซ้ำและระบบสเต็ปแ ละ สแอน	12
2.4	แสดงการเปรียบเทียบแสงที่ฉายภาพด้วยมาส์กแสงแบบปกติและมาส์ก แสงที่มีชั้นช่วยเลื่อนเฟสของแสง	14
2.5	แสดงรูปร่างของลำแสงที่ฉายในระบบโฟโตลิโทกราฟีแบบลำแสงปกติ ลำแสงที่มีลักษณะเป็นวงแหวนและลำแสงที่มีลักษณะวงกลมสี่วง	15
2.6	แสดงการเปรียบเทียบผลการฉายแสงของลำแสงปกติและลำแสงที่ถูก ดัดแปลงรูปร่างในระบบโฟโตลิโทกราฟี	15
2.7	แสดงการทำงานของอุปกรณ์กระจกขนาดไมครอนแบบดิจิทัลในโหมด เปิดและปี	17
2.8	เบดและบด แสดงการการบิดของผลึกเหลวเพื่อควบคุมทิศทางของแสงโพลาไรซ์เชิง เส้น	18
2.9	แสดงลักษณะของสารไวแสงชนิดบวกและสารไวแสงชนิดลบเมื่อผ่าน การฉายแสงและล้างด้วยน้ำยาดีเวลลอปเปอร์	19
2.10	แสดงอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดคอเรสเตอรอลและบริเวณที่เกิดปฏิกิริยา ระหว่างคอเลสเตอรอลและเอมไซม์ที่ใช้ตรวจวัด	22
2.11	แสดงการสร้างเมชบน โครงสร้างที่ต้องการศึกษา	23
2.12	แสดงการเดินทางของแสงผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางในกรณีที่แสงมี	26
	โพลาไรซ์แบบ TE และแสงมีโพลาไรซ์แบบ TM	
2.13	แสดงการตกกระทบของแสงถงบนเกรตติงและการเลี้ยวเบนของแสง	29
2.14	แสดงการตกกระทบของแสงบนวัสดุที่มีโครงสร้างเกรตติง	30
2.15	แสดงการประยุกต์ใช้งานคลื่นอัลตราซาวด์ที่กวามถี่ต่าง ๆ	33

หน้า

สารบัญรูป (ต่อ)

_		หน้า
รูปที่		
2.16	แสดงภาพถ่ายตัดขวางของหลอดเลือดแดงเอออร์ตาและการโฟกัส	34
	คลื่นอัลตราซาวค์บนเนื้อเยื่ออันตราย	
2.17	แสดงการถ่ายภาพด้วยเทกนิกการใช้กลื่นโฟโตอะกูสติก	35
2.18	แสดงการเปลี่ยนแปลงของประจุ ไฟฟ้าเมื่อวัสคุเพียโซอิเล็กทริก ถูก ยึด	36
	และถูกกด	
2.19	แสดงลักษณะการตรวจวัดคลื่นอัลตราซาวด์ด้วยระบบที่อาศัยหลักการ	38
	การแทรกสอคของแสงช <mark>นิดไมเคลสันแล</mark> ะการแทรกสอคแบบฟาบร ี -	
	เปโรต์ประเภทฟิล์มพอลิเมอร์	
2.20	แสดงการตรวจคลื่นอัลตราซาวค์ค้วยไฟเบอร์ออปติก	39
2.21	แสดงลักษณ <mark>ะของว</mark> งแหวนสั่นพ้อง	39
2.22	แสดงลัก <mark>ษณะการตรว</mark> จวัดกลื่นอัลตราซาว <mark>ด์ด้วยระบบที่</mark> ใช้หลักการ	40
	สะท้อนของเฟรสเนลและระบบเซนเซอร์ที่ใช้เทคนิคพลาสมอนบน	
	พื้นผิว	
2.23	แสดงโครงสร้าง <mark>ทางเกมีของพีดีเอ็มเอส</mark>	41
3.1	แสดงลักษณะและสเปก <mark>ตรัมของหล</mark> อคไฟยูวีชนิคแอลอีดี	45
3.2	แสดงระบบส่องสว่างแบบโคเลอร์	46
3.3	แสดงลักษณะของอุปกรณ์กระจิกานาดใมครอนแบบดิจิทัล	46
3.4	แสดงการออกแบบระบบการทำโมดูเลชั่นของความเข้มแสงบนระน าบ	48
	ภาพสำหรับการฉายภาพในกระบวนการโฟโตลิโทกราฟี	
3.5	แสดงภาพโครงสร้างเกรตติงบนอุปกรณ์ไอแพดและภาพฉายโครงสร้าง	49
	เกรตติงบนอุปกรณ์กระจกขนาดใมครอนแบบดิจิทัล	
3.6	แสดงโครงสร้างการจำลองผลการกดของคลื่นอัลตราซาวด์	50
3.7	แสดงโครงสร้างการจำลองผลค่าความสะท้อนของแสง	51
3.8	แสดงลักษณะการวัดขนาดลวดลายเพื่อนำไปกำนวณความกลาดเคลื่อน	58
	ของลวคลายเนื่องจากการเอียงของระบบแสง	

สารบัญรูป (ต่อ)

_		หน้า
รูปที่		
4.1	แสดงผลการจัคเรียงทางเดินแสงระบบการทำโมดูเลชั้นของความเข้ม	59
	แสงบนระนาบภาพ	
4.2	แสดงจากการฉายภาพเส้นตรงที่มีขนาด 60 µm ลงบนสารไวแสงแบบ	60
	ฟิล์มชนิคลบ และลวคลายที่ขึ้นรูป ใช้เวลาฉายแสงที่ 2 นาที และ	
	8 นาที	
4.3	แสดงการสะท้อนและการส่องผ่านของแสงเมื่อมุมตกกระทบน้อยกว่ามุม	61
	วิกฤต มุมตกกระทบเท่ากับมุมวิกฤต และมุมตกกระทบมากกว่ามุมวิกฤต	
4.4	แสดงการสะท้อนและการส่องผ่านของแสงในระบบตรวจวัดอัลตรา	62
	ซาวค์ที่พีคีเอ็มเอสแบบเรียบเป็นตัวรับรู้ ที่มุมตกกระทบบนรอยต่อทั้ง	
	สองมีค่าน้อยกว่ามุมวิกฤต มุมตกกระทบบนรอยต่อพีดีเอ็มเอสและน้ำมี	
	ค่ามากกว่ามุมวิกฤต และมุมตกกระทบบนร <mark>อยต่อแก้วและ</mark> พี่ดีเอ็มเอสมี	
	ค่ามากกว่ามุมวิกฤต	
4.5	แสดงการสะท้อน การส่องผ่านของแสงและการเลี้ยวเบนของแสงเมื่อตก	63
	กระทบถึงบนระบบตรวจวัดอัลตราซาวด์ที่พีดีเอ็มเอสแบบเกรตติงเป็น	
	ตัวรับรู้ที่มุมตกกระทบน้อยกว่ามุมวิกฤต	
4.6	ผลค่าความสะท้อนของแสงของพี่ดีเอ็มเอสแบบเกรตติงที่มีความหนา 35	64
	μm ที่มีขนาดกาบอยู่ในช่วง 0 ถึง 300 μm และมีก่าสัดส่วนของร่องตั้งแต่	
	0 ถึง 1 ที่มุมตกกระทบเท่ากับ 1.332 ที่ลำดับการเลี้ยวเบนที่ -1 0 และ 1	
4.7	แสดงค่าความสะท้อนของแสงที่มุมตกระทบที่มีขนาด 1.25 ถึง 1.45 ของ	65
	แสงโพลาไรซ์แบบ TE บนพีดีเอ็มเอสแบบเรียบ แสงโพลาไรซ์แบบ TM	
	บนพิดีเอ็มเอสแบบเรียบ แสงโพลาไรซ์แบบ TM บนพิดีเอ็มเอสแบบ	
	เกรตดิง และแสงโพลาไรซ์แบบ TM บนพีดีเอ็มเอสแบบเกรตดิง	

สารบัญรูป (ต่อ)

ราเทื่		หน้า
4. 8	แสดงผลการจำลองผลการเปลี่ยนแปลงความหนาของพีดีเอ็มเอสและ	67
	ความคันในตัวกลางของพี่คีเอ็มเอสแบบเรียบและพี่คีเอ็มเอสแบบเกรตติง	
	และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาเริ่มต้นของพี่ดีเอ็มเอสกับ	
	ความหนาที่เปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างพีดีเอ็มเอส	
	แบบเกรตติงที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความหนาเมื่อปล่อยคลื่นอัลตรา	
	ซาวนด์ที่มีความถี่ 1 MHz และมีความดันอยู่ที่ 100 kPa	
4.9	แสดงผลค่าความสะท้อนของแสงเมื่อเกิ <mark>ดกา</mark> รเปลี่ยนแปลงความหนาของ	69
	พีดีเอ็มเอสแบบเรียบและพีดีเอ็มเอสแบบเกรตติง ที่มุมตกกระทบตั้งแต่	
	1.25 ถึง 1.4 <mark>5 และภาพขยายเปรียบเทียบแถบมืดกับตำแห</mark> น่งของโหมด	
	ฟาบรี-เปโรต ์ ของพีคีเอ็มเอ สแบบเรียบ และพีคีเอ็มเอสแบบเกรตติง	
4.10	แสดงค่าค <mark>วามสะท้อนข</mark> องแสงก่อนการปรับ <mark>ปรุงสัญญาณ</mark> และหลังการ	71
	ปรับปรุงสัญ <mark>ญาณในการ</mark> ตรวจวัคกลื่นอัลตร <mark>าซาวค์โคยใ</mark> ช้ตัวรับรู้เป็นพื	
	ดีเอ็มเอสแบบเรียบและพีดีเอ็มเอสแบบเกรตติง	
4.11	การเปรียบเทียบผลประสิทธิภาพการตรวจวัคคลื่นอัลตราซาวค์โคยใช้ตัว	72
	รับรู้เป็นพี่ดีเอิ้มเอสแบบเร <mark>ียบและพี่ด</mark> ีเอ <mark>็มเอสแบบเกรตติง</mark>	
4.12	แสดงภาพฉายเกรตติงที่ถ่ายผ่านระบบการทำโมดูเลชันของความเข้มแสง	73
	บนระนาบภาพ และแสดงลวดลายเกรตติงที่ขึ้นรูป ถ่ายด้วยกล้อง	
	จุลทรรศน์แบบมาโครซูม	
4.13	แสดงตำแหน่งในการคำนวณความคลาดเคลื่อนลวคลายที่เกิดจากการ	75
	เอี้ยงของระบบแสงบนลวดลายเกรตติง	

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

โฟโตลิโทกราฟีหรือออฟติคอลลิโทกราฟี (Optical Lithography) คือ กระบวนการ ้สำหรับการสร้างลวดลายที่มีลักษณะเป็นร่องขุด ซึ่งลวดลายที่สร้างได้มีขนาดเล็กมาก ๆ ตั้งแต่ใน นาโนเมตรจนถึงไมครอน โฟโตลิโทกราฟีเป็นเทคนิคการใช้แสงที่มีความยาวคลื่นในช่วง ระดับ รังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet : UV) หรือแสงยูวีฉายผ่านมาส์กแสง (Photomask) ที่ใช้เป็น ต้นแบบถวดถายไปยังแผ่นรองรับ (Substrate) หรือวัสดุที่ใช้ในการสร้างถวดถาย ซึ่งวัสดุแผ่น รองรับถูกเคลือบด้วยสารไวแสง (Photoresist) ที่สามารถทำปฏิกิริยากับแสงยูวิได้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สารไวแสงชนิคลบ (Negative Photoresist) ที่สามารถแข็งตัวเมื่อถูกฉายด้วยแสงยูวีและ สารไวแสงชนิดบวก (Positive Photoresist) ที่สามารถสลายโครงสร้างเมื่อถูกฉายด้วยแสงยูวีและถูก ้ ถ้างได้ด้วยน้ำยาดีเวลลอปเปอร์ (Developer) เนื่องด้วยข้อจำกัดของระบบโฟโตลิโทกราฟีที่มีความ จำกัดของแสงในเรื่องของขนาดลวดลายที่สร้าง ทำให้เกิดการพัฒนาระบบที่ใช้แหล่งกำเนิดแบบ ต่าง ๆ เช่น ระบบโฟโตลิโทกราฟีที่ใช้รังสีเอกซเรย์และระบบโฟโตลิโทกราฟีที่ใช้ลำแสง อิเล็กตรอน (Electron Beam Lithography : EBL) เป็นระบบที่พัฒนามาจากกล้องจุลทรรศน์แบบ อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ก้าวข้ามในเรื่องของข้อจำกัดของแสงที่ส่งผล ต่อขนาดถวดถายที่สร้างขึ้น นอกจากข้อจำกัดในเรื่องขนาดถวดถายที่สร้างได้ระบบโฟโตลิโทกรา ้ฟียังมีข้อจำกัดในส่วนของมาส์กแสง หนึ่งมาส์กแสงสามารถสร้างถวดถายได้เพียงรูปแบบเคียวทำ ้ให้ไม่สะควกต่อการทำวิจัย กระบวนการผลิตมาส์กใหม่ทุกครั้งมีการสร้างลวคลายใหม่ ๆ นำไปสู่ ระยะเวลาในการทำงานและงบประมาณที่สูงขึ้น (Deng, Wang, Gao, Zhou, He & Hu, 2017) ทำให้ มีการพัฒนาระบบโฟโตลิโทกราฟีแบบไม่ใช้มาส์ก (Thomson, Willson & Bowden, 1983) โดยการ ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ฉายภาพ เช่น อุปกรณ์กระจกขนาคไมครอนแบบคิจิทัล (Digital Micro-Mirror device : DMD) และจอผลึกเหลว (Liquid Crystal Display : LCD) แทนการใช้มาส์กแสง โฟ ์ โตลิโทกราฟีแบบไม่ใช้มาส์กสามารถทำให้ประหยัดงบประมาณในการออกแบบและการออกแบบ ลวคลายมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น (Deng et al., 2017) โดยการออกแบบและสร้างมาส์กแสงผ่าน ้คอมพิวเตอร์ เทคนิคการสร้างถวดลายด้วยกระบวนการโฟโตลิโทกราฟีเป็นที่นิยมในกระบวนการ

สร้างลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์วงการอุตสาหกรรม สร้างลวคลายสำหรับผลิตเซนเซอร์และช่องทาง ใหลระดับจุลภาค (Microfluidic Channel) ในด้านการวิจัย เช่น การสร้างช่องทางใหลจุลภาคสำหรับ เซนเซอร์ที่ใช้ในการตรวจจับและวัคปริมาณคอเลสเตอรอลโดยการใช้เทคนิคซอฟท์โฟโตลิโทกรา ฟี (Soft photolithography) (Ali et al., 2013) ซึ่งเป็นการใช้กระบวนการโฟโตลิโทกราฟีในการสร้าง ลวคลายเพื่อให้เป็นแม่พิมพ์ (Mold) สำหรับการสร้างลวคลายบนพอลิเมอร์ อีกทั้งยังมีการสร้าง ช่องทางใหลจุลภาคสำหรับแยกองค์ประกอบของเลือดในทางการแพทย์ (Nivedita & Papautsky, 2013) รวมถึงการพัฒนาเซนเซอร์แสงโดยการสร้างลวคลายเกรตติงในการเพิ่มความสามารถในการ ตรวจจับของระบบการสั่นพ้องของพลาสมอนพื้นผิว (Indutnyi et al., 2016) เป็นต้น

เซนเซอร์แสงเป็นเซนเซอร์ที่ใช้ในการตรวจวัดปริมาณต่าง ๆ จากการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติต่าง ๆ ของแสง เช่น ความเข้มแสง เฟสของแสง การเปลี่ยนแปลงของสเปกตรัม เป็นต้น เซนเซอร์แสงเป็นอุปกรณ์ตรวจจับที่ให้ความแม่นยำ (Accuracy) และมีความไวในการตอบสนอง (Sensitivity) สูง เช่น การใช้เทคนิคการสั่นพ้องของพลาสมอนพื้นผิวในการตรวจวัคปริมาณสาร ความเข้มเข้นต่ำ ๆ โดยการใช้หลักการที่วัสดุหรือสารต่าง ๆ มีค่าดัชนีหักเห (Refractive index : n) ที่ ไม่เท่ากัน นอกจากเซนเซอร์แสงถูกนำมาใช้ในด้านการวัดปริมาณทางเคมีหรือทางชีวภาพ เซนเซอร์ แสงก็ยังสามารถวัดปริมาตรในเชิงกลได้อีกด้วย เช่น การตรวจวัดการเคลื่อนที่และตำแหน่งของ พื้นผิว (Wang, Chiu, Chen, Kao, & Chang, 2009) และการตรวจวัดความคัน (Wang et al., 2014) ซึ่ง มีเทคนิคในการวัดด้วยเซนเซอร์แสงหลายวิธี เช่น จากการเคลื่อนที่ของแผ่นไดอะแฟรมหรือการใช้ การแทรกสอดของแสงแบบฟาบรี-เปโรต์ (Fabry -Perot) เป็นต้น นอกจากเซนเซอร์แสงสามารถวัด ความคันได้แล้วยังสามารถนำมาหาก่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความคันได้ เช่น การวัดอัตราการไหล ของสารหรืออากาศหรือแม้กระทั่งสามารถตรวจวัดความดันจากกลื่นอัลตราซาวค์ เซนเซอร์แสง สามารถนำมาใช้ตรวจคลื่นอัลตราซาวค์ในการถ่ายภาพด้วยเทคนิคการใช้คลื่นอะคูสติก (Photoacoustic Imaging) ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคนิคที่ใช้แสงเลเซอร์ในการกระตุ้นเซลล์หรือเนื้อเยื่อ ้เพื่อให้เกิดการหดและขยาย ทำให้เกิดกลื่นอัลตราซาวด์ และสามารถสร้างภาพเนื้อเยื่อที่ถ่ายจาก ้คลื่นอัลตราซาวค์ที่เกิดขึ้นได้ โดยทั่วไปการตรวจวัดคลื่นอัลตราซาวค์ในกระบวนการนี้จะใช้ อุปกรณ์เพียโซอิเล็กทริก (Piezoelectric) (Wissmeyer, Pleitez, Rosenthal, & Ntziachristos, 2018) แต่เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องของความไวในการตรวจวัดทำให้เซนเซอร์แสงในรูปแบบต่าง ๆ ถูก นำมาประยุกต์ใช้ เช่น หลักการการแทรกสอดของแสงของมาร์ช เซนเดอร์ (Mach-Zehnder Interferometer) (Paltauf, Nuster, Haltmeier, & Burgholzer, 2007) การใช้ไฟเบอร์ออปติก (Fiber Optics) หรือแม้แต่เทคนิค พลาสมอนบนพื้นผิวเองก็ถูกนำมาใช้ในการตรวจจับคลื่นอัลตราซาวด์ โดยการวัดค่าดัชนีหักเหของตัวกลางที่เปลี่ยนแปลงจากการถูกรบกวนด้วยความดันจากคลื่นอัลตรา ซาวด์ (Sangworasil et al., 2016) อีกวิธีที่มีการนำมาใช้ ได้แก่ ฟาบรี-เปโรต์ ใช้หลักการการที่ คลื่นอัลตราซาวด์ทำให้ความหนาของฟิล์มพอลิเมอร์เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ความเข้มของแสง เปลี่ยนแปลง (Beard, Pérennès, & Mills, 1999) เมื่อไม่นานมานี้ได้มีงานวิจัยที่มีความนำพอลิเมอร์ช นิดพอลิไดเมทิลซิโลเซน (Polydimethylsiloxane: PDMS) หรือพีดีเอ็มเอส มาใช้ในการตรวจวัด คลื่นอัลตราซาวด์จากการเปลี่ยนแปลงความหนาของพอลิเมอร์เมื่อถูกกดด้วยความดันจากคลื่นอัล ตราซาวด์ ทำให้สามารถตรวจวัดคลื่นอัลตราซาวด์ที่เกิดขึ้นได้ (Learkthanakhachon, Pechprasarn, & Somekh, 2018)

ในการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการสร้างแม่พิมพ์ลวดลายเกรตติงจากกระบวนการโฟโต ลิโทกราฟีด้วยการใช้อุปกรณ์กระจกขนาดไมครอนแบบดิจิทัลในการสร้างลวดลายต้นแบบแทน การใช้มาส์กแสง ลวดลายที่สร้างได้สามารถนำมาไปต่อยอดและนำไปใช้เป็นแม่พิมพ์ในการสร้าง ลวดลายบนพีดีเอ็มเอส ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้เป็นตัวรับรู้ (Receptor) ในการตรวจวัดกลิ่นอัลตรา ซาวด์เพื่อเพิ่มความสามารถในการเปลี่ยนแปลงเชิงความหนาโดยศึกษาผลจากแบบจำลองเชิงกล โดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite element method : FEM) และผลการจำลองเชิงแสงโดย ใช้หลักการของเฟรสเนล (Fresnel principle) และการวิเคราะห์กลิ่นควบคู่อย่างเกร่งกรัด (Rigorous Coupled-wave Analysis : RCWA) การสร้างลวดลายโครงสร้างเกรตติงเพื่อใช้ในกระบวนการ สร้างลวดลายบนพีดีเอ็มเอสช่วยให้การตรวจวัดกลิ่นอัลตราซาวด์มีความไวในการตอบสนองมาก ยิ่งขึ้น ซึ่งการสร้างเซนเซอร์แสงสำหรับตรวจวัดกลิ่นอัลตราซาวด์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน การถ่ายภาพด้วยเทคนิกการใช้คลิ่นอัลตราซาวด์รวมถึงยังเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของการ สร้างลวดลายด้วยกระบวนการโฟโตลิโทกราฟีแบบไม่ใช้มาส์กแสงอีกด้วย

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย

1.2.1 เพื่อศึกษาและสร้างระบบการทำโมดูเลชันของความเข้มแสงบนระนาบภาพ สำหรับการฉายภาพในกระบวนการโฟโตลิโทกราฟี โดยการใช้อุปกรณ์กระจกขนาดไมครอนแบบ ดิจิทัลในการสร้างลวดลายต้นแบบ

1.2.2 เพื่อศึกษาเชิงทฤษฎีเพื่อออกแบบโครงสร้างเกรตติงบนพิดีเอ็มเอสที่สามารถช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวัดคลื่นอัลตราชาวด์ที่มีความถี่ 1 MHz

1.2.3 เพื่อศึกษาและสร้างแม่พิมพ์สำหรับสร้างลวคลายบนพิดีเอ็มเอสด้วยระบบการทำ โมดูเลชันของความเข้มแสงบนระนาบภาพสำหรับการฉายภาพในกระบวนการโฟโตลิโทกราฟี

1.3 สมมติฐานการวิจัย

1.3.1 อุปกรณ์กระจกขนาด ไมครอนแบบดิจิทัลสามารถนำมาใช้ในการสร้างลวดลาย ต้นแบบที่ต้องการสร้างแทนการใช้มาส์กแสงในกระบวนการ โฟโตลิโทกราฟีได้

1.3.2 ในศึกษาเชิงทฤษฎีและการจำลองผลของระบบเซนเซอร์ตรวจวัคคลื่นอัลตราซาวค์ ที่ใช้พีคีเอ็มเอสแบบเกรตติงเป็นตัวรับรู้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวัคคลื่นอัลตราซาวค์ ที่มีความถี่ 1 MHz ได้เมื่อเปรียบเทียบกับระบบเซนเซอร์ตรวจวัคคลื่นอัลตราซาวค์ที่ใช้พีคีเอ็มเอส แบบเรียบเป็นตัวรับรู้

1.3.3 ระบบโฟโตลิโทกราฟีที่มีการใช้การทำโมดูเลชันของความเข้มแสงบนระนาบภาพ ในการสร้างลวดลายแทนการใช้มาส์กแสงสามารถสร้างแม่พิมพ์เกรตติงที่มีขนาดถูกต้องตามที่ ออกแบบและสามารถทำซ้ำได้

1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย



รูปที่ 1.1 แสดงกรอบแนวกิดการวิจัย

1.5 นิยามศัพท์

โฟโตลิโทกราฟี (Photolithography) เป็นหนึ่งในวิธีการพิมพ์หรือสร้างถวดถายที่มี ลักษณะเป็นร่อง โดยการใช้แสงยูวีฉายผ่านมาส์กแสงที่เป็นต้นแบบของถวดถายไปยังแผ่นรองรับที่ ถูกเคลือบด้วยสารไวแสง

รังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet : UV) หรือแสงยูวี เป็นแสงที่มีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 100 nm ถึง 400 nm

มาส์กแสง (Photomask) แผ่นบางทึบที่ถูกเจาะรูเป็นลวคลายต่าง ๆ สามารถให้แสงผ่าน และใช้เป็นต้นแบบในการสร้างลวคลายในกระบวนการ โฟโตลิโทกราฟี

แผ่นรองรับ (Substrate) วัสคุแผ่นเรียบที่ถูกเคลือบด้วยสารไวแสง สำหรับการสร้าง ลวคลายในกระบวนการโฟโตลิโทกราฟี ในงานวิจัยนี้ ได้แก่ แผ่นกระจกปิดสไลด์ (Cover Slip)

สารไวแสง (Photoresist) พอลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติแข็งตัวหรือสลายตัวเมื่อผ่านการฉาย ด้วยแสงยูวี และถูกล้างด้วยน้ำยาดีเวลลอปเปอร์

แม่พิมพ์ (Mold) ลวคลายที่สร้างบนสารไวแสงด้วยกระบวนการ โฟโตลิโทกราฟีสำหรับ นำมาสแตมป์บนพีดีเอ็มเอส (PDMS Stamping)

เกรตติง (Grating) ลวดลายที่มีลักษณะเป็นช่องเล็ก ๆ ขนานกันและมีระยะระหว่างช่อง เท่ากัน

เซนเซอร์แสง (Optical Sensor) ตัวรับรู้ที่ใช้ในการตรวจวัดปริมาณต่าง ๆ จากการ เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติต่าง ๆ ของแสง

คลื่นอัลตราซาวด์ (Ultrasonic Wave) คลื่นเสียงที่มีความถี่สูงกว่า 20 kHz

ค่าความสะท้อนของแสง (Reflectance: R) ค่าความเข้มของแสงที่สะท้อนออกจากระบบ เซนเซอร์ตรวจวัคกลื่นอัลตราซาวค์

ตัวรับรู้ (Receptor) เป็นตัวรับรู้การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบ ตรวจวัด ในงานวิจัยนี้เป็นการตรวจวัดความดันของกลื่นอัลตราซาวด์ที่มีความถี่ 1 MHz

โมดูเลชัน (Modulation) เป็นการปรับแอพลิจูดหรือความเข้มของแสงให้มีลักษณะตรง ตามที่ต้องการ โดยการใช้อุปกรณ์ที่มีชื่อว่าอุปกรณ์การทำโมดูเลชันของแสงเชิงพื้นที่ (Spatial Light Modulator : SLM)



บทที่ 2

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 โฟโตลิโทกราฟี (Photolithography)

โฟโตลิโทกราฟี เป็นหนึ่งในเทคนิคที่ใช้ในการสร้างลวดลายที่มีลักษณะเป็นร่องขุดขนาด เล็กมากตั้งแต่ระดับนาโนเมตรจนถึงระดับไมครอน ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญโดยเฉพาะใน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการออกแบบ พัฒนา และสร้างวงจรไฟฟ้าที่มีขนาดเล็ก อีกทั้งโฟโต ลิโทกราฟีเป็นกระบวนการผลิตที่คุ้มค่า ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตมีราคาไม่สูงทำให้เทคโนโลยีดังกล่าว เป็นที่นิยมใช้อย่างกว้างขวาง และใช้สร้างลวดลายได้หลากหลายด้วยการออกแบบมาส์กแสงที่เป็น ด้นแบบของลวดลาย ทำให้โฟโตลิโทกราฟีถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในการสร้างวงจรและ อุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น ใช้สร้างลวดลายในการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดหรือไบโอเซนเซอร์ เนื่องจาก การสร้างชุดอุปกรณ์ตรวจวัดที่มีขนาดเล็กทำให้สามารถลดปริมาณสารที่นำมาตรวจวัดและประหยัด การใช้สารตรวจวัดหรือเอมไซม์ที่มีราคาสูง และในทางการแพทย์มีการนำกระบวนการโฟโตลิ โทกราฟีมาใช้ในการสร้างช่องทางไหลจุลภากสำหรับการแยกสารที่มีขนาดแตกต่างกันหรือสร้าง ช่องสำหรับเพาะเลี้ยงเซลล์ เป็นด้น

2.2.1 หลักการของโฟโตลิโทกราฟี อระบวนอาร โฟโตลิโทอร

กระบวนการ โฟโตลิโทกราฟีเป็นการฉายแสงนำพาลวดลายด้นแบบจากมาส์ก แสงไปยังแผ่นรองรับที่เคลือบด้วยสารไวแสง ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่สามารถแข็งตัว (สารไวแสงชนิด ลบ) และสามารถถูกล้างทำละลาย (สารไวแสงชนิดบวก) ได้ด้วยน้ำยาดีเวลลอปเปอร์ เมื่อถูกฉาย ด้วยแสงยูวี ระบบ โฟโตลิโทกราฟีในปัจจุบันนิยมใช้เป็นระบบฉายภาพ (Optical Projection Lithography) โดยการใช้เลนส์ฉายภาพ (Projection Lens) วางไว้ระหว่างมาส์กแสงและแผ่นรองรับ ดังรูปที่ 2.1 โดยทั่วไปโฟโตลิโทกราฟีเป็นกระบวนการที่บทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมโลหะกึ่ง ตัวนำ โดยเฉพาะกระบวนการการพิมพ์ลายวงจร โฟโตลิโทกราฟีเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่สามารถ ทำให้เกิดการพัฒนาในเรื่องของขนาดของส่วนประกอบต่าง ๆ ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากใน อดีตที่มีขนาด 50 μm จนปัจจุบันเหลือเพียง 7 nm (Al-Hadeethi et al., 2021)



ตัวแปรที่ส่งผลต่อความสามารถของความละเอียดในการสร้างลวดลาย (Resolution : Res) หรือความสามารถในการสร้างลวดลายที่เล็กที่สุด ขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นของ แสงจากแหล่งกำเนิด (λ) ค่าความสามารถในการเก็บรวบรวมแสง (Numerical Aperture : N.A.) ของเลนส์ฉายภาพ ซึ่งนิยามไว้ด้วยสมการที่ 2-1 และสมการที่ 2-2 และค่าปัจจัยในกระบวนการผลิต (Process Dependent Adjustment factor : k_1) ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0.4 ถึง 0.9 ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ค่าความคลาดของเลนส์ (Lens Aberration) คุณภาพของสารไวแสงและการควบคุมเครื่องมือและ อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต เป็นต้น

$$N.A. = n\sin\theta \tag{2-1}$$

$$N.A. = n \sin\left[\arctan\left(\frac{D}{2f}\right)\right]$$
(2-2)

โดยที่ N.A. คือ ค่าความสามารถในการเก็บรวบรวมแสงของเลนส์

- *n* คือ ค่าดัชนีหักเหของแสงของตัวกลาง อากาศมีค่าเท่ากับ 1
- D คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์ (m)

f คือ ความยาวโฟกัสของเลนส์ (m)

ปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมาเป็นไปตามสมการของเรย์ถี (Rayleigh Equation) (Ronse, 2006) ดังสมการที่ 2-3

$$Res = k_1 \cdot \frac{\lambda}{N.A.}$$
(2-3)

การเพิ่มความสามารถในการสร้างลวดลายที่มีขนาดเล็กลงทำได้โดยการใช้ แหล่งกำเนิดแสงที่มีความยาวคลื่นสั้นลง ใช้เลนส์ฉายภาพที่มีค่าความสามารถในการเก็บรวมรวบ แสงมากขึ้น และการควบคุมกระบวนการผลิตให้มีข้อผิดพลาดน้อยลง นอกจากความสามารถของ ความละเอียดในการสร้างลวดลายแล้ว อีกตัวแปรที่สำคัญในการสร้างลวดลายด้วยกระบวนการ โฟ โตลิโทกราฟี ได้แก่ ความลึกของระยะโฟกัส (Depth of Focus : DOF) (Mack, 2004)เป็นค่าที่บ่งบอก ระยะโฟกัสที่ให้ภาพลวดลายที่ถูกต้องและทำให้สารไวแสงสามารถเปลี่ยนสภาพได้เมื่อถูกฉาย ซึ่ง หลักการของเรย์ลียังคงถูกนำมาใช้ในการคำนวณ แสดงในสมการที่ 2-4

$$DOF = k_2 \cdot \frac{\lambda}{N.A.^2}$$
(2-4)

โดยที่

k₂ คือ ค่าปัจจัยในกระบวนการผลิต มีค่าอยู่ในช่วง 0.5 ถึง 1

2.1.2 วิวัฒนาการของระบบโฟโตลิโทกราฟี

โฟโตลิโทกราฟีเป็นเทคโนโลยีที่ถูกคิดค้นและถูกนำมามาใช้อย่างยาวนานและ เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนามาตลอด โดยเริ่มแรกในช่วงปีศริสต์ศักราช 1970 ถึง 1980 โฟโตลิโทกรา ฟีระบบแรกที่เริ่มมีการใช้ คือ การพิมพ์แบบคอนเทค (Contact Printer) เป็นระบบที่ใช้การฉายแสง ไปยังบนมาส์กที่ถูกกคลงไปสัมผัสกับสารไวแสงที่ถูกเคลือบไวบนซิลิคอนเวเฟอร์ (Silicon Wafer) หรือแผ่นรองรับ ดังรูปที่ 2.2 ก. ข้อดีของระบบนี้คือสามารถสร้างรูปร่างและลวดลายที่มีขนาดเล็ก โดยใช้อุปกรณ์ที่มีราคาไม่แพง แต่มีข้อเสียคือเป็นระบบที่อาจจะทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมี ทำให้ต้องมีการทำความสะอาคมาส์กหลังการฉายแสงลงบนแผ่นรองรับ ระบบนี้จะมีสามารถสร้าง รูปร่างที่มีขนาดเดียวกับมาส์กแสง เนื่องด้วยปัญหาการปนเปื้อนทำให้มีการพัฒนาระบบการพิมพ์ แบบพร็อกซิมิตี้ (Proximity Printer) เป็นระบบที่มีช่องว่างเล็ก ๆ ระหว่างมาส์กแสงและแผ่นรองรับ ดังรูปที่ 2.2ข. แต่ระบบนี้มีข้อเสียคือทำให้กวามละเอียดของรูปร่างที่ได้ลดลงเพราะการเลี้ยวเบนของ แสงที่ผ่านมาส์กและตกกระทบลงบนแผ่นรองรับ ต่อมาในช่วงปีศริสต์ศักราช 1980 ถึง 1990 มี ระบบที่เรียกว่า ระบบโฟโตลิโทกราฟีแบบฉายภาพ (Projection Aligner) เป็นระบบที่ระยะห่าง ระหว่างมาส์กและแผ่นรองรับมีขนาดมากขึ้นและเป็นการแก้ไขในเรื่องของความละเอียดของระบบ ระบบการพิมพ์แบบพร๊อกซิมิตี้โดยไม่ต้องเกิดการสัมผัสระหว่างมาส์กแสงและแผ่นรองรับ โดยการ ใช้ระบบเลนส์มาช่วยในการฉายภาพลงบนแผ่นรองรับทำให้ลวดลายที่สร้างได้มีขนาดเล็กกว่ามาส์ก แสง มีความคมชัดและมีระยะห่างของมาส์กแสงและสารไวแสง (Ronse, 2006) ดังรูปที่ 2.2 ก.



รูปที่ 2.2 แสดงลักษณะของระบบโฟโตลิโทกราฟี ก. ระบบการพิมพ์แบบคอนเทค ข. ระบบการพิมพ์แบบพร๊อกซิมิตี้ และ ค. ระบบโฟโตลิโทกราฟีแบบฉายภาพ ที่มา: Wiese, 2019

หลังจากปีคริสต์ศักราช 1990 ระบบที่มีการถูกพัฒนา คือ ระบบสเต็ปและทำซ้ำ (Step and Repeat System) หรือเรียกว่าสเต็ปเปอร์ (Stepper) เป็นการสร้างลวดลายบนแผ่นรองรับที่ มีขนาดใหญ่ เป็นระบบที่มีการออกแบบให้แผ่นรองรับสามารถเคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งได้ สามารถ สร้างลวดลายที่ฉายให้มีขนาดใหญ่ขึ้นได้จากการฉายหลาย ๆ ครั้งโดยใช้ระบบเลนส์เพียง 1 ชุด โดยมาส์กแสงที่ใช้มีลวดลายรูปแบบเดียว ลวดลายที่ฉายจะเหมือนกันทุกครั้ง หลักการของระบบ หลังจากฉายภาพลงบนแผ่นรองรับแล้ว แผ่นรองรับจะขยับเปลี่ยนตำแหน่ง ตำแหน่งที่ถูกฉายภาพ จะเปลี่ยนไป แผ่นรองรับจะขยับจนกระทั่งสร้างรูปร่างบนแผ่นรองรับจนครบทั้งหมด โดยความ กว้างของรูปร่างที่ถูกฉายแต่ละตำแหน่งจะขึ้นอยู่กับขอบเขตของเลนส์ อีกทั้งระบบนี้มีการพัฒนา ระบบเลนส์ที่ใช้ในการฉายภาพลงบนแผ่นรองรับให้มีการลดขนาดภาพลงจากมาส์กประมาณ 4 ถึง 5 เท่า และต่อมาได้พัฒนาเป็นที่มีชื่อว่าระบบสเต็ปและสแกน (Step and Scan System) หรือเรียกว่า สแกนเนอร์ (Scanner) โดยแผ่นรองรับจะมีการสแกนระหว่างการฉายแสงจากแหล่งกำเนิดแสง มี การทำงานร่วมกันระหว่างส่วนที่ฉายภาพและส่วนของการสแกนลวคลายบนแผ่นรองรับ ทำให้ สามารถลดขนาดขอบเขตการฉายภาพของเลนส์ได้และการสร้างลวคลายมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น (Ronse, 2006)



รูปที่ 2.3 แสดงลักษณะการทำงานของ ก. ระบบสเต็ปและฉายซ้ำ และ ข. ระบบสเต็ปและสแกน ที่มา: Das & Sandstrom, 2002

2.1.3 การปรับปรุงและพัฒนาระบบโฟโตลิโทกราฟี

2.1.3.1 การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกำเนิดเพื่อให้ได้ลวดลายที่มีขนาดเล็ก เทค โนโลยีการสร้างลวดลายด้วยกระบวนการ โฟโตลิโทกราฟีมี ข้อจำกัดในด้านของความละเอียดของลวดลายที่สามารถสร้างได้จากความยาวคลื่นของแหล่งกำเนิด ในช่วงของแสงยูวี ทำให้ระบบในการฉายภาพจากแหล่งกำเนิดชนิดอื่น ๆ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อก้าวข้าม ขีดจำกัดในการสร้างภาพขนาดเล็กด้วยแสง ได้แก่ ระบบลิโทกราฟีที่ใช้แสงความยาวคลื่นยูวีช่วงสั้น (Extreme Ultraviolet Lithography : EUV) ระบบลิโทกราฟีที่ใช้รังสีเอกซเรย์ (Proximity X-ray Lithography) ระบบลิโทกราฟีที่ใช้ลำอิเล็กตรอนและระบบลิโทกราฟีที่ใช้ลำไอออน (Ion-projection Lithography) เป็นต้น

ระบบลิโทกราฟีที่ใช้ความยาวคลื่นยูวีช่วงสั้นหรืออียูวีลิโทกราฟี
เป็นกระบวนการที่ใช้ในการย้ายรูปแบบที่ถูกออกแบบบนมาส์กไปยังฟิล์มพอลิเมอร์โดยการใช้

แหล่งกำเนิดแสงที่มีความยาวคลื่นอยู่ในช่วงแสงยูวีช่วงสั้นในช่วงความยาวคลื่น 10 nm ถึง 14 nm (Bjorkholm, 1998) ส่องผ่านมาส์กไปยังแผ่นรองรับ

2) ระบบลิโทกราฟีที่ใช้รังสีเอกซเรย์ ในห้องปฏิบัติการหลาย ๆ ที่ ได้ มีการแทนที่ระบบโฟโตลิโทกราฟีที่ใช้ความยาวคลื่นสั้นด้วยระบบโฟโตลิโทกราฟีที่ใช้รังสี เอกซเรย์ เป็นระบบที่ใช้แหล่งกำเนิดแสงที่มีความยาวคลื่นในช่วงน้อยกว่าน้อยกว่า 0.6 Å (Sheu, Chiang, & Su, 1998) ในการฉายแสงให้กับระบบ วิธีนี้สามารถสร้างรูปร่างที่มีขนาดเล็กถึง 20 nm และเป็นระบบที่มีราคาสูง

3) ระบบลิโทกราฟีที่ใช้ลำอิเล็กตรอน เป็นระบบที่มีการพัฒนามาจาก กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ใช้หลักการสร้างลวดลายโดยการโฟกัสลำแสงของ อิเล็กตรอนลงบนสารไวแสงที่ทำปฏิกิริยากับอิเล็กตรอน ระบบลิโทกราฟีที่ใช้ลำอิเล็กตรอนเป็น ระบบที่มีราคาสูงมาก นิยมนำมาใช้ในการสร้างมาส์กแสง วิธีนี้สามารถสร้างลวดลายที่มีขนาดเล็ก ถึง 10 nm (Liu et al., 2002)

4) ระบบลิโทกราฟีที่ใช้ลำไอออน ระบบจะมีความคล้ายคลึงกับระบบ ลิโทกราฟีที่ใช้ลำอิเล็กตรอนแต่แตกต่างกันที่แหล่งกำเนิคแสงของระบบ วิธีนี้เป็นการโฟกัสลำแสง ใออนลงบนสารไวแสง โดยไออนที่ใช้ คือ *H*⁺และ *He*⁺ (Melngailis, Mondelli, Berry iii, & Mohondro, 1998) ระบบนี้เมื่อเปรียบเทียบกับระบบลิโทกราฟีที่ใช้ลำอิเล็กตรอนจะให้ความละเอียด ที่สูงกว่า ระบบนี้สร้างลวดลายได้มีขนาดเล็กถึง 4 nm (Li, Wu, & Williams, 2012)

2.1.3.2 การพัฒนาระบบให้ก่าปัจจัยในกระบวนการผลิตมีก่าลดลง การพัฒนาระบบไฟโตลิโทกราฟีเพื่อให้ได้ความละเอียดในการฉาย ภาพมากขึ้นด้วยการเปลี่ยนแหล่งกำเนิดเป็นวิธีที่ทางอุตสาหกรรมการผลิตมักเลือกใช้เป็นวิธีสุดท้าย เพราะการเปลี่ยนแหล่งกำเนิดจะตามมาด้วยการแก้ใขส่วนอื่นในระบบ เช่น การเปลี่ยนเลนส์ฉาย ภาพให้เหมาะสมกับแหล่งกำเนิด รวมไปถึงสารไวแสงที่ใช้ ในส่วนการปรับปรุงระบบด้วยการ เปลี่ยนเลนส์ฉายภาพให้มีก่าความสามารถในการเก็บรวมรวบแสงให้มากขึ้น วิธีนี้จะส่งผลทำให้ ความลึกของระยะโฟกัสในการฉายภาพลดลง อ้างอิงจากสมการที่ 2.3 อีกทางเลือกที่ทำให้ไม่ต้อง เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ในระบบ สามารถใช้อุปกรณ์เดิมได้ คือ การลดก่าปัจจัยในกระบวนการผลิต

สามารถทำได้ด้วยการพัฒนาในส่วนของกระบวนการของสารไวแสงหรือมีการใช้เทคนิคบางอย่าง เข้ามาช่วย เช่น การออกแบบมาส์กให้สามารถเลื่อนเฟสของแสง (Phase Shifting Masks) การ ดัดแปลงรูปร่างของลำแสงในระบบ (Off-axis Illumination) (Ronse, 2006) เป็นต้น การออกแบบมาส์กให้สามารถเลื่อนเฟสของแสง โดยการเพิ่มชั้นที่ ช่วยในการเลื่อนเฟสของแสงบนมาส์กแสง ดังรูปที่ 2.4 ข. แสงที่ตกกระทบบนบริเวณที่มีชั้นที่ช่วย เลื่อนเฟสจะมีเฟสตรงข้ามกับบริเวณที่ไม่มีชั้นดังกล่าว การที่เฟสของแสงถูกเปลี่ยนเป็นตรงข้ามจะ ช่วยเพิ่มความคมชัด (Contrast) ของภาพที่ฉาย ช่วยให้สามารถสร้างลวดลายที่มีละเอียดมากยิ่งขึ้น และเพิ่มระยะความลึกของโฟกัสได้ ดังภาพการเปรียบเทียบความเข้มของแสงที่ผ่านมาส์กแบบปกติ และมาส์กที่มีชั้นช่วยเลื่อนเฟสของแสง (Ronse, 2006) ดังรูปที่ 2.4



รูปที่ 2.4 แสดงการเปรียบเทียบแสงที่ฉายภาพ ก. มาส์กแสงแบบปกติ และ ข. มาส์กแสงที่มีชั้นช่วย เถื่อนเฟสของแสง

ที่มา: Ronse, 2006

 การดัดแปลงรูปร่างของลำแสงในระบบ วิธีนี้สามารถเพิ่มความ ละเอียดของลวดลายที่สร้างได้โดยการแก้ใขรูปร่างของลำแสงที่ตกลงกระทบบนมาส์กแสง ตัวอย่าง รูปร่างของลำแสงที่ใช้ ดังแสดงในรูปที่ 2.5 ก. รูปลำแสงปกติเต็มวง รูปที่ 2.5 ข. รูปลำแสงที่มี ลักษณะเป็นวงแหวน (Annular Illumination) และรูปที่ 2.5 ค. ลักษณะวงกลมสี่วง (Quadrupole Illumination)



รูปที่ 2.5 แสดงการเปรียบเทียบรูปร่างของลำแสงที่ฉายในระบบ โฟโตลิโทกราฟีด้วย ก. ลำแสงปกติ ข. ลำแสงที่มีลักษณะเป็นวงแหวน และ ค. ลำแสงที่มีลักษณะวงกลมสี่วง



รูปที่ 2.6 แสดงการเปรียบเทียบปรากฏการณ์เมื่อ ก. ลำแสงปกติ และ ข. ลำแสงที่ถูกคัดแปลงรูปร่าง ก่อนเข้าสู่ระบบโฟโตลิโทกราฟี ที่มา: Fuller, 2017

หลักการของวิธีนี้คือการทำให้แสงที่ตกกระทบบนมาส์กแสงถูกปรับ ให้เอียง ไม่เกิดมุมกระทบแบบตั้งฉากกับมาส์กแสง (Normal Incidence) โดยปกติเมื่อแสงตกกระทบ บนมาส์กจะเกิดการเลี้ยวเบนของแสงไปยังลำดับการเลี้ยวเบนต่าง ๆ ดังรูปที่ 2.6 ก. แต่เมื่อแสงที่ถูก กระทบถูกปรับให้เอียง ทำให้แสงที่เลี้ยวเบนผ่านมาส์กถูกปรับให้เลื่อน เลนส์ฉายภาพที่เก็บ รวบรวมแสงจะเก็บแสงได้มากขึ้น ดังรูปที่ 2.6 ข. ข้อดีของวิธีนี้กือไม่ต้องแก้ไขในส่วนของมาส์ก แสง แต่ข้อเสีย คือ ระบบจะสูญเสียพลังงานจากการที่แสงบางส่วนถูกบังไว้โคยเฉพาะบริเวณตรง กลางและวิธีนี้ใช้ได้กับมาส์กแสงที่มีรูปแบบเฉพาะเท่านั้น (Ronse, 2006)

2.1.3.3 โฟโตลิโทกราฟีแบบไม่ใช้มาส์ก (Maskless Photolithography)

นอกจากความท้าทายขีดจำกัดในด้านของขนาดลวดลายที่ทำให้เกิด การพัฒนาระบบลิโทกราฟีที่มีการใช้แหล่งกำเนิดต่าง ๆ แทนการใช้แสงที่มีความยาวคลื่นในช่วง แสงยูวีแล้ว ยังมีการพัฒนาระบบที่ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ แทนการใช้มาส์กแสง เนื่องจากปัญหาในด้าน ของต้นทุนในการผลิต ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตและการขาดความยืดหยุ่นในการใช้งานเพราะ มาส์กแสงแต่ละชิ้นจะมีลวดลายต้นแบบที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งในด้านของลวดลายและ ขนาด ระบบโฟโตลิโทกราฟีที่ไม่ใช้มาส์กแสงถูกพัฒนาขึ้นโดยการใช้อุปกรณ์สำหรับการทำ โมดูเลชันของกุณสมบัติของแสงเชิงพื้นที่ ยกตัวอย่าง อุปกรณ์กระจกขนาดไมครอนแบบดิจิทัล และ จอภาพผลึกเหลว เป็นต้น

1) อุปกรณ์กระจกขนาดไมครอนแบบคิจิทัล เป็นอุปกรณ์ปรับแสงเชิง พื้นที่จากระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค (Micro-electromechanical System : MEMS) อุปกรณ์ปรับ แสงเชิงพื้นที่จากระบบเครื่องกล ไฟฟ้าจุลภาค มีลักษณะเป็นการเรียงตัวของพิกเซลของซิลิคอนหรือ อะลูมิเนียมที่สามารถปรับเอียงได้ตามกระแสไฟฟ้าที่ง่ายเข้าไป โครงสร้างอารเรย์ของซิลิคอน ตอบสนองต่อสัญญาณแอนะลือกที่ป้อนเข้าไปในแต่ละพิกเซล การปรับเอียงของพิกเซลจะเป็นใน ้ถักษณะคือ เปิดและปิด ต่อมาได้มีการพัฒนาให้สามารถสร้างภาพที่มีระดับสีเทาโดยการใช้หลักการ สร้างสัญญาณแอนะล็อกค้วยการเขียนสัญญาณคิจิทัลขึ้นมา (Pulse with Modulation) โคยทั่วไป อุปกรณ์กระจกขนาดไมครอนแบบดิจิทัลจะประกอบไปด้วยกระจกอะลูมิเนียมที่มีขนาดในระดับ ้ไมครอนที่สามารถสะท้อนแสงไปได้ในสองทิศทาง โดยทิศทางการสะท้อนของแสงขึ้นอยู่กับการ ้ควบคุมผ่านวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ทิศทางในการสะท้อนของแสงควบคุมโดยการเอียงของกระจก ้อะลูมิเนียมไปยังองศาที่กำหนดไว้ โดยทั่วไปอุปกรณ์กระจกขนาดไมครอนแบบดิจิทัลถูกใช้ใน ้เครื่องฉายภาพ ทำงานร่วมกับแหล่งกำเนิดแสงและเลนส์สำหรับฉายภาพ กระจกอะลูมิเนียมจะบิด ้เอียงเพื่อให้แสงที่ตกกระทบจากแหล่งกำเนิดแสงสะท้อนเข้าสู่หรือออกไปจากเลนส์ฉายภาพ โดย ้ปกติเมื่อกระงกไม่เกิดการบิด ถือว่าเป็นสถานะเปิด คือแสงจะถูกสะท้อนเข้าสู่เลนส์ฉายภาพ เกิด แสงที่ปลายทางของเลนส์ และเมื่อกระจกบิคจะถือว่าอยู่ในสถานะปิค แสงจะถูกสะท้อนออกไป ไม่ เข้าสู่เลนส์ฉายภาพปลายทางของเลนส์ฉายภาพจะ ใม่มีแสงหรือเกิดบริเวณมืด (Dudley, Duncan, & Slaughter, 2003)



รูปที่ 2.7 แสดงการทำงานของอุปกรณ์กระจกขนาดไมครอนแบบดิจิทัลในโหมดเปิดและปิด ที่มา: Gong & Hogan, 2014

ในปี 2010 อุปกรณ์กระจกขนาดไมครอนแบบดิจิทัลได้ถูกนำมาใช้ใน ระบบโฟโตลิโทกราฟี โดยมีแหล่งกำเนิดแสงในระบบเป็นหลอดไฟฮาโลเจนที่มีกำลัง 250 W และ เลือกใช้ความขาวกลื่นจากหลอดฮาโลเจนในช่วง 450 nm ฉายผ่านระบบเลนส์ที่ออกแบบและ ประกอบขึ้นเองจากเลนส์จำนวน 8 ชิ้น ระบบนี้สามารถสร้างรูปร่างบนแผ่นรองรับให้ความละเอียด ถึง 4 μm (Lee, 2010) และในปีคริสตศักราช 2013 Ding และกณะ พัฒนาระบบโฟโตลิโทกราฟีแบบ ไม่ใช้มาส์ก โดยการใช้อุปกรณ์กระจกขนาดไมครอนแบบดิจิทัลแต่มีการดัดแปลงแหล่งกำเนิดแสง จากการใช้หลอดไฟเป็นการใช้ลำแสงเลเซอร์ที่มีความขาวคลื่น 365 nm และระบบเลนส์ฉายภาพลง บนแผ่นรองรับมีการประยุกต์ใช้เลนส์ใกล้วัดถุของกล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยาย 10 เท่าในการย่อ ขนาดภาพ ระบบนี้มีส่วนเพิ่มเติมคือแหล่งกำเนิดแสงหลังแผ่นรองรับ ในการวิจัยนี้ใช้แผ่นรองรับ เป็นเรซิน ที่มีลักษณะโปร่งใสและมีเซนเซอร์รับภาพ ทำหน้าที่รับภาพรูปแบบแสงจากแหล่งกำเนิด ผ่านเลนส์ใกล้วัดถุ จุดมุ่งหมายของระบบนี้คือศึกษาลักษณะลวดลายที่เกิดในการใช้ลำแสงรูปแบบ ต่าง ๆ พบว่าการใช้อุปกรณ์กระจกขนาดไมครอนแบบดิจิทัลทำให้มีความยืดหยุ่นในการสร้าง ลวดลายและมีความแม่นยำในการสร้างลวดลายทั้งใน 2 และ 3 มิติ (Ding, Ren, & Lu, 2013)

2) อุปกรณ์ผลึกเหลวเป็นสารที่มีคุณสมบัติเป็นทั้งของแข็งและ ของเหลว สามารถปรับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของแสงได้ มักนิยมใช้ในการสร้างอุปกรณ์จอภาพใช้กับ แสงในช่วงที่ตามนุษย์สามารถมองเห็น นอกจากนี้อุปกรณ์จอผลึกเหลวถูกนำมาศึกษาและพัฒนา สำหรับการนำไปใช้งานด้านอื่น ๆ เช่น การประมวลผลข้อมูลด้วยแสง (Optical Data Processing) เทคโนโลยีระบบปรับสภาพตามแสง (Adaptive Optics) สำหรับใช้กับกล้องโทรทรรศน์ เป็นต้น การ ใช้อุปกรณ์ผลึกเหลวสามารถส่งข้อมูลไปยังลำแสงได้ทั้งโหมดส่องผ่านและโหมดสะท้อน โดยทั่วไปผลึกเหลว (Liquid Crystals) มีลักษณะแบบโครงสร้างที่แตกต่างของกันไปตามทิสทาง ของการวัดทำให้มีค่าสภาพยอมทางไฟฟ้า (Permittivity : ɛ) และคุณสมบัติของแสงที่ไม่เท่ากันในแต่ ละทิสทางที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านแผ่นอิเล็กโทรด โครงสร้างของ ผลึกเหลวมีรูปร่าง 3 ลักษณะ ได้แก่ ผลึกเหลวมีการเรียงตัวตั้งฉากกับแผ่นอิเล็กโทรด (Homeotropic Configuration) ผลึกเหลวมีการเรียงตัวขนานกับแผ่นอิเล็กโทรด (Planar Configuration) และผลึก เหลวมีการบิดองสาต่าง ๆ กับแผ่นอิเล็กโทรด (Twist Configuration) การเรียงตัวของผลึกเหลวส่งผล ทำให้ลำแสงเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนคุณสมบัติของความเป็นโพลาไรซ์ (Polarization) ของแสงจะเปลี่ยนแปลงตามทิสทางการเรียงตัวที่เกิดการบิดตัวของผลึกเหลว ซึ่งเกิดจากในแต่ละชั้น ที่แตกต่างกันเกิดจากการเติมสารไครัล (Chiral Agent) ทำให้องสาการบิดตัวของผลึกเหลวในแต่ละ ระนาบแตกต่างกัน การเรียงตัวและการบิดของผลึกเหลวจึงมีลักษณะคล้ายกับเกลียว ดังรูปที่ 2.8 ค. การเปลี่ยนแปลงของผลึกเหลวทำให้สามารถทำการโมดูเลชันหรือเปลี่ยนแปลงกุณสมบัติของแสงที่ ส่องผ่านเข้ามาได้ (Efron, 2001)



รูปที่ 2.8 แสดงการการบิดของผลึกเหลวเพื่อควบคุมทิสทางของแสง โพลาไรซ์เชิงเส้น ที่มา: Yoon et al., 2019

ในปีคริสตศักราช 2001 Jain ใด้จดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ระบบโฟโตลิ โทกราฟีแบบไม่ใช้มาส์ก โดยการแทนที่มาส์กด้วยอุปกรณ์สำหรับการทำโมดูเลชันของคุณสมบัติ ของแสงเชิงพื้นที่ระบบของ Jain จะใช้เลเซอร์เป็นแหล่งกำเนิดแสงและให้แสงเป็นพัลส์ (Pulse) อุปกรณ์สำหรับการทำโมดูเลชันของคุณสมบัติของแสงเชิงพื้นที่ที่ใช้คือ วาล์วแสงที่เปลี่ยนตามผลึก เหลว (Liquid Crystal Light Valve : LCLV) ที่สามารถเลือกแสงที่ตกกระทบลงบนแต่ละพิกเซลและ เลือกแสงที่สะท้อนไปยังเลนส์ฉายภาพที่สามารถย่อขนาดแสงจากแต่ละพิกเซลให้เล็กลงก่อนฉายลง บนแผ่นรองรับได้ (Jain, 2001)

2.1.3.4 การพัฒนาในรูปแบบอื่นๆ

ในปีคริสตศักราช 2001 มีการคัคแปลงกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ส่องผ่านให้เป็นระบบโฟโตลิโทรกราฟี โดยการออกแบบแหล่งกำเนิดแสงด้วยหลอดไอปรอท (Mercury-vapor Lamp) กำลัง 80 W ถึง 100 W ฉายแสงผ่านมาส์กและผ่านเลนส์ใกล้วัตถุเพื่อสร้าง ลวดลายบนแผ่นรองรับที่อยู่บนแท่นวางสไลด์ เลนส์ใกล้วัตถุที่ใช้ในระบบคังกล่าวเป็นเลนส์ที่ต้อง หยดน้ำมันระหว่างหัวเลนส์และกระจกปิคสไลด์ มีกำลังขยาย 100 เท่า และมีค่าความสามารถในการ เก็บรวบรวมแสงเท่ากับ 1.2 ระบบนี้สามารถสร้างรูปร่างที่มีความละเอียดได้สูงถึง 0.6 μm (Love, Wolfe, Jacobs, & Whitesides, 2001)



2.1.4 สารไวแสงที่ใช้ในกระบวนการโฟโตลิโทกราฟี

รูปที่ 2.9 แสดงลักษณะของสารไวแสงชนิดบวกและสารไวแสงชนิคลบเมื่อผ่านการฉายแสงและล้าง ด้วยน้ำยาดีเวลลอปเปอร์

ที่มา: Bellah, Christensen, & Iqbal, 2012

สารไวแสง เป็นหนึ่งในวัสดุที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมสารโลหะกึ่งตัวนำ สารไวแสงเป็นพอลิเมอร์ สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท ได้แก่ สารไวแสงชนิดลบและสารไวแสง ชนิดบวก สารไวแสง 2 ชนิดดังกล่าวแตกต่างกันที่สภาพหลังการฉายแสง สารไวแสงชนิดลบบริเวณ ที่สัมผัสกับแสงจะแข็งตัวและไม่ถูกทำให้สลายตัวไปหลังจากกระบวนการใช้น้ำยาดีเวลลอปเปอร์ ในทางตรงกันข้ามสารไวแสงชนิดบวกบริเวณที่ถูกฉายแสง จะถูกทำให้ละลายในตัวน้ำยาดีเวลลอป เปอร์ ในขณะที่บริเวณที่ไม่ถูกแสงจะคงอยู่แม้ว่าจะถูกชะล้างด้วยสารเคมี ดังรูปที่ 2.9 สารไวแสงทั้ง 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดบวกและชนิดลบมีคุณลักษณะและข้อดีข้อเสียแตกต่างกันดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติทั่วไปของสารไวแสงชนิดบวกและสารไวแสงชนิคลบ

กุณลักษณะ	สารไวแสงชนิดบวก	สารไวแสงชนิคลบ
การจับตัวกับซิลิคอน	ไม่ดี	ดีมาก
ราคา	มีรากาสูง	ราคาไม่สูง
ชนิดน้ำยาดีเวลลอปเปอร์	สารที่สะลายในน้ำ	ออร์แกนิก
สิ่งที่ละลายในน้ำยาดีเวลลอปเปอร์	บริเวณที่ถูกฉาย	บริเวณที่ไม่ถูกฉาย
ขนาดที่เล็กที่สุดที่ส <mark>ร้างได้</mark>	0.5 μm	2 µm
ความต้านทานการสึกก <mark>ร่อนทางเ</mark> คมี	ต่ำ	ត្តរ

ที่มา: Madou, 2002

สารไวแสง นอกจากจะถูกแบ่งประเภทตามลักษณะหลังการฉายแล้ว ยังมีการ แบ่งตามโครงสร้างทางเคมี สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ สารไวแสงชนิดโฟโตพอลิเมอร์ (Photopolymer Photoresist) สารไวแสงชนิดที่ละลายตัวด้วยแสง (Photo-decomposing Photoresist) และสารไวแสงที่มีโครงสร้างเป็นร่างแหได้ด้วยแสง (Photocrosslinking Photoresist)

2.1.4.1 โฟโตพอลิเมอร์ มักเป็นสารประเภทแอลิล มอนอเมอร์ (Allyl Monomer) เมื่อถูกฉายแสงจะกลายเป็นสารที่เป็นอนุมูลอิสระ คือ อะตอมหรือโมเลกุลที่มีอิเล็กตรอนเดี่ยวใน ชั้นนอกสุดสามารถจับหรือสร้างพันธะกับสารอื่นได้อย่างรวดเร็ว โฟโตพอลิเมอร์นิยมนำมาใช้เป็น

สารไวแสงชนิคลบ เช่น เมทิลเมทาคริเลต (Methyl Methacrylate : MMA) (Nakamura, 2014) 2.1.4.2 สารไวแสงชนิคที่ละลายตัวด้วยแสง เป็นสารไวแสงที่จะกลายเป็นสารที่

สามารถละถายในน้ำ (Hydrophilic) นิยมนำมาใช้เป็นสารไวแสงชนิดบวก (Lin, 2007) 2.1.4.3 สารไวแสงที่มีโครงสร้างเป็นร่างแหได้ด้วยแสง เป็นสารไวแสงที่ สามารถเกิดการเกาะตัวเป็นร่างแหที่ไม่ละถายได้ เมื่อผ่านการฉายแสง สารไวแสงที่มีโครงสร้างเป็น ร่างแหได้ด้วยแสง นำมาใช้เป็นสารไวแสงชนิดถบ (Ding et al., 2019) ในส่วนของสารไวแสงชนิดต่าง ๆ นั้น นอกจากในรูปของของเหลวแล้ว ใน ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้อยู่ในรูปของพอลิเมอร์ที่มีลักษณะคล้ายแผ่นฟิล์ม (Dry-film photoresist) เช่น สารไวแสง รุ่น ETERTEC HT-115T DRY FILM PHOTORESIST เป็นสารไวแสงชนิดลบ สามารถล้างบริเวณที่ไม่ต้องการได้ด้วยวิธีการกัดด้วยสารเกมี จุดเด่นของสารไวแสงชนิดนี้ คือ ใช้ การได้ดีกับการเกลือบบนผิวของโลหะและสามารถสร้างลวดลายด้วยความละเอียดสูง รวมถึงใช้ เวลาในการสร้างลวดลายไม่นาน นิยมนำมาใช้การผลิตแผ่นวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักแต่มี งานวิจัยที่นำสารไวแสงแบบฟิล์มมาใช้ในการสร้างแม่พิมพ์สำหรับสร้างช่องทางไหลจุลภาคที่มี ขนาด 100 µm อิกด้วย (Zhang & Songjing, 2018)

2.1.5 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานลวดลายต่าง ๆ ที่สร้างจากกระบวนการโฟโตลิโทกราฟี นอกจากการถูกนำมาใช้สร้างลวคลายในวงจรอิเล็กทรอนิกส์แล้วโฟโตลิโทกราฟี ยังถูกนำมาใช้ในการสร้างลวคลายเพื่อจุคประสงค์ต่าง ๆ เช่น การสร้างช่องทางใหลจุลภาค การ สร้างลวคลายบนใบโอเซนเซอร์ และเทคโนโลยีที่รวมช่องทางใหลจุลภาคและใบโอเซนเซอร์เข้า ด้วยกันในรูปแบบของห้องปฏิบัติการบนชิป เป็นด้น

2.1.<mark>5.1 ช่องทาง</mark>ใหลจุลภาค

ช่องทางไหลจุลภากเป็นช่องทางไหลที่มีขนาดเล็กระดับไมครอน ใช้ สำหรับเป็นทางไหลของของเหลวหรือแก๊ส ช่องทางไหลจุลภาคสามารถนำมาใช้ในการศึกษา ลักษณะการไหลของสาร ใช้ในการขนส่งสารที่เป็นของเหลว รวมถึงการควบคุมการไหลของสารที่ มีปริมาตรในระดับไมโครลิตรได้ ช่องทางไหลจุลภาคนิยมถูกสร้างและใช้ในทางชีววิทยา ทางเคมี รวมถึงทางการแพทย์ เป็นต้น ตัวอย่างการใช้งานช่องทางไหลจุลภาค ได้แก่ การออกแบบและสร้าง ช่องทางไหลจุลภาคสำหรับการแยกสารที่มีขนาดต่างกัน เช่น ในทางการแพทย์ ได้มีการแบบ ช่องทางไหลจุลภาคที่ใช้สำหรับการคัดแยกองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในเลือด (Yang, Ündar, & Zahn, 2006) รวมถึงการสร้างช่องสำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์ (Xiong et al., 2014) เป็นต้น

2.1.5.2 ใบโอเซนเซอร์

ใบโอเซนเซอร์หรือตัวตรวจวัดทางชีวภาพ เป็นการวิเคราะห์สารต่าง ๆ ทางชีวภาพ โดยการใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการตรวจวัดไม่ว่าจะเป็นทางด้านเคมีโดยการใช้เอมไซม์ (Enzyme) หรือใช้แสงในในการตรวจวัดคุณสมบัติของสาร เป็นต้น ยกตัวอย่างการใช้ กระบวนการโฟโตลิโทกราฟีในไบโอเซนเซอร์ เช่น การสร้างลวดลายของอิเล็กโทรดบนอุปกรณ์ ใบโอเซนเซอร์ (Hsu et al., 2016) เป็นต้น
2.1.5.3 เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการบนชิป (Lap-on-a-chip : LOC) เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการบนชิป เป็นเทคโนโลยีที่รวมช่องทางไหล

จุลภาคและ ใบโอเซนเซอร์เข้าด้วยกัน เพื่อรวมองค์ประกอบทางเคมีและชีววิทยาเข้าด้วยกันเป็นชิ้น เดียวกัน เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ ใบโอเซนเซอร์ให้มีขนาดเล็ก พกพาใด้ สามารถตรวจวัด ได้แบบ เรียล ไทม์ (Realtime) สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบสารหลาย ๆ ชนิดได้ด้วยอุปกรณ์ชิ้นเดียว รวมถึงสามารถใช้แล้วทิ้งได้ ยกตัวอย่าง ช่องทางใหลจุลภาคจะช่วยในการคัดแยกสารหรือผสมสาร เข้าด้วยกันขึ้นอยู่กับการออกแบบลวดลาย ห้องปฏิบัติการบนชิปที่มีการใช้กระบวนการโฟโต ลิโทกราฟีในการสร้างลวดลายในส่วนของช่องทางใหลสาร เช่น การสร้างอุปกรณ์สำหรับตรวจวัด คอเลสเตอรอลโดยการใช้เอมไซม์ 2 ชนิดได้แก่ คอเลสเตอรอลออกซิเดส (Cholesterol Oxidase : ChOx) และ คอเลสเตอรอลเอสเทอร์เรส (Cholesterol Esterase) และ วัดปริมาณของคอเลสเตอรอล ด้วยเทคนิกโครโนแอมเพอโรเมทรี (Chronoamperometry) เป็นการวัดกระแสที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยา ของสารที่นำมาทดสอบและเอมไซม์ คังรูปที่ 2.10



รูปที่ 2.10 แสดง ก. อุปกรณ์สำหรับตรวจวัดคอเรสเตอรอล และ ข. บริเวณที่เกิดปฏิกิริยาระหว่าง คอเลสเตอรอลและเอมไซม์ที่ใช้ในการตรวจวัด

ที่มา: Ali et al., 2013

2.1.5.4 โครงสร้างเกรตติง

เกรตติงเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ทางด้านแสงที่สามารถทำให้เกิด ปรากฏการณ์การเลี้ยวเบนของแสงเมื่อแสงเดินทางไปตกกระทบ ในทางการตรวจวัดปริมาณต่าง ๆ เกรตติงได้ถูกนำมาใช้ในการเพิ่มความสามารถในการตรวจวัดด้วยเซนเซอร์แสงโดยการเพิ่ม โครงสร้างเกรตติงเข้าไปในส่วนของตัวรับรู้ของระบบ เช่น การตรวจวัดด้วยคลื่นผิวพลาสมอนเป็น เทคนิคในการตรวจวัดปริมาณสารจากการเปลี่ยนแปลงค่าดัชนีหักเห ได้มีงานวิจัยที่นำเสนอผลการ จำลองในการนำโครงสร้างเกรตติงมาช่วยเพิ่มความไวในการตอบสนองและค่าความเป็นเซนเซอร์ที่ ดีในการตรวจวัดอีกด้วย (Sasivimolkul, Pechprasarn, & Somekh, 2021)

2.2 ระเบียบวิธีไฟในต์เอลิเมนต์

ระเบียบวิธีไฟในต์เอลิเมนต์เป็นหนึ่งในวิธีการทางคณิตศาสตร์ที่นิยมนำใช้ในการหา คำตอบหรือการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในทางวิศวกรรม หลักการของระเบียบวิธีนี้ คือ การใช้สมการ อนุพันธ์ย่อย (Partial Differential Equation) มาใช้ในการคำตอบเพื่อลดความซับซ้อนของโครงสร้าง ที่ต้องการศึกษา โดยการแบ่งโครงสร้างของสิ่งที่ต้องการศึกษา (Problem Domain) ให้เป็นหลาย ๆ องค์ประกอบย่อย (Element) เรียกว่า การสร้างเมช (Meshing) โดยในแต่ละองค์ประกอบย่อยจะมี โหนด (Node) ซึ่งเป็นจุดที่มีการคำนวณเพื่อหาผลลัพธ์หรือคำตอบที่ต้องการศึกษา ดังรูปที่ 2.11



ข้อดีของการแก้ปัญหาด้วยการใช้ระเบียบวิธีไฟในต์เอลิเมนต์ คือ วิธีนี้สามารถนำมาใช้ใน การแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนมาก ๆ รวมถึงการศึกษาโครงสร้างวัสดุที่มีความซับซ้อนหรือวัสดุ ที่มีลักษณะที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันในแต่ละทิศทาง เรียกว่า แอนไอโซโทรปี (Anisotropic Material) เช่น วัสดุที่เป็นแบบออร์โททรอปิก (Orthotropic Material) คือ วัสดุที่มีคุณสมบัติเชิงกล และความร้อนไม่สม่ำเสมอกันในแต่ละทิศทาง เป็นต้น รวมถึงวิธีนี้สามารถคำนวณผลลัพธ์ทั้งใน 1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ แต่วิธีนี้ยังมีข้อเสียคือในแต่ละจุดที่มีการคำนวณจะมีก่าความคลาดเกลื่อน (Error) ของจุดนั้น ๆ อยู่ เมื่อรวมผลลัพธ์ในแต่ละจุดจะทำให้เกิดก่าความคลาดเกลื่อนสะสมได้และ การคำนวณผลลัพธ์ด้วยวิธีนี้ต้องการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะที่ก่อนข้างสูง (พิมสาร, 2564)

2.2.1 การศึกษาผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างคลื่นเสียงและวัสดุของแข็งโดยใช้ระเบียบวิธีไฟ ในต์เอลิเมนต์ในโดเมนความถี่

การศึกษาผลการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคลื่นเสียงและวัสดุของแข็งระนาบที่ เกี่ยวกับความถี่เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของความคันเสียง (Acoustic Pressure) ที่เดินทางผ่าน โดเมนของเหลว (Fluid Domain) และตกลงบนรอยต่อระหว่างของเหลวและวัสดุของแข็ง ทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงในวัสดุที่เป็นของแข็ง เช่น ค่าความเก้น (Strain) ที่เปลี่ยนแปลงบนวัสดุหรือรูปร่าง ที่เปลี่ยนแปลง (Displacement) ของวัสคุได้ ผลการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคลื่นเสียงและวัสดุของแข็ง สามารถนำไปใช้แก้ปัญหา เช่น การหาค่าความส่องผ่าน (Transmittance : T) ของคลื่นเสียงผ่าน วัสดุหยืดหยุ่นหรือการสั่นของลำโพงที่เกิดจากคลื่นเสียง เป็นต้น ในการศึกษาปฏิสัมพันธ์นี้ ประกอบด้วยการกำนวณ 2 ส่วน คือ การคำนวณของความคันคลื่นเสียงในบริเวณ โดเมนของเหลวที่ คลื่นเสียงเดินทาง และการกำนวณเชิงกลศาสตร์ในส่วนของโครงสร้างที่เป็น โดเมนของแข็ง (Solid Domain)

2.2.1.1 การศึกษาความดันคลื่นเสียงด้วยโดเมนความถี่ (Frequency Domain) เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของความดันคลื่นเสียงใน โดเมนของเหลว ซึ่งเป็นตัวกลางในการ เคลื่อนที่ของคลื่นเสียง หลักการฟิสิกส์ที่ถูกนำมาใช้ในการศึกษาปัญหานี้ คือ สมการของเฮล์ม โฮลทซ์ (Helmholtz Equation) ซึ่งเป็นสมการที่ใช้ในการคำนวณฮาร์มอนิกของคลื่นเสียงในสนาม ความดัน (Harmonic Sound Pressure Field) ในฟังก์ชันความถี่เชิงมุม (ω) มีหน่วยเป็นเรเดียน (rad) (COMSOL Inc., 2018)

$$\nabla \cdot \left(-\frac{1}{\rho_c} \left(\nabla_{p_t - q_d} \right) \right) - \frac{k_{eq}^2 p_t}{\rho_c} = Q_m$$
(2-5)

โดยที่ $p_t = p + p_b$ และ $k_{eq}^2 = \left(\frac{\omega}{c_c}\right) - k_z^2$

- p คือ ความคันคลื่นเสียงที่ใส่เข้าไป (Pa)
- p_b คือ ความคันคลื่นเสียงพื้นหลัง (Background pressure) (Pa)
- p_t คือ ความคันคลื่นเสียงรวมทั้งระบบ (Total pressure) (Pa)
- ho_c คือ ค่าความหนาแน่นของตัวกลาง (Density) (kg/m³)

 k_z คือ เวกเตอร์ของคลื่นเสียง (Wavevector) (m⁻¹)

 c_c คือ ค่าความเร็วที่คลื่นเสียงเดินทางผ่านตัวกลาง (m/s) และความถิ่ของคลื่นเสียง (f) มีสัมพันธ์กับความถิ่เชิงมุม $f=rac{\omega}{2\pi}$

2.2.1.2 การคำนวณเชิงกลศาสตร์ในส่วนของโครงสร้างที่เป็นโคเมนของแข็ง เป็นการศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของแข็งที่เกิดจากการตกกระทบของคลื่นเสียง ที่ เดินทางผ่านโคเมนของเหลว เช่น การเปลี่ยนแปลงของรูปร่างหรือความหนา ความเค้นและ ความเครียดในวัสดุ เป็นต้น โดยการใช้สมการของนาเวียร์ (Navier's Equation) ในการคำนวณ ผลลัพธ์ (COMSOL Inc., 2017) ดังสมการที่ 2-6

$$\mathbf{f} = \mathbf{n} \cdot \left\{ -pI + (\mu (\nabla \mathbf{u}_{\text{fluid}} + (\nabla \mathbf{u}_{\text{fluid}})^T) - \frac{2}{3} \mu (\nabla \cdot \mathbf{u}_{\text{fluid}}) \mathbf{I} \right\}$$
(2-6)

โดยที่ p คือ ความดัน μ คือ ก่าความหนืดพลวัตร (Dynamic Viscosity) n คือ เวกเตอร์ตั้งฉากกับรอยต่อรอยต่อโคเมนของเหลวและ โคเมนของแข็ง I คือ เมทริกซ์เอกลักษณ์

111-

และ น_{กมน่} คือเวกเตอร์ของคลื่นเสียงในโคเมนของเหลว

จากสมการที่ 2-6 สามารถคำนวณหาแรง (Force : F) โดยคำนวณผลที่ละองค์ประกอบย่อย (Frame) ได้จากสมการที่ 2-7

$$F=f \cdot \frac{dv}{dV}$$
(2-7)

โดยที่ dv คือ ค่าสเกลของเอลิเมนต์ขององค์ประกอบย่อย (Spatial frame)

และ dV คือ ค่าสเกลของเอลิเมนต์ของวัสดุ (Material frame)

2.3 ทฤษฎีเชิงแสง

2.3.1 หลักการของเฟรสเนล (Fresnel principle)

สมการของเฟรสเนลเป็นสมการที่ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ของแสงหรือ กลื่นแม่เหล็ก ใฟฟ้าเมื่อเดินทางผ่านรอยต่อระหว่าง 2 ตัวกลางซึ่งเป็นตัวกลางที่มีค่าดัชนีหักเห แตกต่างกัน เมื่อแสงเดินทางผ่านรอยต่อของตัวกลาง แสงบางส่วนจะถูกสะท้อนกลับไปยังตัวกลาง เดิมหรือตัวกลางที่ 1 และแสงบางส่วนจะเกิดการส่องผ่านไปยังตัวกลางที่ 2 ดังรูปที่ 2.12 โดยทั่วไป กลื่นแม่เหล็ก ไฟฟ้าจะประกอบ ไปด้วยสนามแม่เหล็ก (Magnetic Field : *B*) และสนามไฟฟ้า (Electric Field : *E*) ตั้งฉากกันและตั้งฉากกับทิสทางการเคลื่อนที่ของคลื่นแสง ทิสทางของ สนามแม่เหล็กและสนาม ไฟฟ้ามีผลต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้มีการสึกษาผลลัพธ์ของ สนาม ไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กดังกล่าว โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่สนาม ไฟฟ้าตั้งฉากกับ ระนาบตกกระทบ (Transverse Electric Polarization : TE) หรือมีอีกชื่อว่า แสงมีโพลาไรซ์แบบเอส (S-polarization) ดังรูปที่ 2.12 ก. และกรณีที่สนามแม่เหล็กตั้งฉากกับระนาบตกกระทบ (Transverse Magnetic Polarization : TM) หรือมีอีกชื่อว่า แสงมีโพลาไรซ์แบบพี (P-polarization)



รูปที่ 2.12 แสดงการเดินทางของแสงผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางในกรณีที่ ก. แสงมีโพลาไรซ์แบบ TE และ ข. แสงมีโพลาไรซ์แบบ TM ที่มา: คัดแปลงมากจาก Mohamad, 2020 จากรูปที่ 2.12 เห็นใด้ว่าแสงที่ตกกระทบทำมุม $heta_i$ กับแกนตั้งฉาก แสงที่ สะท้อนทำมุม $heta_r$ กับแกนตั้งฉากและแสงที่ส่องผ่านรอยต่อจะเกิดการหักเหและทำมุม $heta_r$ กับแกน ตั้งฉาก จากกฎของการหักเหของสเนล (Snell's Law) (Vandergriff & McLean, 2021)

$$\theta_i = \theta_r \tag{2-8}$$

$$n_r \sin \theta_r = n_t \sin \theta_t \tag{2-9}$$

จากเงื่อนใบสำหรับแสงโพลาไรซ์แบบ TE

$$E_i + E_r = E_t \tag{2-10}$$

หรือ

หรือ

$$B_i \cos \theta_i - B_r \cos \theta_r = B_t \cos \theta_t \tag{2-11}$$

จากเงื่อนใขสำหรับแสงโพลาไรซ์แบบ TM

L

$$-B_i + B_r = -B_t \tag{2-12}$$

 $E_i \cos \theta_i - E_r \cos \theta_r = E_t \cos \theta_t$

จากความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าจากสมการของแม็กเวลล์ (Maxwell's equation)

$$E = \left(\frac{c}{n}\right)B \tag{2-14}$$

โดยที่ c คือ อัตราเร็วของแสงเดินทางในสุญญากาศ (m/s) n คือ ค่าดัชนีหักเหของตัวกลาง (2-13)

จากสมการที่ 2-9 และ 2-10 แสงโพลาไรซ์แบบ TE สามารถจัครูปได้เป็น

$$E_i + E_r = E_t \tag{2-15}$$

หรือ

$$n_0 E_i \cos \theta_i - n_0 E_r \cos \theta_r = n_1 E_t \cos \theta_t$$
(2-16)

และแสงโพลาไรซ์แบบ TM สามารถจัครูปได้เป็น

$$-n_0 E_i + n_0 E_r = -n_1 E_t (2-16)$$

หรือ

$$E_i \cos \theta_i - E_r \cos \theta_r = E_t \cos \theta_t \tag{2-17}$$

เราสามารถคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนและค่าสัมประสิทธิ์การส่อง ผ่านได้ สำหรับแสงโพลาไรซ์แบบ TE (Mohammed, 2019) ดังนี้

$$r_{s} = \frac{E_{r,s}}{E_{i,s}} = \frac{n_{0}\cos\theta_{i} - n_{1}\cos\theta_{i}}{n_{0}\cos\theta_{i} + n_{1}\cos\theta_{i}}$$
(2-18)

$$E_{t_s} = \frac{E_{t,s}}{E_{i,s}} = \frac{2n_0 \cos \theta_i}{n_0 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_i}$$
(2-19)

สำหรับแสงโพลาไรซ์แบบ TM (Mohammed, 2019) คังนี้

$$r_p = \frac{E_{r,p}}{E_{i,p}} = \frac{n_1 \cos \theta_i - n_0 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i + n_0 \cos \theta_t}$$
(2-20)

$$t_p = \frac{E_{t,p}}{E_{i,p}} = \frac{2n_0 \cos \theta_i}{n_1 \cos \theta_i + n_0 \cos \theta_i}$$
(2-21)

และค่าความสะท้อนของแสงและความส่องผ่านสามารถคำนวณได้จาก

$$R = \left| r \right|^2 \tag{2-22}$$

$$T = \left| t \right|^2 \tag{2-23}$$

2.3.2 การวิเคราะห์เชิงแสงด้วยทฤษฎีกลื่นควบคู่อย่างเคร่งครัด

เมื่อแสงหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเมื่อตกกระทบลงบนรอยต่อระหว่าง 2 ตัวกลาง ที่มีลักษณะ โครงสร้างเป็นคาบ เช่น เกรตติง เป็นต้น ทำให้เกิดปรากฏการณ์การเลี้ยวเบนของแสงไป ยังลำดับการเลี้ยวเบนต่าง ๆ ดังรูปที่ 2.13 แสดงการตกกระทบของแสงลงบนเกรตติงที่มีความหนา (Thickness : d) และขนาดคาบ (Period : A) และแสงเกิดการเลี้ยวเบนลำดับที่ -2 -1 0 1 และ 2



ที่มา: Magnusson, 2017

ทฤษฎีคลื่นควบคู่อย่างเคร่งครัคเป็นทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายหรือทำนาย ปรากฏการณ์การสะท้อนและการส่องผ่านของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ทั้งกรณีที่แสงมีโพลาไรซ์ แบบ TM และ TE เช่นเดียวกับหลักการของเฟรสเนล โดยใช้สมการของแม็กเวลส์มาทำนาย ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ทฤษฎีคลื่นควบคู่อย่างเคร่งครัดนั้น มีความซับซ้อนมากกว่าหลักการของ เฟรสเนลเนื่องจากวัสดุที่แสงเดินทางผ่านมีความซับซ้อนมากกว่า (Moharam, Grann, Pommet, & Gaylord, 1995)



รูปที่ 2.14 แสดงการตกกระทบของแสงบนวัสดุที่มีโครงสร้างเกรตติง ที่มา: ดัดแปลงมาจาก Moharam, Grann, Pommet, & Gaylord, 1995

จากรูปที่ 2.14 แสดงการตกกระทบของแสงบนรอยต่อระหว่างตัวกลางที่ I และ ตัวกลางที่ II ที่มีโครงสร้างเกรตติงความหนาเท่ากับ d คาบของเกรตติง เท่ากับ Λ และมีค่าสัดส่วน ของเกรตติง (Fill Factor : *FF*) เท่ากับ *FF* แสงที่ตกกระทบทำมุม θ กับแกนตั้งฉาก ทิศทางของ สนาม ใฟฟ้าทำมุม w กับแกน z และระนาบตกกระทบทำมุม ø กับแกน x สมการที่ใช้ในการ คำนวณ ดังสมการที่ 2-24 แสดงสมการสำหรับคำนวณค่าประสิทธิภาพการเลี้ยวเบน (Diffraction Efficiency : DE) ในกรณีแสงโพลาไรซ์แบบ TE ของแสงสะท้อน

$$DE_{ri} = R_i R_i^* \operatorname{Re}\left(\frac{k_{1,zi}}{k_0 n_1 \cos \theta}\right)$$
(2-24)

โดยที่ *i* คือ อันดับการเลี้ยวเบน

 $n_{\rm I}$ คือ ก่าดัชนีหักเหของตัวกลาง I

 $k_{_0}$ คือ เวกเตอร์ของคลื่นแสง สามารถคำนวณได้จาก $k_{_0}=2\pi$ / $\lambda_{_0}$

 $\lambda_{_0}$ คือ ความยาวคลื่นของแสงที่ตกกระทบ

 $k_{l,zi}$ คือ เวกเตอร์ของแสงในตัวกลาง คำนวนจากสมการที่ 2-25

$$k_{l,zi} = \begin{cases} k_{l,zi} = \left\{ +k_0 \left[n_l^2 - \left(k_{xi} / k_0 \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} & k_0 n_l > k_{xi}, \\ k_{l,zi} = \left\{ +jk_0 \left[\left(k_{xi} / k_0 \right) - n_l^2 \right]^{\frac{1}{2}} & k_{xi} > k_0 n_l \\ l = \mathbf{I}, \mathbf{II} & l = \mathbf{I}, \mathbf{II} \end{cases}$$
(2-25)

สามารถคำนวน R_i ได้จากการแก้สมการที่ 2-26 และ 2-27

$$\delta_{i0} + R_i = \sum_{m=1}^n w_{i,m} \left[c_m^{+} + c_m^{-} \exp(-k_0 q_m d) \right]$$
(2-26)

$$j[n_{I}\cos\theta\delta_{i0} - (k_{I,zi} / k_{0})R_{i}] = \sum_{m=1}^{n} v_{i,m} \left[c_{m}^{+} + c_{m}^{-}\exp(-k_{0}q_{m}d) \right]$$
(2-27)

โดยที่ _{Wi,m} คือ เมทริกซ์ของเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ (Eigenvector)

q_m คือ the รากที่สองเป็นบวกของค่าเฉพาะ (Eigenvalue) ของเมทริกซ์ A โดยเมทริกซ์ A สามารถคำนวนจากสมการที่ 2-28

$$A=K_r^2-E$$

(2-28)

โดยที่ E คือ เมทริกซ์ของฮาโมนิกของสภาพยอมไฟฟ้า

และ K_x คือ เมทริกซ์ทแยงมุม (Diagonal matrix)

$$c_m^+$$
 และ c_m^- ค่าคงที่ที่กำหนดจากเงื่อนไขขอบเขต

d กือ ความหนาของเกรตติง

 $v_{i,m}$ คือ ผลคูณของ $w_{i,m}$ และ q_m

และ m คือ เอลิเมนต์ของเมทริกซ์

สมการที่ 2-29 แสดงสมการสำหรับคำนวณค่าประสิทธิภาพการเลี้ยวเบนใน กรณีแสงโพลาไรซ์แบบ TE ของแสงที่ส่องผ่าน

$$DE_{ti} = T_i T_i^* \operatorname{Re}\left(\frac{k_{II,zi}}{k_0 n_1 \cos \theta}\right)$$
(2-29)

และค่า T_i สามารถคำนวนใค้จากการแก้สมการที่ 2-30 และ 2-31

$$\sum_{m=1}^{n} w_{i,m} \left[c_{m}^{+} \exp(-k_{0} q_{m} d) + c_{m}^{-} \right] = T_{i}$$
(2-30)

$$\sum_{m=1}^{n} v_{i,m} \left[c_{m}^{+} \exp(-k_{0} q_{m} d) + c_{m}^{-} \right] = j(k_{\text{II,zi}} / k_{0})T_{i}$$
(2-31)

สมการสำหรับคำนวณค่าประสิทธิภาพการเลี้ยวเบนในกรณีแสงโพลาไรซ์แบบ

TM ของแสงสะท้อน

$$DE_{ri} = R_i R_i^* \operatorname{Re}\left(k_{\mathrm{I},zi} / k_0 n_{\mathrm{I}} \cos\theta\right)$$
(2-32)

สามารถคำนวน R_i ได้จากการแก้สมการที่ 2-33 และ 2-34

$$\delta_{i0} + R_i = \sum_{m=1}^n w_{i,m} \left[c_m^{+} + c_m^{-} \exp(-k_0 q_m d) \right]$$
(2-33)

$$j\left[\left(\frac{\cos\theta}{n_{\rm f}}\right)\delta_{i0} - \left(\frac{k_{\rm L,zi}}{k_{\rm 0}n_{\rm I}^{2}}\right)R_{i}\right] = \sum_{m=1}^{n} v_{i,m}\left[c_{m}^{+} - c_{m}^{-}\exp(-k_{\rm 0}q_{m}d)\right]$$
(2-34)

สมการที่ 2-35 แสดงสมการสำหรับคำนวณค่าประสิทธิภาพการเลี้ยวเบนใน กรณีแสงโพลาไรซ์แบบ TE ของแสงสองผ่าน

$$DE_{ti} = T_i T_i^* \operatorname{Re}\left(\frac{k_{\Pi, zi}}{n_{\Pi}^2}\right) / \left(\frac{k_0 \cos\theta}{n_{\Pi}}\right)$$
(2-35)

และค่า T_i สามารถคำนวนใค้จากการแก้สมการที่ 2-36 และ 2-37

$$\sum_{m=1}^{n} w_{i,m} \left[c_{m}^{+} \exp(-k_{0} q_{m} d) + c_{m}^{-} \right] = T_{i}$$
(2-36)

$$\sum_{m=1}^{n} v_{i,m} \left[c_{m}^{+} \exp(-k_{0} q_{m} d) + c_{m}^{-} \right] = j \left(\frac{k_{\mathrm{I},zi}}{k_{0} n_{\mathrm{II}}^{2}} \right) T_{i}$$
(2-37)

2.4 การตรวจวัดคลื่นอัลตราซาวด์

2.2.1 คลื่นอัลตราชาวด์ (Ultrasound wave)

คลื่นอัลตราซาวน์เป็นคลื่นกลมีลักษณะเป็นคลื่นของความคันเคลื่อนที่ผ่าน ตัวกลางมีความถิ่มากกว่า 20 kHz หรือเรียกว่าความถิ่ที่สูงกว่าหูมนุษย์ได้ยินขึ้นไปจนถึง 1 GHz คลื่นอัลตราซาวค์มีลักษณะเป็นคลื่นตามยาว (Longitudinal Wave) อนุภาคในตัวกลางที่เสียงเดิน ทางผ่านเคลื่อนที่ขนานกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น คลื่นอัลตราซาวค์ในช่วงความถิ่ต่าง ๆ ถูก นำมาประยุกต์ใช้งานหลากหลายรูปแบบ คังรูปที่ 2.15



2.2.2.1 การใช้ประโยชน์ของคลื่นอัลตราชาวค์ในทางการแพทย์

 การสร้างภาพทางการแพทย์ เป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและ ยาวนาน ตั้งแต่กริสตศักราช 1960 คลื่นอัลตราซาวด์สามารถใช้ในการสร้างภาพเนื้อเยื่อหรืออวัยวะ ต่าง ๆ ภายในร่างกายโดยหลักการ คือ การปล่อยคลื่นอัลตราซาวด์ที่มีความถี่ในช่วง 1 MHz ถึง 10 MHz ไปบนผิว คลื่นอัลตราซาวด์เดินทางผ่านไปยังเนื้อเยื่อและเกิดการสะท้อนกลับมายังตัวตรวจวัด เมื่อเสียงเดินทางผ่านตัวกลางที่มีก่าความต้านทานเสียง (Acoustic Impedance) ที่แตกต่างกัน คลื่นอัล ตราซาวด์ที่วัดได้สามารถแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าและแสดงผลเป็นภาพตัดขวางของเนื้อเยื่อได้ (Rantanen & Ewing III, 1981) ดังรูปที่ 2.16 ก. แสดงภาพตัดขวางของหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา (Aorta) นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาการเทคนิคสร้างภาพด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ที่สามารถช่วยในการ วินิจฉัยโรคบางชนิดได้ เช่น อีลาสโตกราฟี (Elastography) เป็นการถ่ายภาพที่สามารถแสดงความ คุณสมบัติความหยืดหยุ่น (Elastic) และความแข็ง (Stiffness) ของเนื้อเยื่อเพื่อการวินิจฉัยทาง การแพทย์ เช่น เนื้อเยื่อที่มีมะเร็งจะมีความแข็งมากกว่าเนื้อเยื่อปกติ และการถ่ายภาพความละเอียด สูง (Super Resolution Imaging) เป็นการใช้คลื่นอัลตราซาวด์ในการติดตาม ไมโครบับเบิ้ล (Microbubbles) ที่เกิดขึ้นในเส้นเลือดจากการกระเจิงของคลื่นอัลตราซาวด์ เป็นต้น (Seo & Kim, 2017)

การรักษาในทางการแพทย์ นอกจากถูกนำมาใช้ในการสร้างภาพ

แล้วคลื่นอัลตราซาวด์ที่มีความเข้มสูง (High Intensity Focused Ultrasound : HIFU) สามารถนำมาใช้ ในการรักษามะเร็งในช่องท้องและรักษาโรคทางสมองโดยไม่ต้องทำการผ่าตัด (Seo & Kim, 2017) หลักการของการรักษาคือการใช้คลื่นอัลตราซาวด์ที่มีความเข้มสูงโฟกัสบนเนื้อเยื่ออันตรายเพื่อสร้าง ความร้อนเพื่อทำลายเนื้อเยื่อบริเวณดังกล่าว (Izadifar, Izadifar, Chapman, & Babyn, 2020) ดังรูปที่ 2.16 ข.



รูปที่ 2.16 ก. แสดงภาพถ่ายตัดขวางของหลอดเลือดแดงเอออร์ตา และ ข. แสดงการ โฟกัสกลื่นอัลตราซาวด์บนเนื้อเยื่ออันตราย ที่มา: Takano et al., 2021; Izadifar, Izadifar, Chapman, & Babyn, 2020

2.2.2.2 การถ่ายภาพด้วยเทคนิคการใช้กลื่นโฟโตอะดูสติก

การถ่ายภาพด้วยเทคนิคการใช้คลื่นอะคูสติกเป็นการประยุกต์ใช้

กลื่นอัลตราซาวด์ในการวิจัย วิธีนี้สามารถสร้างภาพของตัวอย่างที่มีขนาดเล็ก เช่น เซลล์เคี่ยว (Single cell) (Strohm, Moore, & Kolios, 2016) หรือสมองของหนูทดลอง (Yao et al., 2015) เป็นต้น หลักการของการถ่ายภาพอัลตราซาวด์ด้วยคลื่นอะดูสติก คือ การสร้างคลื่นโฟโตอะดูสติก โดนการ ใช้แสงเลเซอร์ที่มีลักษณะพลัลส์ที่มีความถิ่มากกว่า 1 kHz กระตุ้นเซลล์หรือเนื้อเยื่อทำให้อุณหภูมิ ของเซลล์หรือเนื้อเยื่อสูงขึ้นและเกิดการหดและขยายตัว ทำให้เกิดคลื่นความดัน (Pressure Wave) ในเนื้อเยื่อในรูปของคลื่นเสียงความถิ่สูงและสามารถตรวจวัดได้บริเวณภายนอกของเนื้อเยื่อ (Wang & Yao, 2016) เมื่อนำสัญญาณที่วัดได้มาผ่านกระบวนการปรับปรุงสัญญาณ (Signal Processing) การ ประกอบภาพขึ้นมาจากสัญญาณที่ได้ (Image Reconstruction) และการประมวลผลภาพ (Image Processing) ดังรูปที่ 2.17



2.2.2.3 การใช้ประโยชน์ของคลื่นอัลตราซาวค์ในอุตสาหกรรมอาหาร

 การใช้ประโยชน์ของคลื่นอัลตราซาวด์ความเข้มต่ำ (Low-intensity Ultrasound) มักใช้สำหรับการตรวจวัดและการตรวจหาข้อมูลทางเคมิฟิสิกส์ (Physicochemical Characteristics) ของอาหาร เช่น โครงสร้างและความแน่นเนื้อ (Firmness) เป็นต้น หลักการของการ ตรวจวัด คือ การวัดสัมประสิทธิ์การลดทอน (Attenuation Coefficient) ของอัลตราซาวด์ที่เกิด ทางผ่านผลิตภัณฑ์อาหาร ทำให้สามารถตรวจวัดองค์ประกอบที่เปลี่ยนแปลงไปได้ (BermúdezAguirre, Mobbs, & Barbosa-Cánovas, 2011) นอกจากนี้คลื่นอัลตราซาวค์ที่มีความถี่สูงถูกนำใช้ใน กระบวนการแปรรูปอาหาร (Food Processing) เช่น การใช้คลื่นอัลตราซาวค์ในเครื่องเพิ่มความชื้น (Humidifier) เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นของผลไม้และผัก รวมถึงในระบบทำความชื้นให้เป็นเนื้อสัตว์ใน ห้องเย็นเพื่อเพิ่มคุณภาพของอาหารและลดการที่เนื้อสัตว์มีน้ำหนักลดลงในระหว่างการเก็บรักษา (Mohammed & Alhajhoj, 2019)

2) การใช้ประโยชน์ของคลื่นอัลตราซาวด์ความเข้มสูง (High-intensity Ultrasound) ใช้ในการเปลี่ยนคุณสมบัติทางฟิสิกส์และทางเคมีของอาหาร คลื่นอัลตราซาวด์ที่มีความ เข้มสูง แต่ความถี่ต่ำสามารถใช้ในกระบวนการทำความสะอาด การทำให้เกิดอิมัลชัน (Emulsification) และการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการใช้คลื่นอัลตราซาวด์ในการ แปรรูปอาหาร เช่น ในกระบวนการอบแห้งผลไม้ การใช้คลื่นอัลตราซาวด์ความเข้มสูงที่อุณหภูมิต่ำ จะช่วยในการกำจัดน้ำออกจากอาหาร ซึ่งวิธีนี้สามารถลดระยะเวลาในการแปรรูปได้อีกด้วย (Mohammed & Alhajhoj, 2019)

2.2.3 เทคนิคหรือกระบวนการตรวจวัดคลื่นอัลตราซาวด์



2.2.3.1 การตรวจวัดคลื่นอัลตราซาวด์ด้วยปรากฏารณ์เพียโซอิเล็กทริก

รูปที่ 2.18 แสดงการเปลี่ยนแปลงของประจุไฟฟ้าเมื่อวัสดุเพียโซอิเล็กทริกถูกยืดและถูกกด ที่มา: Manbachi & Cobbold, 2011 ้วัสดุเพียโซอิเล็กทริกมีกุณสมบัติในการแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็น

พลังงานกล รวมถึงแปลงกลับจากพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ เรียกว่า ปรากฏการณ์เพียโซอิ เล็กทริก (Piezoelectric Effect) วัสดุเพียโซอิเล็กทริกมีหลากหลายชนิดและสามารถพบเจอได้ใน ธรรมชาติ เช่น คริสตัลควอซ (Crystal Quartz) โทแพซ (Topaz) รวมถึงอวัยวะในร่างกายกายของเรา เช่น เอ็น (Tendon) หรือ กระดูก (Bone) ก็มีคุณสมบัติที่น่าสนใจนี้เช่นกัน หลักการของปรากฏการณ์ นี้ คือ โดยปกติการวัสดุนี้มีสภาพไฟฟ้าแบบไดโพลโมเมนต์ (Dipole Moment) บริเวณที่มีการกระจุก ด้วของอิเล็กตรอนอย่างหนาแน่นจะมีลักษณะเป็นขั้วลบ และบริเวณที่มีการกระจายตัวของ อิเล็กตรอนจะมีลักษณะเป็นขั้วบวก หรือมีความเป็นขั้วลบน้อยกว่า และเมื่อมีแรงกลหรือคลื่น อัลตราชาวด์ที่มีลักษณะเป็นคลื่นกลกดลงบนวัสดุเพียโซอิเล็กทริก ทำให้เกิดการเรียงตัวใหม่ของ อิเล็กตรอน ดังรูปที่ 2.18 และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของความหนาแน่นของประจุไฟฟ้าบนผิว (Surface Charge Density) และความดันไฟฟ้า (Voltage) (Manbachi & Cobbold, 2011)

ในปัจจุบันวัสคุเพียโซอิเล็กทริกถูกนำมาใช้เป็นทรานสดิวเซอร์ (Transducer) ใช้ทั่วไปในการตรวจวัดและสร้างกลื่นอัลตราซาวด์ โดยเฉพาะในทางการแพทย์ทั้งใน ด้านการรักษาและการวินิจฉัย ในการรักษาเช่น การใช้กลื่นอัลตราซาวด์การรักษามะเร็ง (Wood & Sehgal, 2015) ในการวินิจฉัยโดยการนำมาใช้ในการสร้างภาพทางการแพทย์เพื่อดูกวามผิดปกติของ อวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย (Wells, 2006) เป็นต้น

2,2.3.2 การตรวจวัดคลื่นอัลตราซาวด์ด้วยแสง

ในการตรวจวัดคลื่นอัลตราซาวด์ด้วยเซนเซอร์แสงได้มีการถูก นำมาใช้เนื่องจากเซนเซอร์แสงเป็นเซนเซอร์ที่ให้ความไวในการตรวจจับที่สูง มีความแม่นยำ รวมถึง ตัวระบบมีขนาดไม่ใหญ่มากทำให้เป็นที่นิยมนำมาใช้ในการตรวจวัด ระบบเซนเซอร์แสงรูปแบบ ต่าง ๆ ได้ถูกนำมาออกแบบและใช้ในการตรวจวัดคลื่นอัลตราซาวด์ ได้แก่

 การวัคกลื่นอัลตราซาวค์ค้วยฟรีสเปซออปติก (Free Space Optics Based Ultrasound Detection) เป็นการตรวจวัคการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากคลื่นอัลตราซาวค์ เช่น การขยับหรือเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนแปลงความเร็วที่ระนาบ หรือการเปลี่ยนแปลงของค่าคัชนี หักเหของแสง เป็นต้น ตัวอย่างระบบแบบฟรีสเปซออปติก ได้แก่ ระบบที่ใช้หลักการการแทรกสอด ของแสงชนิด ไมเคิลสัน (Michelson Interferometry) โดยใช้ประยุกต์ใช้หลักการของการแทรกสอด ของแสงที่สะท้อนจากระนาบอ้างอิงและระนาบที่เคลื่อนที่จากการถูกกคด้วยคลื่นอัลตราซาวค์ ทำให้ สามารถตรวจวัดคลื่นอัลตราซาวด์ได้ ดังรูปที่ 2.19 ก. (Abu-Taha & Jabr, 2014) และการประยุกต์ใช้ ฟาบรี-เปโรต์ประเภทฟิล์มพอลิเมอร์ที่เคลือบด้วยอะลูมิเนียมที่มีค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนที่ไม่ เท่ากัน โดยด้านหนึ่งแสงสะท้อนได้บางส่วนและอีกด้านหนึ่งแสงสะท้อนได้ทั้งหมด ฟาบรี-เปโรต์ ประเภทฟิล์มพอลิเมอร์จะใช้หลักการการที่คลื่นอัลตราซาวด์ทำให้ความหนาของฟิล์มพอลิเมอร์ เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เฟสของแสงที่สะท้อนกลับมาจากกระจกอะลูมิเนียมทั้ง 2 ด้านของฟิล์มพอลิ เมอร์เกิดการเปลี่ยนแปลงและความเข้มแสงเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการแทรกสอดของแสง (Beard, Perennes, & Mills, 1999) ดังรูปที่ 2.19 ข.



รูปที่ 2.19 แสดงลักษณะการตรวจวัคคลื่นอัลตราซาวค์ ก. ระบบที่อาศัยหลักการการแทรกสอดของ แสงชนิดไมเคลสัน และ ข. การแทรกสอดแบบฟาบรี-เปโรต์ประเภทฟิล์มพอลิเมอร์ ที่มา: คัดแปลงมากจาก Dong, Sun, & Zhang, 2017

2) การวัดคลื่นอัลตราซาวค์ด้วยการใช้ไฟเบอร์ออปติก (Fiber Optics Based Ultrasound Detection) ข้อดีของการใช้ไฟเบอร์ออปติกคือต้นทุนไม่สูง หลักการในการ ตรวจวัดคลื่นอัลตราซาวค์มีลักษณะคล้ายกับแบบฟรีสเปซออปติกคือเป็นการวัดเฟสที่เปลี่ยนแปลง ของแสงจากการเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีหักเหของไฟเบอร์ออปติกที่เกิดจากคลื่นอัลตราซาวค์ ดัง รูปที่ 2.20 แสงจะเดินทางผ่านไฟเบอร์ออปติกค้านล่างที่เป็นเส้นทางที่ค่าดัชนีหักเหเปลี่ยนแปลงด้วย คลื่นอัลตราซาวค์และเส้นทางด้านบนคือเส้นทางอ้างอิง แสงจากสองเส้นทางเกิดการแทรกสอด ทำ ให้สามารถวัดคลื่นอัลตราซาวค์ได้ (Lan, Zhou, & Xie, 2018) เป็นต้น



รูปที่ 2.20 แสดงการตรวจคลื่นอัลตราซาวด์ด้วยไฟเบอร์ออปติก ที่มา: Ma et al., 2021

3) การวัคคลื่นอัลตราซาวค์วงแหวนสั่นพ้องขนาคไมครอน (Optical Ring Resonator) โดยปกติวงแหวนสั่นพ้องถูกนำมาใช้อย่างหลากหลาย เช่น ใช้ในการกรองความ ยาวคลื่นของแสง ใช้ในการตรวจวัคความคัน เป็นต้น หลักการของวงแหวนสั่นพ้องคือการเคลื่อนที่ ของแสงผ่านตัวกลางนำแสงที่มีลักษณะเป็นวงวน (Loop) เมื่อขนาคของวงวนมีความเหมาะสมทำ ให้แสงเกิดการสั่นพ้องภายในวงวนนั้นได้ ดังรูปที่ 2.21 แสงที่ออกมาจากวงวนจะแทรกสอดกับแสง ที่ผ่านตัวกลางนำแสง ด้วยวิธีนี้สามารถใช้วัคคลื่นอัลตราซาวค์โดยการปล่อยคลื่นอัลตราซาวค์ลงบน วงแหวนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีหักเหของวงแหวนและรูปร่างของวงแหวน ทำให้ แสงที่เดินทางเข้าสู่วงแหวนเกิดการเปลี่ยนแปลง



รูปที่ 2.21 แสดงลักษณะของวงแหวนสั่นพ้อง ที่มา: Ahmed et al., 2016

4) การวัดคลื่นอัลตราซาวค์ด้วยการหลักการการอินเตอร์เฟซของแสง (Ultrasound Detection via Optical Interface) เป็นการเปลี่ยนแปลงความคันที่เกิดจากคลื่นอัลตรา ซาวด์ที่ผิวของอินเตอร์เฟซ เช่น ระบบที่ใช้หลักการสะท้อนของเฟรสเนล (Fresnel Reflection) เป็น วิธีที่ถือว่าง่ายที่สุดในการตรวจวัดคลื่นอัลตราซาวด์ ด้วยการใช้การอินเตอร์เฟซงองแก้วและ งองเหลวที่เป็นตัวกลางของคลื่นอัลตราซาวด์ ความดันจากอัลตราซาวด์จะทำให้ความหนาแน่นของ ตัวกลางทั้งสองเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ค่าดัชนีหักเหเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เมื่อวัดแสงที่สะท้อน ออกมาจากระบบดังรูปที่ 2.22 ก. จะทำให้สามารถตรวจวัดคลื่นอัลตราซาวด์ได้ อีกระบบหนึ่งที่มี การนำมาใช้ในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีหักเหของตัวกลางที่เปลี่ยนแปลง คือ ระบบ เซนเซอร์ที่ใช้เทคนิคพลาสมอนบนพื้นผิวดังรูปที่ 2.22 ข. หลักการของเซนเซอร์ชนิดนี้คือ ปริซึม หรือแก้วจะถูกเคลือบด้วยโลหะมีตระกูล (Novel Metal) เช่น ทอง เงิน ทองแดง และ แพลทินัม เมื่อ แสงตกกระทบลงบนแก้วที่มุมพลาสมอนจะทำให้เกิดคลื่นอีวาสเนสเซนต์ (Evanescent Field) ส่งผล ให้แสงเกิดการสูญเสียพลังงาน เกิดเป็นแถบมืด (Dark Band) เมื่อค่าดัชนีหักเหของตัวกลางเปลี่ยนจะ ทำให้ดำแหน่งของแถบมืดเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย



2.5 พอลิไดเมทิลซิโลเซนหรือพีดีเอ็มเอส

พีดีเอ็มเอสเป็นพอลิเมอร์ที่อยู่ในกลุ่มของซิลิโคนอีลาสโตเมอร์ (Silicone Elastomer) มี ความหยึดหยุ่นสูง (Hyperelastic Material) การสังเคราะห์พีดีเอ็มเอสเกิดขึ้นครั้งแรกในปีคริสต ศักราช 1950 (Victor, Ribeiro, & Araújo, 2019) ในช่วงแรก พีดีเอ็มเอสถูกใช้ในการห่อหุ้มอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการยืดอายุการใช้งานของชิป (Chip) แต่หลังจากมีการศึกษาคุณสมบัติต่าง ๆ แล้ว พีดีเอ็มเอสจึงถูกนำมาใช้ในเทคโนโลยีที่มีขนาคระดับไมโครและนาโนเมตร

2.5.1 โครงสร้างของพีดีเอ็มเอส

พี่ดีเอ็มเอสอยู่ในกลุ่มของไซล๊อกเซน (Siloxane) เป็นกลุ่มพึงชันก์ที่เชื่อมโยงกัน ด้วยพันธะของซิลิคอนและออกซิเจน (Si-O-Si) หลักการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชนิคนี้คือการเชื่อม ซิลิคอน ออกซิเจนและหมู่เมทิล (Kuncova-Kallio & Kallio, 2006) ดังรูปที่ 2.23 อีกทั้งกลุ่มเมทิล สามารถแทนที่ด้วยหมู่อื่นๆ เช่น หมู่ฟีนิล หรือ หมู่ไวนิล รวมถึงกลุ่มของสารอนินทรีย์ (Inorganic) เพื่อให้ได้กุณสมบัติที่แตกต่างออกไป



รูปที่ 2.23 แสดง โครงสร้างทางเคมีของพีดีเอ็มเอส ที่มา: Guevara, Jones, Mullner, & Jankowski, 2020

2.5.1 คุณสมบัติทั่วไปของพิดีเอ็มเอส

พิดีเอ็มเอสมีคุณสมบัติที่ดีในการเป็นโครงสร้างที่มีขนาดในระดับไมครอน สามารถผลิตได้ง่ายและมีราคาไม่แพง รวมถึงพีดีเอ็มเอสมีเสถียรภาพทางความร้อน มีความโปร่ง แสง มีความเป็นฉนวนไฟฟ้าและความร้อน ในทางเคมีพีดีเอ็มเอสเป็นวัสดุที่มีความเสถียรทางเคมี และสามารถเสื่อมสภาพหรือสลายได้เร็วเมื่อเทียบกับพอลิเมอร์ตัวอื่น ในส่วนของข้อเสียนั้น ผิวของ พีดีเอ็มเอสมีคุณสมบัติไม่ชอบน้ำ (Hydrophobic) เนื่องจากหมู่เมทิล พีดีเอ็มเอสเป็นวัสดุที่มีสภาพ ซึมผ่านได้ (Permeability) ยอมให้แก็สสามารถแพร่เข้าไปได้และมีความหยืดหยุ่นสูง เนื่องจาก โครงสร้างของซิลิคอนและออกซิเจน พีดีเอ็มเอสสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ดีเมื่อมีแรงมากระทำ และ สามารถกลับคืนสู่สภาพเดินได้เมื่อเอาแรงที่มากระทำออกไป (Victor, Ribeiro & Araújo, 2019)

2.5.2 ความเข้ากันได้ทางชีวภาพกับร่างกายมนุษย์

หนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญของพีคีเอ็มเอส คือ ความเข้ากันได้ทางชีวภาพกับ เนื้อเยื่อต่าง ๆ ได้ดี โดยปกติเมื่อมีการฝัง (Implant) อุปกรณ์หรืออวัยวะเทียมลงในร่างกายมนุษย์ ทำ ให้เกิดการอักเสบขึ้นได้ เนื่องจากปฏิกิริยาของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ด้วยสาเหตุนี้ทำให้ต้องมี การหาวัสดุที่ส่งผลกระทบต่อเนื้อเยื่อต่าง ๆ น้อยที่สุด และพีดีเอ็มเอสเป็นพอลิเมอร์ที่ถูกศึกษาว่า สามารถเข้ากับเนื้อเยื่อได้ และได้มีการใช้พีดีเอ็มเอสเคลือบลงบนอุปกรณ์ที่ต้องการทำการฝังลงใน ร่างกายของมนุษย์และสัตว์ (Hassler, Boretius, & Stieglitz, 2011)



บทที่ 3

ระเบียบวิธีการวิจัย

3.1 ตารางแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการคำเนินงานของงานวิจัยการทำโมดูเลชันของความเข้มแสงบนระนาบภาพ สำหรับการสร้างเซนเซอร์ระดับไมครอนเพื่อใช้ตรวจวัดกลื่นอัลตราซาวค์ ดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอน	เดือน	เดือน	เดือน	เดือน	เดือน	เดือน	เดือน	เดือน
	1-3	2-6	7-9	10-12	13-15	16-18	19-21	22-24
 การรวบรวมและศึกษา 								
ข้อมูลเบื้องต้น								
2. การออกแบบและพัฒนา								
ระบบทางเดินแสงระบบการ		/ • •			Situ			
ทำโมดูเลชั่นของความเข้ม					S			
แสงบนระนาบภาพสำหรับ								
การฉายภาพ 🔗	ยารังเ	2 m	Baul	sit				
4. จำลองผลลัพธ์ของการ			1.0					
ตรวจวัดกลื่นอัลตราซาวด์								
ด้วยพิดีเอ็มเอสแบบเรียบ								
และพิดีเอ็มเอสแบบยืดหยุ่น								
5. การสร้างและขึ้นรูป								
ลวดลายสำหรับใช้เป็น								
แม่พิมพ์ของโครงสร้างเกรต								
ติงที่สามารถนำไปประยุกต์								
ใช้ในการตรวจวัคคลื่นอัล								
ตราซาวด์								

ตารางที่ 3.1 แผนการดำเนินงาน (ต่อ)

ขั้นตอน	เดือน							
	1-3	2-6	7-9	10-12	13-15	16-18	19-21	22-24
5. การวิเคราะห์ลวดลายของ								
แม่พิมพ์ที่สร้างด้วยระบบการ								
ทำโมดูเลชั่นของความเข้ม								
แ สงบน ระนาบภาพสำหรับ								
การฉาย ภาพในกระบวนการ								
โฟโตลิโท กราฟี								
 เขียนบทความวิจัยและ 		15						
ตีพิมพ์ผลงานวิจัย								
7. จัดทำวิทยานิพนธ์								

3.2 การออกแบบและจัดเรียงทางเดินแสง (Optical alignment) ของระบบการทำ โมดูเลชันของความเข้มแสงบนระนาบภาพสำหรับการฉายภาพในกระบวนการโฟโตลิ โทกราฟี

3.2.1 อุปกรณ์และส่วนประกอบของทางเดินแสงของระบบที่มีการทำโมดูเลชันของความ เข้มแสงบนระนาบภาพสำหรับกระบวนการโฟโตลิโทกราฟี

3.2.1.1 แหล่งกำเนิดแสงใช้หลอดไฟประเภทแอลอีดี (Light Emitting Diode: LED) กำลังไฟฟ้า 50 W หลอดไฟใช้แรงดันไฟฟ้า 30 V และมีขนาดเส้นทแยงมุมเท่ากับ 30 mm ดัง รูปที่ 3.1 ก. แสดงลักษณะของหลอดไฟยูวีแอลอีดี และจากการวัดการวัดสเปกตรัมของแสงจาก หลอดไฟที่วัดด้วยเครื่องออฟติกอลสเปกโทรมิเตอร์ (Optical Spectrometer) ยี่ห้อ AVANTES พบว่า หลอดไฟยูวีแอลอีดีให้แสงที่มีช่วงกวามยาวกลิ่น 350 nm ถึง 450 nm ดังรูปที่ 3.1 ข.



45

รูปที่ 3.1 ก. แสดงสักษณะของหลอดไฟชูวีชนิดแอลอีดี และ ข. สเปกตรัมของหลอดไฟชูวีชนิดแอลอีดี

3.2.1.2 ระบบส่องสว่างแบบโคเลอร์ (Köhler Illumination) ถูกออกแบบสำหรับ ใช้ในการรวมแสงจากหลอดไฟให้เป็นลำแสงสม่ำเสมอ (Uniform Beam) มีหน้าคลื่นเท่ากันและ ปรับลำแสงให้มีขนาดใกล้เคียงกับอุปกรณ์กระจกขนาดไมครอนแบบดิจิทัล ก่อนฉายไปบนอุปกรณ์ กระจกขนาดไมครอนแบบดิจิทัล ประกอบไปด้วยเลนส์นูนสองค้านจำนวน 3 ชิ้น ได้แก่ เลนส์เก็บ รวบรวมแสง (Collecting Lens) เลนส์สนาม (Field Lens) และเลนส์กอนเดนเซอร์ (Condenser Lens) ดังรูปที่ 3.2 หลักในการเลือกเลนส์ที่จะนำมาประกอบในส่วนนี้ได้แก่ ขนาดของเลนส์ ระยะโฟกัส ของเลนส์ และค่าความสามารถในการเก็บรวบรวมแสงของเลนส์ คำนวณได้จากสมการที่ 2.2 เลนส์ สนามและเลนส์คอนเดนเซอร์ทำหน้าที่ปรับขนาดของลำแสงให้พอดีหรือใกล้เคียงกับขนาดของ อุปกรณ์กระจกขนาดไมครอนแบบดิจิทัล โดยคำนวณจากระยะโฟกัสของเลนส์ทั้งสองชิ้น ดัง สมการที่ 3.1

กำลังขยาย =
$$\frac{f_2}{f_1}$$
 (3-1)

โดยที่ f_1 คือ ระยะ โฟกัสของเลนส์ตัวหน้า f_2 คือ ระยะ โฟกัสของเลนส์ตัวหลัง



รูปที่ 3.2 แสดงระบบส่องสว่างแบบโคเลอร์

3.2.1.3 อุปกรณ์กระจกขนาดใมครอนแบบคิจิทัลเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ทำโมดูเลชั่นของแสงเชิงพื้นที่ อุปกรณ์กระจกขนาคไมครอนแบบดิจิทัลที่เลือกใช้เป็นรุ่น DLP2010 ของบริษัท Texas Instrument ที่ประกอบอยู่กับอุปกรณ์ฉายภาพประเภทดีแอลพี (Digital light Processing Projector : DLP) ซึ่งมีรายละเอียด ดังตารางที่ 3.2 และรูปที่ 3.3 แสดงลักษณะของ อุปกรณ์กระจกงนาดใมครอนแบบคิจิทัล

ตารางที่ 3.2 แสดงกุณสมบัติของอุปกรณ์กระจกขนาดใมครอนแบบดีจีทัล				
รายละเอียด	คุณสมบติ			
ชื่อรุ่น	DLP2010			
ขนาดของจอ (เส้นทแยงมุม)	7.34 mm			
อัตราส่วน	16:9			
ขนาดอาร์เรย์ <i>จีปรังสิต</i>	$R009^{854} \times 480 \text{ pixels}^2$			
มุมในการปรับของกระจก	17°			



รูปที่ 3.3 แสดงลักษณะของอุปกรณ์กระจกขนาดไมครอนแบบดิจิทัล

3.2.1.4 เลนส์ใกล้วัตถุ จะทำหน้าที่ในการรับภาพบนอุปกรณ์กระจกขนาด ใมครอนแบบดิจิทัลและฉายลงบนแผ่นรองรับที่เคลือบด้วยสารไวแสง การเลือกเลนส์ในส่วนนี้ เลือกจากกำลังขยายหรือกำลังในการย่อภาพที่ด้องการฉายจากภาพบนอุปกรณ์กระจกขนาดไมครอน แบบดิจิทัลลงบนแผ่นรองรับและความละเอียดของเลนส์ในการเก็บและฉายภาพที่เล็กที่สุด สามารถ คำนวณจากสมการที่ 2-3 โดยทั่วไปเลนส์ใกล้วัตถุจะมีกำลังขยายภาพและค่าความสามารถในการ เก็บรวบต่างกันไป ในงานนี้ได้เลือกใช้เลนส์ใกล้วัตถุที่มีกำลังขยาย 4 เท่าและมีค่าความสามารถใน การเก็บรวบรวมแสงเท่ากับ 0.1

 ประเภทเลนส์ใกล้วัตถุ
 สังยุกจำกัด (Finite conjugated lens)

 กำลังบยาย
 4 เท่า

 NA
 0.1

 ระยะโฟกัส
 160 mm

ตารางที่ 3.3 แสดงคุณสมบัติเลนส์ใกล้วัตถุในระบบการทำโมดูเลชันของแสงบนระนาบภาพ

 3.2.1.5 แผ่นรองรับ ใช้เป็นแผ่นกระจกปิดสไลด์ (Cover Slip) ที่มีความหนา
 0.17 mm มีความกว้าง 18 mm และยาว 18 mm ในกระบวนการโฟโตลิโทกราฟีแผ่นรองรับจะถูก เคลือบด้วยสารไวแสงเพื่อสร้างลวดลาย

3.2.1.6 ตัวแยกแสง (Beam Splitter) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแบ่งแยกแสงที่เข้า มาออกเป็น 2 ทิศทาง ได้แก่ ทิศทางของการส่องผ่านและทิศทางของการสะท้อนตามแนวกระจกซึ่ง อยู่ตรงกลางของตัวแยกแสง ปริมาณของแสงที่สะท้อนและส่องผ่านจะถูกแบ่งไปในแต่ละทิศทางจะ ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นตามที่กำหนดไว้

3.2.1.7 อุปกรณ์บันทึกภาพ ในส่วนระบบบันทึกภาพออกสำหรับการตรวจสอบ ความคมชัดของภาพลวดลายจากอุปกรณ์กระจกขนาดไมครอนแบบดิจิทัลที่ถูกฉายลงบนแผ่น รองรับ อุปกรณ์บันทึกภาพที่ใช้ในระบบเป็นเซนเซอร์รับภาพของกล้องดีเอสแอลอาร์ (Digital Single-lens Reflex : DHLR) รุ่น E50 ของ Canon โดยในอุปกรณ์กล้องตัวนี้จะมีเซนเซอร์รับภาพ ขนาดและรายละเอียด ตารางที่ 3.4 ผลการรับภาพจะถูกสามารถดูได้จากการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ บันทึกภาพกับคอมพิวเตอร์ผ่านสายยูเอสบี

ประเภทเซนเซอร์	CMOS
ความละเอียดภาพสูงสุด	4752 x 3168 (15.1 MPixel)
ขนาดเซนเซอร์รับภาพ	$22.3 \times 14.9 \text{ mm}^2$
อัตราส่วนขนาด	3:2
ความหนาแน่นของพิกเซล	4.5 MPixel $/cm^2$
ขนาดของพิกเซลล์แต่ละพิกเซล	4.99 μm
ระบบกรองสี	RGB
ประเภทไฟล์	JPEG, RAW (14-bit, Canon original), sRAW, RAW+JPEG

ตารางที่ 3.4 แสดงคุณสมบัติและลักษณะของกล้องคีเอสแอลอาร์ ยี่ห้อ Canon รุ่น EOS 50D

ระบบทางเดินแสงระบบการทำโมดูเลชันของความเข้มแสงบนระนาบภาพ สำหรับการฉายภาพในกระบวนการโฟโตลิโทกราฟี ด้วยการใช้อุปกรณ์กระจกขนาดไมรอนแบบ ดิจิตอล ในการสร้างต้นแบบลวดลายที่ฉายลงบนแผ่นรองรับมีลักษณะดังรูปที่ 3.4 เส้นสีม่วงแสดง การเดินทางของแสงยูวี



รูปที่ 3.4 แสดงการออกแบบระบบการทำโมดูเลชั่นของความเข้มแสงบนระนาบภาพ สำหรับการฉายภาพในกระบวนการโฟโตลิโทกราฟี

3.2.2 การควบคุมการฉายภาพของอุปกรณ์กระจกขนาดใมครอนแบบดิจิทัล

อุปกรณ์กระจกขนาดไมครอนแบบดิจิทัลสามารถควบคุมได้ด้วยการใช้วงจร อิเล็กทรอนิกส์ที่มาพร้อมกันในตัวอุปกรณ์ฉายภาพ ซึ่งทำให้สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สาย (Wireless) กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือหรือ ไอแพด (iPad) ลวดลายที่ต้องการฉาย สามารถออกแบบได้บนอุปกรณ์ดังกล่าวและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์กระจกขนาดไมครอนแบบดิจิทัล เมื่อต้องการฉายภาพ เมื่อเราออกแบบลวดลายที่ต้องการและเปิดลวดลายให้ปรากฏขึ้นบนจอ ภาพ ลวดลายจะไปปรากฏบนอุปกรณ์กระจกขนาดไมครอนแบบดิจิทัล ดังรูปที่ 3.5



รูปที่ 3.5 ก. แสดงภาพโครงสร้างเกรตติงบนอุปกรณ์ใอแพคและ ข. แสดงภาพฉายโครงสร้าง เกรตติงบนอุปกรณ์กระจกขนาดไมครอนแบบดิจิทัล

ในงานวิจัยนี้จะสร้างลวดลายที่ต้องการบนผ่านแอปพลิเคชั่นที่มีชื่อว่า Keynote ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับนำเสนองาน สามารถสร้างลวดลายต่างๆ ได้หลากหลาย หน่วยของ ขนาดลวดลายที่สร้างบนแอพลิเคชั่นเป็นหน่วยพ้อยท์ (Point: pt) และเมื่อต้องการฉายภาพเต็มจอ ของอุปกรณ์กระจกขนาดไมครอนแบบดิจิทัลที่มีขนาดกว้าง 6.4 mm และยาว 3.6 mm ต้องฉายภาพ ลวดลายที่มีขนาดกว้าง 1925 pt และสูง 1085 pt บนแอปพลิเคชั่น จากความสัมพันธ์สามารถเขียน สมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดลวดลายบนแอพลิเคชั่นกับลวดลายที่ปรากฏบนอุปกรณ์ กระจกขนาดไมครอนแบบดิจิทัลได้ดังสมการที่ 3-2

$$\mathbf{S}_{ipad} = 300.78 \times \mathbf{S}_{DMD} \tag{3-2}$$

โดยที่ S_{ipad} คือ ขนาดของลวดลายที่ปรากฏบนไอแพด S_{DMD} คือ ขนาดของลวดลายที่ปรากฏบนอุปกรณ์กระจกขนาดไมครอนแบบดิจิทัล 3.3 การจำลองผลเชิงทฤษฎีของการตรวจวัดคลื่นอัลตราซาวด์ที่ใช้ตัวรับรู้เป็นพีดีเอ็มเอส แบบเรียบและพีดีเอ็มเอสแบบเกรตติง

 3.3.1 การจำลองผลการเปลี่ยนแปลงความหนาของพีดีเอ็มเอสแบบเรียบและพีดีเอ็มเอสแบบ เกรตติงจากการถูกกดด้วยความดันของคลื่นอัลตราชาวด์ที่มีความถี่ 1 MHz ด้วยการใช้ระเบียบวิธี ไฟในต์เอลิเมนต์บนโปรแกรม COMSOL Multiphysics 5.3a



ศึกษาการจำลองผลการกดของคลื่นอัลตราซาวด์ที่มีความถี่ 1 MHz บน โครงสร้างแบบ 2 มิติ ดังรูปที่ 3.5 โดยคลื่นอัลตราซาวดน์ที่ถูกปล่อยอย่างต่อเนื่องจะเดินทางผ่านน้ำ ที่เป็นตัวกลางโดยความเร็วที่คลื่นเสียงเดินทางผ่านน้ำมีค่าเท่ากับ 1,484 m/s (Dogru, Aksoy, Bayraktar, & Alaca, 2018) ไปตกกระทบลงบนโครงสร้างพีคีเอ็มเอสที่มีค่ามอดุลัสของยัง (Young's Modulus) เท่ากับ 123.4 MPa (Learkthanakhachon, Pechprasarn & Somekh, 2018) และมีค่า อัตราส่วนปัวซองเท่ากับ 0.43 (Chávez, Sosa, & Tsumura, 1985) ทั้งแบบเรียบ ดังรูปที่ 3.6 ก. และ แบบโครงสร้างเกรตติง ดังรูปที่ 3.6 ข. ขอบด้านซ้ายและขวาของแบบจำลองถูกออกแบบให้มีค่าซ้ำ ๆ อย่างต่อเนื่องหรือเป็นลักษณะคาบ (Periodic Boundary) สำหรับผลแบบจำลองการยุบตัวของพี ดีเอ็มเอสแบบเรียบภายใต้คลื่นอัลตราซาวด์ถูกศึกษาเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับผลของแบบจำลองการ ยุบตัวของพีคีเอ็มเอสแบบเกรตติง แบบจำลองการยุบตัวของพีคีเอ็มเอสแบบเกรตติงได้มีการศึกษา (1) ขนาดคาบ (Λ) (2) สัดส่วนของร่องเกรตติง (*FF*) และ (3) ความสูงของโครงสร้าง (d) ที่ส่งผลต่อ การยุบตัวของโครงสร้างพีคีเอ็มเอสเกรตติงภายใต้คลื่นอัลตราซาวด์ที่มีความถี่ 1 MHz ขนาดเมชใน การจำลองนี้มีขนาด 15 nm ถึง 300 nm

3.3.2 การจำลองผลเชิงแสงของระบบตรวจวัดคลื่นอัลตราซาวด์ที่มีการใช้พีดีเอ็มเอสแบบ เรียบและพีดีเอ็มเอสแบบเกรตติงเป็นตัวรับรู้



รูปที่ 3.7 แสดง โครงสร้างการจำลองผลค่าความสะท้อนของแสงของ ก. พิดีเอ็มเอสแบบเรียบ และ ข. พิดีเอ็มเอสแบบเกรตติง

ขั้นตอนนี้เป็นการจำลองผลค่าความสะท้อนของแสงที่สะท้อนออกจากระบบ ตรวจวัคคลื่นอัลตราซาวค์ที่มีการใช้พีคีเอ็มเอสแบบเรียบและพีคีเอ็มเอสแบบเกรตติงเป็นตัวรับรู้ ลักษณะระบบที่ทำการจำลองคังรูปที่ 3.7 โดยที่รูปที่ 3.7 ก. เป็นโครงสร้างการจำลองผลของพีคีเอ็ม เอสแบบเรียบและรูปที่ 3.7 ข. โครงสร้างการจำลองผลของพีคีเอ็มเอสแบบเกรตติง ทั้งสอง โครงสร้างใช้แหล่งกำเนิดของระบบตรวจวัค คือ แสงสีแคงที่มีความยาวคลื่น 633 nm แสงจะเดิน ทางผ่านแก้วที่มีค่าดัชนีหักเห (n_0) เท่ากับ 1.515 ตกกระทบทำมุม θ_0 กับแกนตั้งฉากลงบนรอยต่อ ระหว่างแก้วและพีคีเอ็มเอส ค่าดัชนีหักเหของพีคีเอ็มเอส (n_{pdms}) เท่ากับ 1.4298 เมื่อผ่านรอยต่อ แสงที่ส่องผ่านเข้าไปยังพีคีเอ็มเอสจะตกกระทบบนรอยต่อระหว่างพีคีเอ็มเอสกับน้ำ ซึ่งน้ำมีค่าดัชนี หักเห (n_{water}) เท่ากับ 1.3317 งานวิจัยนี้ทำการศึกษาผลของแสงที่มีโพลาไรซ์ทั้งแบบ TE และ TM ในการจำลองผลค่าความสะท้อนของแสง ในกรณีของพีคีเอ็มเอสแบบเรียบจะใช้หลักการของ เฟรสเนลในการคำนวณและกรณีของพีคีเอ็มเอสแบบเกรตติงจะใช้ทฤษฎีคลื่นควบคู่อย่างเคร่งครัค โดยทั้ง 2 วิธีจะถูกคำนวณบนโปรแกรม MATLAB 2019 สำหรับการจำลองผลของเกรตติงงานวิจัย นี้ได้ศึกษาเฉพาะผลของกรณีที่ระนาบตกกระทบขนานกับระนาบของเกรตติง คังรูปที่ 3.7 ข. และ คำนวณผลของลำคับการเลี้ยวเบนจำนวน 131 ลำคับ ในขั้นตอนนี้ยังรวมถึงจำลองการเปลี่ยนแปลง ของค่าความสะท้อนของแสงเมื่อพีคีเอ็มเอสแบบเรียบและพีคีเอ็มเอสแบบเกรตติงเปลี่ยนแปลงความ หนาอันเนื่องมาจากความคันของคลื่นอัลตราชาวค์ที่มีความถี่ 1 MHz อีกค้วย

3.3.3 พารามิเตอร์ที่ใช้ในการจำลองผลการเปลี่ยนแปลงความหนาและรูปร่างของพีดีเอ็ม เอส จากการถูกกดด้วยความดันของคลื่นอัลตราชาวด์ความถี่ 1 MHz และการจำลองผลเชิงแสงของ พีดีเอ็มเอสแบบเรียบและพีดีเอ็มเอสแบบเกรตติง

พารามิเตอร์		อ้างอิง				
การจำล <mark>องผลการเปลี่</mark> ยนแปลงความหนาและรูปร่างของพิดีเอ็มเอส						
ค่ามอคุลัสของยังของพี ่ดีเอ็มเอส	123.4 MPa	(Learkthanakhachon et al., 2018)				
อัตราส่วนปัวซอง	0.43	(Dogru et al., 2018)				
ก่ากวามเร็วในการเดินทางของ	1484 m/s	(Chávez et al., 1985)				
กลื่นอัลตราซาวค์ในน้ำ ที่อุณหภูมิ		sit				
20 องศาเซลเซียล	an Rang					
การจำลองผลเชิงแสง						
ความยาวกลื่นของแหล่งกำเนิด	633 nm					
ค่าดัชนีหักเหของแก้ว (n₀)	1.5150	(Kudo, Nagase, Kubo, Sugihara,				
		& Nakagawa, 2011)				
ก่าดัชนีหักเหของพิดีเอ็มเอส	1.4298	(Schneider, Draheim, Kamberger,				
(n_{pdms})		& Wallrabe, 2009)				
ค่าดัชนีหักเหของน้ำ (n _{water})	1.3317	(Hale & Querry, 1973)				

ตารางที่ 3.5 แสดงพารามิเตอร์ที่ใช้การจำลองผลเชิงทฤษฎี

3.3.4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการตรวจวัดคลื่นอัลตราชาวน์ด้วยพิดีเอ็มเอส แบบ เรียบและพิดีเอ็มเอสแบบเกรตติง

3.3.4.1 การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุนามกำลังสาม (Cubic Polynomial Regression Analysis)

ในการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการวัดหรือการจำลองผลมี ความสัมพันธ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่เป็นเชิงเส้น จึงทำการวิเคราะห์สัญญาณและปรับปรุง ผลลัพธ์ให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ โดยการหาสมการถดถอยที่อยู่ในรูปของพหุนามกำลัง สามโดยมีรูปแบบสมการดังนี้

$$R_T = aR^3 + bR^2 + cR + d \tag{3-3}$$

โดยที่ R_T คือ ค่าความสะท้อนของแสงหลังปรับปรุงสัญญาณ
 R คือ ค่าความสะท้อนของแสงก่อนปรับปรุงสัญญาณ
 a,b,c คือ d ค่าสัมประสิทธิ์ของสมการพหุนาม

3.3.4.2 การกำนวณความไวในการตอบสนอง

ความไวในการตอบสนอง คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าความสะท้อน ของแสงต่อปริมาณความคันของคลื่นอัลตราซาวด์ สามารถคำนวณจากสมการที่ 3-4

$$Sensitivity = \left| \frac{dR_T}{dP} \right| = \left| \frac{R_{T,UL} - R_{T,0}}{P} \right|$$
(3-4)

P คือ ความดันของคลื่นอัลตราซาวด์ที่เข้าสู่ระบบ

3.3.4.3 การคำนวณค่าความเป็นเซนเซอร์ที่ดี

ค่าความเป็นเซนเซอร์ที่ดี คือ อัตราส่วนระหว่างความไวในการ ตอบสนองและค่าความสะท้อนของแสงเริ่มต้นหรือก่อนปล่อยคลื่นอัลตราซาวค์ แสดงดังสมการที่

3-5

$$FoM = \left| \frac{Sensitivity}{R_{T,0}} \right|$$
(3-5)

3.3.4.4 ช่วงของการตอบสนอง (Detectable Range)

ช่วงของการตอบสนอง คือ ช่วงที่ค่าความสะท้อนของแสง เปลี่ยนแปลงและตอบสนองเป็นเส้นตรง เมื่อปล่อยคลื่นอัลตราซาวค์เข้าสู่ระบบ

3.4 การขึ้นรูปลวดลายด้วยกระบวนการโฟโตลิโทกราฟี

3.4.1 วัสดุ สารเคมีและอุปกรณ์สำหรับการสร้างลวดลายด้วยกระบวนการโฟโตลิโทกราฟี

3.4.1.1 แผ่นกระจกปิคส ไลค์สำหรับใช้เป็นแผ่นรองรับ 3.4.1.2 สาร ไวแสงแบบฟิล์มชนิคลบ ยี่ห้อ Eternal รุ่น ETERTEC HT-115T

ตารางที่ 3.6 แสดง <mark>กุณสมบัติขอ</mark> งสารไวแส	งชนิดฟิล์ม รุ่น ETERTEC HT-115T DRY FILM
PHOTORESIST	
ประเภท <mark>สารไวแสง</mark>	สารไวแสงชนิคฟิล์ม รุ่น ETERTEC HT-115T
ความหนาของสารไวแสง	40 μm
สีของสารไวแสงก่อนการฉายแสง	Rongsit เขียว
สีของสารไวแสงหลังการฉายแสง	น้ำเงิน
ความละเอียดที่สร้างได้	60 μm
เวลาในการสร้างด้วยดีเวลลอปเปอร์	39-48 s
ข้อแนะนำในการใช้	ใช้ในการเกลือบบนผิวของโลหะ
	ใช้สารเคมีในการกัดลวดลาย

ที่มา: Eternal Materials Co., 2019

3.4.1.3 อะซิโตน (Acetone)
3.4.1.4 ไอโซโพรพิวแอลกอฮอล์ (Isopropyl Alcohol : IPA)
3.1.1.5 ปีกเกอร์สำหรับใส่สาร (Beaker)
3.4.1.6 อ่างส่งคลื่นความถี่สูง (Sonicator Bath)
3.4.1.7 แก๊สโตรเจน (Nitrogen Gas)
3.4.1.8 ตู้อบลมร้อน ยี่ห้อ MEMMERT รุ่น UN55
3.4.1.9 น้ำปราศจากไออน (Deionized Water : DI Water)
3.4.1.10 น้ำยาดีเวลลอปเปอร์ ได้แก่ โซเดียมคาเบอเนต (Sodium Carbonate : Na₂CO₃) ผสมกับน้ำกลั่นในอัตราส่วน 4 g ต่อน้ำ 200 mL
3.4.1.11 เครื่องเกลือบบัตร
3.4.1.12 ไอแพด (iPad) รุ่น 2018

3.4.2 ขั้นตอนการทำความสะอาดและเตรียมแผ่นรองรับ

3.4.2.1 นำแผ่นกระจกปิดสไลด์แช่ลงในบีกเกอร์ที่ใส่อะซิโตนและนำบีกเกอร์ ลงไปแช่ในอ่างส่งคลื่นความถี่สูง ใช้เวลา 5 นาที
 3.4.2.2 นำแผ่นกระจกปิดสไลด์มาล้างต่อในบีกเกอร์ที่ใส่ไอโซโพรพิว แอลกอฮอล์และนำลงไปในอ่างส่งคลื่นความถี่สูง ใช้เวลา 5 นาที
 3.4.2.3 นำกระจกปิดสไลด์ล้างด้วยน้ำปราศจากไอออน
 3.4.2.4 เป่าด้วยในโตรเจนแล้วนำเข้าตู้อบลมร้อน ตั้งอุณหภูมิ 75°C ระยะเวลา 1
 ชั่วโมง

3.4.3 ขั้นตอนการสร้างลวดลายด้วยกระบวนการโฟโตลิโทกราฟี การสร้างลวดลายด้วยกระบวนการโฟโตลิโทกราฟี มีขั้นตอนดังนี้

3.4.3.1 การออกแบบลวคลายลงบนไอแพคที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์กระจกขนาค

ไมครอนแบบคิจิทัล

3.2.3.1 การทำความสะอาคแผ่นรองรับ มีรายละเอียดคังหัวข้อที่ 3.4.2
 3.4.3.2 การเคลือบสารไวแสงลงบนแผ่นรองรับที่ทำความสะอาคเรียบร้อยแล้ว
 นำแผ่นรองรับหรือแผ่นปีดสไลด์เคลือบด้วยสารไวแสงแบบฟิล์มชนิดลบ โดยการใช้เครื่องเคลือบ

บัตรรีคฟิล์มให้แนบสนิทไปกับแผ่นปีคสไลด์ที่อุณหภูมิห้อง เพราะสารไวแสงจะละลายเมื่อได้รับ ความร้อนสูงกว่า 120 °C

3.4.3.3 การฉายแสง นำแผ่นรองรับที่เกลือบด้วยสารไวแสงติดตั้งลงบน ระบบโฟโตลิโทกราฟีแบบไม่ใช่มาส์กแสงและฉายแสงที่มีลวดลายตามที่ต้องการลงบนแผ่นรองรับ โดยใช้ความยาวกลื่นหรือแหล่งกำเนิดแสงเฉพาะที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเกมีที่ทำให้สารไวแสงแบบ ฟีล์มชนิดลบแข็งตัวและไม่สามารถละลายได้ด้วยน้ำยาดีเวลลอปเปอร์

3.4.3.4 การล้างในน้ำยาดีเวลลอปเปอร์ นำแผ่นรองรับที่ฉายแสงแล้วไปแช่ลงใน น้ำยาดีเวลลอปเปอร์เพื่อล้างบริเวณที่ไม่ถูกแสงให้ละลายออกไป

3.4.3.5 เป่าด้วยในโตรเจนเพื่อทำให้แผ่นรองรับแห้งก่อนนำไปวิเคราะห์

3.4.4 การหาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการฉายแสงและขนาดลวดลายที่สร้างจาก กระบวนการโฟโตลิโทกราฟี

การหาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการฉายแสงและขนาดลวดลายที่สร้าง จากกระบวนการโฟโตลิโทกราฟีเป็นการศึกษาระยะเวลาในการฉายภาพที่มีผลต่อขนาดของ ลวดลายที่ได้ โดยการฉายเส้นตรงขนาด 240 μm บนอุปกรณ์กระจกขนาดไมครอนแบบดิจิทัล เลนส์ ใกล้วัตถุจะย่อภาพที่ฉายลง 4 เท่าแล้วฉายลงบนแผ่นรองรับ ทดลองฉายภาพลงบนแผ่นรองรับด้วย เวลาต่าง ๆ ได้แก่ 2 นาที 4 นาที 6 นาทีและ 8 นาที เวลาละ 3 ครั้ง ถ่ายภาพลวดลายที่ได้ด้วยกล้อง จุลทรรศน์แบบมาโครซูม (Macro Zoom Imaging System) ยี่ห้อ Olympus รุ่นMVX10 และวัดขนาด ของลวดลาย

3.5 การวิเคราะห์คุณภาพลวดลายเกรตติงที่ขึ้นรูปด้วยกระบวนการโฟโตลิโทกราฟี

3.5.1 การวิเคราะห์ความถูกต้องของลวดลายสร้างจากกระบวนการโฟโตลิโทกราฟีและ ความสามารถในการทำซ้ำที่สร้างจากกระบวนการโฟโตลิโทกราฟี

กระบวนการนี้เป็นการทดสอบความสามารถของระบบในการฉายภาพและ สร้างถวดลายที่ถูกต้องตามถวดลายต้นแบบโดยการสร้างถวดลายเกรตติงที่ใช้เป็นแม่พิมพ์สำหรับ สร้างเกรตติงที่มีขนาดคาบและมีค่าอัตราส่วนของร่องที่ดีที่สุดในการใช้เป็นตัวรับรู้ในการตรวจวัด กลื่นอัลตราซาวด์ที่มีความถี่ 1 MHz บนพีดีเอ็มเอส ใช้ระยะเวลาฉายที่ดีที่สุดจากการทำการทดลองที่ 3.4.4 บันทึกภาพที่ฉายบนแผ่นรองรับและฉายถวดลายบนแผ่นรองรับที่เคลือบด้วยสารไวแสง สำหรับการสร้างลวดลายในกระบวนการโฟโตลิโทกราฟี ทำซ้ำ 3 ครั้ง นำถวดลายที่สร้างได้ไปถ่าย ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบมาโครซูม แล้วเปรียบเทียบความถูกต้องและความคมชัดกับภาพต้นแบบ โดยการคำนวณหาค่าเฉลี่ย (Mean, ฐ) ของเกรตติง ด้วยสมการที่ 3-6 และคำนวณเปอร์เซ็นต์ความ ผิดพลาด (The Percent of Error: E) เปรียบเทียบกับลวดลายต้นแบบ ด้วยสมการที่ 3-7

$$\overline{\mathbf{x}} = \frac{\sum_{i=1}^{n} \mathbf{x}_{i}}{n}$$
(3-6)

- โดยที่ x_i คือ ขนาดของเกรตติงลำดับที่ i
 - i คือ ลำคับของเกรตติง
 - *n* คือ จำนวนเกรตติง

$$E = \frac{\left(\overline{\mathbf{x}} - X_T\right)}{X_T} \times 100 \tag{3-7}$$

โดยที่ X_T คือ ขนาดของเกรตติงที่ออกแบบตามฤษฎีและฉายลงบนแผ่นรองรับ

ในส่วนของการวิเคราะห์ความสามารถในการทำซ้ำโดยการคำนวนส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D.) ของขนาดถวดถายเกรตติงที่สร้างด้วยกระบวนการโฟ โตลิโทกราฟี ด้วยสมการที่ 3-8

$$S.D. = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2}{n-1}}$$
(3-8)

3.5.2 การวัดความคลาดเคลื่อนลวดลายเนื่องจากการเอียงของระบบแสง

การวัดความคลาดเคลื่อนลวดลายเนื่องจากการเอียงของระบบแสงสามารถทำได้ โดยการฉายลวดลายเกรตติงบนแผ่นรองรับที่เคลือบด้วยสารไวแสงสำหรับการสร้างลวดลายใน กระบวนการโฟโตลิโทกราฟี นำลวดลายที่สร้างได้ไปถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบมาโครซูมวัด

้งนาคเส้นของเกรตติงที่ฉายผ่านระบบแล้วเปรียบเทียบงนาคเกรตติงด้วยสมการที่ 3.9 ทำซ้ำ 3 ครั้ง
58

$$\Delta x = \frac{1}{2} \left(x_2 - x_1 \right)$$
 (3-9)

โดย x_1 และ x_2 คือ ความกว้างเส้นตรงในรูปที่ 3-9



รูปที่ 3.8 แสดงลักษณะการวัดขนาดลวดลายเพื่อนำไปคำนวณความคลาดเกลื่อนลวดลายเนื่องจาก



บทที่ 4

ผลการวิจัย

4.1 ผลการออกแบบและจัดเรียงทางเดินแสงของระบบการทำโมดูเลชันของความเข้มแสง บนระนาบภาพสำหรับการฉายภาพในกระบวนการโฟโตลิโทกราฟี

ระบบการทำโมดูเลชันของความเข้มแสงบนระนาบภาพสำหรับการฉายภาพใน กระบวนการโฟโตลิโทกราฟี ประกอบไปด้วย หลอดไฟแอลอีดีที่ให้แสงยูวี ระบบส่องสว่างแบบ โคเลอร์ อุปกรณ์กระจกขนาดไมครอนแบบดิจิทัลทำหน้าที่ฉายลวดลายต้นเบบ เลนส์ใกล้วัตถุที่มี กำลังขยาย 4 เท่า ทำหน้าที่ในการฉายภาพบนอุปกรณ์กระจกขนาดไมครอนแบบดิจิทัลลงบนแผ่น รองรับ ตัวแยกแสงและเซนเซอร์รับภาพทำหน้าที่เก็บภาพลวดลายบนแผ่นรองรับ ดังรูปที่ 4.1



รูปที่ 4.1 แสดงผลการจัดเรียงทางเดินแสงระบบการทำโมดูเลชันของความเข้มแสงบนระนาบภาพ

4.1.2 การเทียบขนาดลวดลายที่ต้องการสร้างและการศึกษาเวลาที่ฉายแสงที่มีผล ต่อขนาดลวดลายที่ฉายได้

จากการฉายภาพที่มีขนาดกว้าง 240 µm บนอุปกรณ์กระจกขนาดไมครอนแบบ ดิจิตอล เมื่อฉายผ่านเลนส์ใกล้วัตถุ ลวดลายมีขนาดคลดลงเหลือ 60 µm รูปที่ 4.2 ก. แสดงลวดลายที่ ฉายลงบนแผ่นรองรับบันทึกผ่านกล้องในระบบการทำโมดูเลชันของความเข้มแสงบนระนาบภาพ รูปที่ 4.2 ข. แสดงลวดลายเส้นตรงที่ได้จากกระบวนการโฟโตลิโทกราฟี ใช้เวลาที่ฉายเวลา 2 นาที และรูปที่ 4.2 ค. แสดงลวดลายเส้นตรงที่ลายด้วยเวลา 8 นาทีพบว่าเวลาที่ฉายภาพมีผลต่อขนาด ลวดลายที่สร้างได้ โดยเวลาที่ฉายภาพที่ 2 นาทีจะให้ขนาดลวดลายที่เล็กกว่าลวดลายที่ฉายด้วยเวลา 8 นาที ตารางที่ 4.1 เสดงผลความกว้างของเส้นตรงที่สร้างได้จากการฉายแสงที่เวลา 2 นาที 4 นาที 6 นาทีและ 8 นาที



รูปที่ 4.2 ก. แสดงจากการฉายภาพเส้นตรงที่มีขนาด 60 µm ลงบนสารไวแสงแบบฟิล์มชนิดลบ และ ลวดลายที่ขึ้นรูปด้วยกระบวนการโฟโตลิโทกราฟี ใช้เวลาฉายแสงที่ 2 นาที และ 8 นาที

เวลาที่ฉาย	ขนาคลวคลายที่วัคได้ (μm)					
(นาที)	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้ง 3	เฉลี่ย		
2	59.17	57.5	65.00	60.56		
4	72.50	75.00	72.50	73.33		
6	72.52	77.5	79.12	76.38		
8	77.52	74.37	78.75	76.88		

	r ۷		,
a	44 IV	S 1 S A S A	a 1
ดารา.ๆทั/เป	แสดงขบบอลวดลายท่าบราโด้วยกระบวา	เการไฟ โตลไทกราฟ	ຈາຍແສງທ່າລາຫາງ ຕ
YI IJ IN VI 4.1		3	
	9		•

จากผลการศึกษาพบว่าเมื่อเวลาในการฉายมากขึ้นจะทำให้ลวดลายที่ได้มีขนาด ใหญ่ขึ้นเนื่องจากการที่ฉายแสงนานเกินไป (Overexposure) ทำให้สารไวแสงเกิดการจับตัวกันแน่น ไม่สามารถล้างส่วนที่อยู่รอบๆ บริเวณที่ฉายภาพได้ (Zhang & Songjing, 2018)

4.2 ผลการจำลองผลเชิงทฤษฎีของการตรวจวัดคลื่นอัลตราซาวด์ด้วยตัวรับรู้พิดีเอ็มเอส แบบเรียบและพิดีเอ็มเอสแบบเกรตติง

4.2.1 ผลการจำลองผลค่าความสะท้อนของระบบตรวจวัดคลื่นอัลตราซาวด์ที่มีเป็นตัว รับรู้เป็นพี่ดีเอ็มเอสแบบเรียบและพี่ดีเอ็มเอสแบบเกรตติง

เมื่อแสงเดินทางตกกระทบไปบนรอยต่อระหว่างตัวกลางที่มีค่าดัชนีหักเห ต่างกัน เกิดปรากฏการณ์การส่องผ่านและการสะท้อนของแสงบนรอยต่อ ตัวแปรที่ส่งผลต่อ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น คือ มุมตกกระทบของแสง (θ_i) ถ้ามุมตกกระทบน้อยกว่ามุมวิกฤต (Critical Angle: θ_c) แสงบางส่วนจะเดินทางผ่านรอยต่อและส่องผ่านไปได้ ดังรูปที่ 4.3 ก. แต่ในกรณีที่มุม กระทบมากกว่ามุมวิกฤต แสงจะเกิดการสะท้อนกลับหมด (Total Internal Reflection) ดังรูปที่ 4.3 ค. และกรณีที่มุมตกกระทบมีก่าเท่ากับมุมวิกฤต แสงจะเดินทางไปตามรอยต่อระหว่าง 2 ตัวกลาง และมุมหักเหของแสงเท่ากับ 90° ดังรูปที่ 4.3 ข. มุมวิกฤตสามารถกำนวณได้ด้วยกฏของสเนล ดัง สมการที่ 2.9 โดยมุมที่แสงหักเหไปยังตัวกลางที่ 2 (θ_i) กำหนดเป็น 90°



รูปที่ 4.3 แสดงสะท้อนและการส่องผ่านของแสงเมื่อ ก. มุมตกกระทบน้อยกว่ามุมวิกฤต ข. มุมตกกระทบเท่ากับมุมวิกฤตและ ค. มุมตกกระทบมากกว่ามุมวิกฤต จากรูปแบบระบบที่ทำการจำลองโดยใช้พีคีเอ็มเอสแบบเรียบ คังรูปที่ 3.6 ก. แสงเดินทางผ่านแก้ว ตกกระทบลงบนรอยต่อของแก้วและพีคีเอ็มเอส ถ้ามุมตกกระทบมีค่าน้อยกว่า มุมวิกฤต แสงเกิดการส่องผ่านและการสะท้อน แสงที่ส่องผ่านจะเดินทางผ่านพีดีเอ็มเอสและตก กระทบลงบนรอยต่อของพีคีเอ็มเอสกับน้ำ เกิดปรากฏการณ์เช่นเดียวกัน ถ้ามุมตกกระทบน้อยกว่า มุมวิกฤตของรอยต่อพีดีเอ็มเอสกับน้ำ แสงบางส่วนจะส่องผ่านไปยังน้ำและเดินทางออกจากระบบ ไป ส่วนแสงที่สะท้อนเดินทางกลับมายังพีดีเอ็มเอส ตกกระทบลงบนรอยต่อของน้ำกับพีดีเอ็มเอ สอีกครั้ง แสงที่ส่องผ่านบนรอยต่อนี้สามารถแทรกสอดกับแสงที่สะท้อนบนรอยต่อแก้วกับพีดีเอ็ม เอสได้ ดังรูปที่ 4.4 ก.



รูปที่ 4.4 แสดงสะท้อนและการส่องผ่านของแสงในระบบตรวจวัดอัลตราซาวด์ที่พีคีเอ็มเอสแบบ เรียบเป็นตัวรับรู้ ก. มุมตกกระทบบนรอยต่อทั้งสองมีค่าน้อยกว่ามุมวิกฤต ข. มุมตกกระทบบน รอยต่อพีคีเอ็มเอสและน้ำมีก่ามากกว่ามุมวิกฤตและ ก. มุมตกกระทบบนรอยต่อแก้วและพีคีเอ็มเอส

รูปที่ 4.4 ข. แสดงปรากฏการณ์ของกรณีที่มุมตกกระทบของแสงบนรอยต่อของ แก้วและพีดีเอ็มเอสมีค่าน้อยกว่ามุมวิกฤต แต่มุมตกกระทบของแสงบนรอยต่อของพีดีเอ็มและน้ำมี ด่ามากกว่ามุมวิกฤต จะเกิดปรากฏการณ์เช่นเดียวกับกรณีของรูปที่ 4.4 ก. แต่แตกต่างกันที่แสงเกิด การสะท้อนกลับหมดบนรอยต่อของพีดีเอ็มเอสกับน้ำ และรูปที่ 4.4 ค. แสดงปรากฏการณ์ของกรณี ที่มุมตกกระทบของแสงบนรอยต่อของแก้วและพีดีเอ็มเอสมีค่ามากว่ามุมวิกฤต แสงเกิดการสะท้อน กลับหมดบนรอยต่อของแก้วและพีดีเอ็มเอส

รูปที่ 4.5 แสดงปรากฏการณ์ที่แสงเดินทางในระบบที่ใช้พีดีเอ็มเอสแบบเกรตติง ในกรณีที่มุมตกกระทบบนทั้งสองรอยต่อน้อยกว่ามุมวิกฤต แสงส่องผ่านและสะท้อนบนทั้งสอง รอยต่อแบบเดียวกับกรณีของพีดีเอ็มเอสแบบเรียบ ดังรูปที่ 4.4 ก. แต่ในกรณีของพีดีเอ็มเอสแบบ เกรตติงจะมีปรากฏการณ์ของการเลี้ยวเบนของแสงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะเมื่อแสงตกกระทบลง บนเกรตติงจะเกิดการเลี้ยวไปยังลำดับการเลี้ยวเบนต่าง ๆ



รูปที่ 4.5 แสดงการสะท้อน การส่องผ่านของแสงและการเลี้ยวเบนของแสงเมื่อตกกระทบลงบน ระบบตรวจวัดอัลตราชาวด์ที่พีดีเอ็มเอสแบบเกรตติงเป็นตัวรับรู้ที่มุมตกกระทบน้อยกว่ามุมวิกฤต

จากปรากฏการณ์ที่กล่าวมาข้างค้น เมื่อทำการจำลองผลค่าควาสะท้อนของแสง ของระบบตรวจวัดคลื่นอัลตราชาวด์ที่มีพีดีเอ็มเอสเกรตติงที่มีขนาดคาบตั้งแต่ 0 µm ถึง 300 µm มีค่า สัดส่วนของร่องตั้งแต่ 0 คือ ไม่มีชั้นของพีดีเอ็มเอส ถึง 1 คือ มีชั้นพีดีเอ็มเอสแบบเรียบ และมีความ หนาอยู่ที่ 35 µm โดยรูปที่ 4.6 ก. แสดงค่าความสะท้อนของแสงที่ลำคับการเลี้ยวเบนที่ -1 รูปที่ 4.6 ข. แสดงค่าความสะท้อนของแสงที่ลำคับการเลี้ยวเบนที่ 0 และรูป 4.6 ค. แสดงค่าความสะท้อนของ แสงที่ลำคับการเลี้ยวเบนที่ 1 โดย 3 กรณีศึกษาที่มุมตกกระทบเท่ากับ 1.332 จากผลการศึกษาพบว่า แสงที่หายไปบนลำคับการเลี้ยวเบนที่ 0 และไปปรากฏบนลำคับการเลี้ยวเบนที่ -1 และ 1 และรูปร่าง ของเกรตติงมีผลต่อประสิทธิภาพการเลี้ยวเบน แสงจะสามารถเกิดการเลี้ยวเบนได้ดี เมื่อตกกระทบ ลงบนเกรตดิงที่มีก่าสัดส่วนของร่องเท่ากับ 0.5 และขนาดของคาบเกรตดิงกวรมีขนาดใหญ่กว่าความ ยาวกลื่นแสง



รูปที่ 4.6 ผลก่าความสะท้อนของแสงของพีคีเอ็มเอสแบบเกรตติงที่มีความหนา 35 μm ที่มีขนาดกาบ อยู่ในช่วง 0 ถึง 300 μm และมีก่าสัดส่วนของร่องตั้งแต่ 0 ถึง 1 ที่มุมตกกระทบเท่ากับ 1.332 ก. ลำดับการเลี้ยวเบนที่ -1 ง. ลำดับการเลี้ยวเบนที่ 0 และ ค. ลำดับการเลี้ยวเบนที่ 1

รูปที่ 4.7 ก. และ 4.7 ขี้. ใเสดงผลการจำลองค่าความสะท้อนของแสงในกรณีพี ดีเอ็มเอสแบบเรียบที่มีความหนา 35 µm โดยที่แกนนอน คือ มุมตกกระทบที่เขียนในรูปของผลดูณ ระหว่างก่าดัชนีหักเหของแก้วและค่ามุมตกกระทบในรูปของพึงก์ชันไซน์ (*n*₀ sin *θ*_i) และแกนตั้ง กือ ค่าความความสะท้อนของแสง พบว่า มุมกระทบที่ 1.33 เป็นก่ามุมตกกระทบที่ทำให้เกิดมุม วิกฤตที่รอยต่อระหว่างพีดีเอ็มเอสและน้ำ ช่วงมุมกระทบทีต่ำกว่า 1.33 ค่าความสะท้อนของแสงมีก่า น้อย เกิดจากแสงบางส่วนส่องผ่านรอยต่อระหว่างพีดีเอ็มเอสกับน้ำและเดินทางออกจากระบบไป ทำให้สามารถเห็นผลการแทรกสอดของแสงที่สะท้อนบนรอยต่อพีดีเอ็มเอสกับน้ำและรอยต่อแก้ว กับพีดีเอ็มเอส ในกรณีที่ช่วงมุมตกกระทบมากกว่า 1.33 แสงเกิดการสะท้อนกลับหมดบนรอยต่อ ของพีดีเอ็มเอสและน้ำ ก่าความสะท้อนของแสงมีก่าเท่ากับ 1 ทำให้ไม่เห็นผลการแทรกสอดของ แสง

64



รูปที่ 4.7 แสดงก่ากวามสะท้อนของแสงที่มุมตกระทบที่มีขนาด 1.25 ถึง 1.45 ของ ก. แสงโพลาไรซ์ แบบ TE บนพีดีเอ็มเอสแบบเรียบ ข. แสงโพลาไรซ์แบบ TM บนพีดีเอ็มเอสแบบเรียบ ก. แสงโพลาไรซ์แบบ TM บนพีดีเอ็มเอสแบบเกรตติง และ ง. แสงโพลาไรซ์แบบ TM บน พีดีเอ็มเอสแบบเกรตติง

จากการเปรียบเทียบผลของแสงโพลาไรซ์แบบ TE และ TM โดยที่รูป 4.7 ก. แสดงผลการศึกษาแสงโพลาไรซ์แบบ TE และ รูป 4.7 ข. แสดงผลการศึกษาแสงโพลาไรซ์แบบ TM พบว่า กรณีที่มุมตกกระทบน้อยกว่า 1.33 แสงโพลาไรซ์แบบ TE จะมีค่าความเข้มแสงมากกว่า แสง โพลาไรซ์แบบ TM เนื่องจากแสงโพลาไรซ์แบบ TM จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่แสงส่องผ่าน รอยต่อทั้งหมด เมื่อมุมตกกระทบมีค่าเท่ากับมุมบรูสเตอร์ (Brewster's Angle) ทำให้ก่าความสะท้อน ของแสงจึงมีค่าน้อยกว่า รูปที่ 4.7 ก. และ 4.7 ง. แสดงผลการจำลองก่ากวามสะท้อนของแสงในกรณีพี ดีเอ็มเอสแบบเกรตติง ที่มีกวามหนา 35 µm ขนาดกาบ 300 µm และมีก่าสัดส่วนของเกรตติงเท่ากับ 0.5 พบว่าก่อนมุมตกกระทบที่ 1.33 ก่าการสะท้อนของแสงกล้ายกับกรณีของพีดีเอ็มเอสแบบเรียบ แต่จะมีกวามลึกของแถบมืดหรือบริเวณที่มีก่าต่ำ ต่ำกว่าและหลังจากมุมตกกระทบ 1.33 พบว่ามีแถบ มืดเกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์การเสี้ยวเบนของแสงที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้ การเพิ่ม โครงสร้างเกรตดิงเข้าไปทำให้เราสามารถเห็นผลการแทรกสอดของแสงที่สะท้อนออกจากรอยต่อ ของพีดีเอ็มเอสกับน้ำและแก้วกับพีดีเอ็มเอสได้ ซึ่งไม่สามารถเห็นได้ในกรณีพีดีเอ็มเอสแบบเรียบ ปรากฏการณ์นี้สามารถพบจนถึงช่วงที่มุมกระทบมีก่ามากกว่า 1.4298 เมื่อมุมตกกระทบมากกว่า 1.4298 แสงที่ตกกระทบจะเกิดการสะท้อนกลับหมดบนรอยต่อของแก้วกับพีดีเอ็มเอส ไม่มีแสงส่อง ผ่านไปยังพีดีเอ็มเอสและไม่เกิดการแทรกสอดของแสง จากการศึกษาผลของแสงโพลาไรซ์ รูปที่ 4.7 ก. เป็นผลของแสงโพลาไรซ์แบบ TE และ รูปที่ 4.7 ก. เป็นผลของแสงโพลาไรซ์แบบ TM พบว่า แสงโพลาไรซ์แบบ TE ให้ก่าความสะท้อนแสงมากกว่าในกรณีที่มุมตกกระทบน้อยกว่า 1.33 ซึ่งเป็น ปรากฏการณ์เดียวกันกับกรณีของพีดีเอ็มเอสแบบเรียบ

4.2.2 ผลก<mark>ารจำลองการเป</mark>ลี่ยนแปลงความหนาของพิดีเอ็มเอสแบบเรียบและพิดีเอ็มเอส แบบเกรตติงจากการถูกกุดด้วยความดันของคลื่นอัลตราชาวด์ที่มีความถี่ 1 MHz

รูปที่ 4.8 ก. แสดงผลกวามค้นในตัวกลางและการขุบตัวของพีดีเอ็มเอสแบบ เรียบที่มีความหนา 35 µm และรูปที่ 4.8 ข. แสดงผลกวามค้นในตัวกลางและการขุบด้วของ พีดีเอ็มเอสแบบเกรตดิง มีความหนา 35 µm ขนาดคาบเท่ากับ 300 µm และมีก่าสัดส่วนของเกรตดิง เท่ากับ 0.5 เมื่อปล่อยคลื่นอัลตราซาวด์ที่มีความถี่ 1 MHz และมีความดันอยู่ที่ 100 kPa จากการวัด การเปลี่ยนแปลงความหนา พบว่าพีดีเอ็มเอสแบบเรียบมีอัตราการเปลี่ยนแปลงความหนาอยู่ที่ 1.0756×10⁻⁴ nm/Pa และพีดีเอ็มเอสแบบเกรตดิงมีอัตราการเปลี่ยนแปลงความหนาอยู่ที่ 1.0756×10⁻⁴ nm/Pa และพีดีเอ็มเอสแบบเกรตดิงมีอัตราการเปลี่ยนแปลงความหนาอยู่ที่ 1.6756×10⁻⁴ nm/Pa และพีดีเอ็มเอสแบบเกรตดิงมีอัตราการเปลี่ยนแปลงความหนาได้มากกว่าเนื่องจาก โครงสร้างเกรตดิงมีพื้นที่ด้านข้างให้พีดีเอ็มเอสได้ขยายตัวเมื่อถูกกดจากด้านบน จากผลของความ ดันในตัวกลางที่กรณีเกรตดิงมีก่ามากกว่า เนื่องจากการที่คลื่นเสียงเดินทางผ่านตัวกลางที่มีก่าความ ด้านทานของคลื่นเสียง (Acoustic Impedance) ต่างกัน ทำให้เกิดการสะท้อนและส่องผ่าน เช่นเดียวกับแสง โดยการสะท้อนและส่องผ่านขึ้นอยู่กับก่าความด้านทานของคลื่นเสียงของทั้งสอง ดัวกลาง ก่าความด้านทานของคลื่นเสียงของน้ำ พีดีเอ็มเอส และแก้ว มีก่าเท่ากับ 1.48 MRayls, 1.01 MRayls และ 12.1 MRayls ตามลำดับ (Learkthanakhachon, Pechprasarn & Somekh, 2018)



รูปที่ 4.8 แสดงผลการจำลองการเปลี่ยนแปลงความหนาของพีดีเอ็มเอสและความดันในตัวกลางของ n. พีดีเอ็มเอสแบบเรียบและ ข. พีดีเอ็มเอสแบบเกรตติง ค. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนา เริ่มต้นของพีดีเอ็มเอสกับความหนาที่เปลี่ยนแปลงและ ง. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างพีดีเอ็ม เอสแบบเกรตติงที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความหนาเมื่อปล่อยคลื่นอัลตราซาวนด์ที่มีความถี่ 1 MHz และมีความดันอยู่ที่ 100 kPa

จากการคำนวณค่าความสะท้อนของเสียงระหว่างเดินทางจากน้ำไปยังพีดีเอ็ม เอสและน้ำไปยังแก้วโดยสมการที่ 4-1 มีค่าเท่ากับ 0.035 และ 0.6116 ตามลำดับ กรณีที่พีดีเอ็มเอ สแบบเกรตติงมีค่าความดันในน้ำที่สูงกว่ากรณีของพีดีเอ็มเอสแบบเรียบเป็นเพราะปริมาณของเสียง ที่สะท้อนกลับบนรอยต่อของน้ำและแก้วมีก่ามากกว่าบนรอยต่อของน้ำและพีดีเอ็มเอส

$$R = \left(\frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}\right)^2$$
(4-1)

โดยที่ Z₁ คือ ค่าความต้านทานของคลื่นเสียงของตัวกลางแรก
 และ Z₂ คือ ค่าความต้านทานของคลื่นเสียงของตัวกลางที่สอง

รูปที่ 4.8 ค. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาเริ่มต้นของพีดีเอ็มเอสกับ ความหนาที่เปลี่ยนแปลงเมื่อปล่อยคลื่นอัลตราซาวนค์ที่มีความถี่ 1 MHz และมีความคันอยู่ที่ 100 kPa พบว่า ความหนาเริ่มต้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความหนา โดยศึกษาความหนาของพีดีเอ็มเอส ตั้งแต่ 1 μm ถึง 40 μm พบว่าเมื่อความหนามากเริ่มต้นมาก การเปลี่ยนแปลงความหนาขะมากขึ้น มี งานวิจัยที่รายงานว่าพีดีเอ็มเอสที่มีขนาดและความหนาไม่เท่ากัน ทำให้มีคุณสมบัติเชิงกลที่แตกต่าง กัน (Abazari, Safavi, Rezazadeh, & Villanueva, 2015) รูปที่ 4.8 ง. แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง รูปร่างของโครงสร้างเกรตติงบนพีดีเอ็มเอสที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความหนาเมื่อปล่อยคลื่นอัล ตราซาวด์ที่มีความถี่ 1 MHz และมีความคันอยู่ที่ 100 kPa โดยรูปร่างเกรตดิงที่ศึกษา คือ ช่วงของคาบ ตั้งแต่ 150 μm ถึง 300 μm และความหนาของเกรตติงตั้งแต่ 0 μm ถึง 40 μm พบว่าเมื่อความหนาของ เกรตติงมาก การเปลี่ยนแปลงความหนามากขึ้นซึ่งคล้ายกับกรณีของพีดีเอ็มแบบเรียบ ในส่วนของ ลาบเกรตติงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความหนา เมื่อเกรตดิงมีขนาดคาบมาก การเปลี่ยนแปลงความ หนาก็จะมากขึ้น ค่าสัดส่วนเกรตติงที่ศึกษามีค่าเท่ากับ 0.5 เนื่องจากเป็นค่าที่ทำให้เกิดการเลี้ยวเบน ได้ดีที่สุด ดังรูปที่ 4.6

4.2.3 ผลการจำลองค่าความสะท้อนของแสงเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงความหนาของ พีดีเอ็มเอสแบบเรียบและพีดีเอ็มเอสแบบเกรตติง

รูปที่ 4.9 ก. และ รูปที่ 4.9 ง. แสดงผลการจำลองค่าความสะท้อนของแสง ของพื ดีเอ็มเอสแบบเรียบและพิดีเอ็มเอสแบบเกรตติงที่มีขนาดคาบเท่ากับ 300 μm และมีค่าสัดส่วนเกรต ติงเท่ากับ 0.5 เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงความหนาตั้งแต่ 0 μm ถึง 35 μm พบว่า เมื่อเปลี่ยนแปลงความ หนาค่าความสะท้อนของแสงจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเป็นลักษณะแทบมืดและแทบสว่างแบบฟังก์ชัน ไซน์ ซึ่งในกรณีของพีดีเอ็มเอสแบบเรียบจะสามารถเห็นปรากฏการณ์นี้ได้เฉพาะที่มุมตกกระทบ น้อยกว่า 1.33 ส่วนในกรณีของพีดีเอ็มเอสแบบเกรตดิงจะสามารถเห็นปรากฏการณ์นี้ได้เฉพาะที่มุมตกกระทบ น้อยกว่า 1.4289 เนื่องจากการเลี้ยวเบนของแสง ซึ่งอธิบายไว้ในหัวข้อที่ 4.2.1 โดยค่าความ สะท้อนที่เปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากการแทรกสอดของแสงที่สะท้อนจากรอยต่อของแก้วกับพีดีเอ็มเอส และพีดีเอ็มเอสกับน้ำ เมื่อความหนาของพีดีเอ็มเอสเปลี่ยนแปลง ระยะทางที่แสงเดินทาง (Optical Path Length) ในพีดีเอ็มเอสเปลี่ยนแปลงไปด้วย ความหนาของพีดีเอ็มเอสที่มีก่าความสะท้อนของ แสงมาก คือ ความหนาที่ทำให้เฟสของแสงที่สะท้อนจากทั้งสองรอยต่อเกิดการแทรกสอดกันแบบ เสริมกัน ความหนาที่มีค่าความสะท้อนของแสงต่ำ คือ ความหนาที่ทำให้เฟสของแสงเกิดการหักล้าง กัน ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เรียกว่า การแทรกสอดแบบฟาบรี-เปโรต์ ซึ่งเราสามารถคำนวนตำแหน่ง ของโหมดได้ (Pechprasarn et al., 2016) ดังสมการที่ 4-2



รูปที่ 4.9 แสดงผลค่าความสะท้อนของแสงเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงความหนาของ ก. พีคีเอ็มเอส แบบเรียบและ ข. พีคีเอ็มเอสแบบเกรตติง ที่มุมตกกระทบตั้งแต่ 1.25 ถึง 1.45 และภาพขยายของ ก. และ ข. เปรียบเทียบแถบมืดกับตำแหน่งของโหมดฟาบรี-เปโรต์ (เส้นประ) ของ ค.พีคีเอ็มเอสแบบเรียบ และ ง. พีคีเอ็มเอสแบบเกรตติง

$$2k_{z,pdms}d + \phi_{upper} + \phi_{lower} = 2\pi M \tag{4-2}$$

โดยที่ $k_{z,pdms}$ คือเวกเตอร์คลื่นในพีดีเอ็มเอส สามารถคำนวณหาได้จากสมการที่ 4-3

$$k_{z,pdms} = \sqrt{\left(\frac{2\pi n_{pdms}}{\lambda_0}\right)^2 - \left(\frac{2\pi n_0 \sin\theta}{\lambda_0}\right)^2}$$
(4-3)

และ M คือ ลำดับของโหมดฟาบรี-เปโรต์

รูปที่ 4.9 ค. และ 4.9 ง. แสดงการเปรียบเทียบแถบมืดที่เกิดขึ้นกับลำดับโหมด ของฟาบรี-เปโรต์ โดยรูปที่ 4.9 ค. แสดงผลค่าความสะท้อนของแสงของพีดีเอ็มเอสแบบเรียบและ รูปที่ 4.9 ง. แสดงผลค่าความสะท้อนของแสงของพีดีเอ็มเอสแบบเกรตติงในช่วงความหนา 30 µm ถึง 35 µm และมุมตกกระทบในช่วง 1.3 ถึง 1.35 โดยเส้นประสีฟ้า คือ ลำคับของการเกิดโหมด ฟาบรี-เปโรต์ ตั้งแต่ลำคับที่ 45 ถึง 66 จากพบการเปรียบเทียบพบว่าตำแหน่งโหมดของฟาบรี-เปโรต์ เกิดตรงกับแถบมืดพอดี ทั้งในกรณีของพีดีเอ็มเอสแบบเรียบและพีดีเอ็มเอสแบบเกรตติง สามารถ สรุปได้ว่าปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากการแทรกสอดแบบฟาบรี-เปโรต์ เกรตติงช่วยให้แสงเลี้ยว และทำให้เห็นผลการแทรกสอดของแสง เมื่อมุมตกกระทบมากกว่า 1.33

4.3 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการตรวจวัดคลื่นอัลตราซาวด์โดยใช้ตัวรับรู้ เป็นพีดีเอ็มเอสแบบเรียบและพีดีเอ็มเอสแบบเกรตติง

4.3.1 ผลการปรับปรุงสัญญาณให้มีความเป็นเส้นตรงสำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ของการตรวจวัดคลื่นอัลตราซาวด์โดยใช้ตัวรับรู้เป็นพีดีเอ็มเอสแบบเรียบและพีดีเอ็มเอส แบบเกรตติง

จากผลการจำลองการเปลี่ยนแปลงความหนาของพีคีเอ็มเอสเมื่อถูกกคด้วย กลื่นอัลตราซาวค์ที่มีความถี่ 1 MHz และผลการจำลองการเปลี่ยนแปลงของก่าความสะท้อนของแสง เมื่อความหนาของพีคีเอ็มเอสเปลี่ยนแปลง ทำให้สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างความคันของ กลื่นอัลตราซาวค์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงก่าความสะท้อนของแสงได้ ดังรูปที่ 4.10 ก. และ 4.10 ข. แสดงก่าความสะท้อนของแสงก่อนและหลังการปรับปรุงสัญญาณภายใต้กลื่นอัลตราซาวค์ที่มี ความถี่ตั้งแต่ 0 ถึง 10,000 kPa ที่มุมตกกระทบ 1.00 1.10 1.20 และ 1.30 ของพีคีเอ็มเอสแบบเรียบ และพีคีเอ็มเอสแบบเกรตติงด้วยสมการถคถอยแบบพหุนามกำลังสาม พบว่าก่าความสะท้อนของ แสงที่ผ่านการปรับปรุงสัญญาณมีความสัมพันธ์ที่เป็นเชิงเส้นมากขึ้นและมีอัตราการเปลี่ยนแปลง ของค่าความสะท้อนคงที่เมื่อความคันเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงสัญญาณด้วยสมการถดถอยแบบพหุ นามกำลังสามให้ค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ (The Coefficient of Determination : *R*²) มากกว่า 0.99 ในทุกค่ามุมตกกระทบ



รูปที่ 4.10 แสดงก่ากวามสะท้อนของแสงก่อนการปรับปรุงสัญญาณ (เส้นทึบ) และหลังการปรับปรุง สัญญาณ (เส้นประ) ของ ก. ก่ากวามสะท้อนของแสงตรวจวัดกลิ่นอัลตราซาวค์โดยใช้ตัวรับรู้เป็นพื ดีเอ็มเอสแบบเรียบ และ ข. ก่ากวามสะท้อนของแสงตรวจวัดกลิ่นอัลตราซาวค์โดยใช้ตัวรับรู้เป็น พึดีเอ็มเอสแบบเกรตดิง

4.3.2 ผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพผลการจำลองการตรวจวัดคลื่นอัลตราซาวด์โดยใช้ตัว รับรู้เป็นพี่ดีเอ็มเอสแบบเรียบและพี่ดีเอ็มเอสแบบเกรตติง รูปที่ 4.11 แสดงการเปรียบเทียบผลประสิทธิภาพการตรวจวัดคลื่นอัลตราซาวด์ ของพีดีเอ็มเอสแบบเรียบและพีดีเอ็มเอสแบบเกรตติงที่มุมตกกระทบตั้งแต่ 0 ถึง 1.4298 โดยรูปที่ 4.11 ก. แสดงการเปรียบเทียบความไวในการตอบสนองของการตรวจวัดคลื่นอัลตราซาวด์ พบว่าพี ดีเอ็มเอสแบบเกรตติงมีความไวในการตอบสนองมากกว่าพีดีเอ็มเอสแบบเรียบ 4.76 เท่า โดย พีดีเอ็มเอสแบบเกรตติงมีความไวในการตอบสนองมากที่สุดอยู่ที่ 3.46×10⁻⁷ Pa⁻¹ และพีดีเอ็มเอ สแบบเรียบความไวในการตอบสนองมากที่สุดเพียง 7.27×10⁻⁸ Pa⁻¹ โดยตัวรับรู้ทั้งสองชนิดจะมี ลักษณะเดียวกันคือ เมื่อเมื่อมุมตกกระทบมากขึ้นจะทำให้การตรวจวัดมีความไวในการตอบสนอง มากขึ้น เนื่องจากเมื่อมุมกระทบมากขึ้นแสงที่ส่องผ่านออกไปจากระบบจะมีจำนวนน้อยลงและแสง สะท้อนกลับมากขึ้น ทำให้ก่าความสะท้อนมีค่าสูงมากกว่าบริเวณที่มีมุมตกระทบต่ำ ๆ



รูปที่ 4.11 การเปรียบเทียบผลประสิทธิภาพการตรวจวัดคลื่นอัลตราซาวด์โดยใช้ตัวรับรู้เป็น พีดีเอ็มเอสแบบเรียบ (เส้นสีน้ำเงิน) และพีดีเอ็มเอสแบบเกรตติง (เส้นสีแดง) โดย ก. แสดงผลกวาม ไวในการตอบสนอง ข. ค่าความเป็นเซนเซอร์ที่ดีและ ค. ช่วงในการตอบสนอง รูปที่ 4.11 ข. แสดงการเปรียบเทียบค่าความเป็นเซนเซอร์ที่ดีของการตรวจวัด คลื่นอัลตราซาวด์ พบว่า พีดีเอ็มเอสแบบเกรตติงมีความไวในการตอบสนองมากกว่าพีดีเอ็มเอสแบบ เรียบ 1.17 เท่า เป็นผลมาจากก่าความไวในการตอบสนอง โดยพีดีเอ็มเอสแบบเกรตติงมีก่าความเป็น เซนเซอร์ที่ดีมากที่สุดอยู่ที่ 1.10×10⁻⁶ Pa⁻¹ และพีดีเอ็มเอสแบบเรียบความไวในการตอบสนองมาก ที่สุดเพียง 9.44×10⁻⁷ Pa⁻¹ แต่ก่าความเป็นเซนเซอร์ที่ดีจะลดลงเมื่อมุมกระทบมากขึ้น เนื่องจากก่า ความสะท้อนของแสงเริ่มต้นมีก่ามากขึ้นเมื่อมุมตกกระทบสูงขึ้น ดังรูปที่ 4.11

รูปที่ 4.11 ค. แสดงการเปรียบเทียบช่วงในการตอบสนองของการตรวจวัด คลื่นอัลตราซาวด์ พบว่าพีดีเอ็มเอสแบบเรียบมีช่วงในการตอบสนองที่มากกว่าเมื่อมุมตกกระทบ น้อยกว่า 1.33 โดยมีค่าสูงสุดอยู่ที่ 2,820 kPa ในการตรวจวัดทั่วไปมักมีช่วงในการตอบสนองที่ แปรผกผันกับค่าความไวในการตอบสนอง ระบบที่มีค่าความไวในการตอบสนองที่สูงจะมีช่วงใน การตอบสนองที่แคบ (Li, Ligthart, Huang, Lu, & Van Der Zwan, 2008) แต่เมื่อมุมตกกระทบมีค่า มากกว่า 1.33 พีดีเอ็มเอสแบบเกรตติงมีช่วงในการตอบสนองที่กว้างมาก สูงสุดถึง 10,000 kPa ซึ่ง มากกว่าค่าสูงสุดของพีดีเอ็มเอสแบบเรียบ 3.55 เท่า

4.4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพลวดลายเกรตติงจากกระบวนการโฟโตลิโทกราฟี





รูปที่ 4.12 ก. แสดงภาพฉายเกรตติงที่ถ่ายผ่านระบบการทำโมดูเลชันของความเข้มแสง บนระนาบภาพ และ ข. แสดงลวดลายเกรตติงที่ขึ้นรูป ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบมาโครซูม

ครั้งที่	ความกว้างเกรตติง	ระยะร่อง (µm)	ความยาว (µm)
	(µm)		
1	152.10	150.04	1015.25
2	156.31	151.45	1019.50
3	154.18	147.32	1021.55
x	154.20	149.60	1018.76
E	2.79	0.27	13.19
S.D.	2.10	2.09	3.21

ตารางที่ 4.2 แสดงการเปรียบเทียบความกว้าง ความยาวและระยะช่องของลวดลายเกรตติง

รูปที่ 4.12 ก. แสคงลวคลายที่ฉายลงบนแผ่นรองรับและบันทึกค้วยเซนเซอร์รับ

ภาพในระบบการทำโมดูเลชั่นของความเข้มแสงบนระนาบภาพ โดยขนาดลวดลายได้จากการ ออกแบบเกรตติงบนไอแพคค้วยสมการที่ 3-1 และภาพบนอุปกรณ์กระจกงนาคไมครอนแบบคิจิทัล จะถูกย่องนาดลง 4 เท่า และรูปที่ 4.12 ง. แสดงลวดลายที่สร้างจากกระบวนการโฟโตลิโทกราฟี และฉายภาพด้วยระบบการทำโมดูเลชั่นของความเข้มแสงบนระนาบภาพถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์ แบบมาโครซูม เกรตติงที่สร้างได้มีความคมชัด ความกว้างของเกรตติงเฉลี่ยอยู่ที่ 152.10 mm ระยะ ร่องเฉลี่ยอยู่ที่ 150.04 mm และมีความยาวเกรตติงเฉลี่ยอยู่ที่ 1015.25 mm และตารางที่ 4.1 แสดง ขนาดของเกรตตติงที่ทำซ้ำ 3 ครั้ง ค่าเฉลี่ยความกว้าง ระยะร่องและความยาวของเกรตติง เท่ากับ 154.20 µm 149.60 µm และ 1018.76 µm จากการวิเคราะห์ความถูกต้องของลวดลายที่สร้างได้ เกรต ติงมีความกว้างและระยะร่องถูกต้องตามที่ออกแบบ มีเปอร์เซ็นต์ความกลาดเกลื่อนเท่ากับ 2.79 และ 0.27 แต่ในส่วนของความยาวเกรตติงเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนมีค่าเท่ากับ 13.19 เนื่องจากขอบ ้งองอุปกรณ์กระจกงนาดไมครอนแบบดิจิทัลสามารถทำให้แสงยวีบางส่วนที่นอกเหนือจากลวดลาย ้ที่ออกแบบฉายลงมาได้ ดังรูปที่ 4.12 ก. ทำให้ความยาวของเกรตติงที่สร้างมากขึ้น วิธีนี้สามารถ แก้ไขได้โดยการออกแบบลวคลายโดยไม่เต็มจอของอุปกรณ์กระจกขนาดไมครอนแบบคิจิทัล ใน ้ส่วนของการวิเคราะห์ความสามารถในการทำซ้ำ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความกว้างของเกรตติง ระยะร่องและความยาวของเกรตติงมีค่าเท่ากับ 2.10 2.09 และ 3.21 ตามลำคับ จากค่าที่คำนวนได้บ่ง ้บอกว่าระบบสามารถสร้างลวยลายที่มีขนาดใกล้เคียงลวดลายเดิมได้

4.4.2 การวัดความคลาดเคลื่อนลวดลายที่เกิดจากการเอียงของระบบแสง

ในการวัดความคลาดเคลื่อนลวดลายที่เกิดจากการเอียงของระบบแสง โดยการ วัดขนาดความกว้างของเกรตติงที่ชิดซ้ายและขวา ดังรูปที่ 4.13 และนำค่าที่ได้คำนวนด้วยสมการที่ 3-8 ค่าที่คำนวนได้ดังแสดงในตารางที่ 4.2 ซึ่งจากการคำนวนค่าความคลาดเคลื่อนลวดลายจากเกรต ติงจำนวน 3 อัน คำนวนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.032 จากค่าความคลาดเคลื่อนลวดลายที่เกิดจากการเอียง ของระบบแสงสามารถสรุปได้ว่าการจัดเรียงทางเดินแสงของระบบการทำโมดูชันของความเข้มแสง บนระนาบภาพมีความถูกต้องและไม่เอียงจนทำให้ลวดลายที่ฉายมีรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง



รูปที่ 4.13 แสดงตำแหน่งในการกำนวนความกลาดเกลื่อนลวดลายที่เกิดจากการเอียงของระบบแสง

บนลวดลายเกรตติง

ตารางที่ 4.2 แสดงความคลาดเคลื่อนของลวดลายที่เกิดจากการเอียงของระบบแสง

เกรตติง	⁴⁷ ลัยวังสิต	R ค่าความคลาคเคลื่อน (μm)	
1	0.0101	0.027	
2		0.040	
3		0.028	
เฉลี่ย		0.032	

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

งานวิจัยในหัวข้อเรื่อง การทำโมดูเลชันของความเข้มแสงบนระนาบภาพสำหรับการสร้าง เซนเซอร์ระดับไมครอน : การตรวจวัคคลื่นอัลตราซาวค์ เป็นการพัฒนาระบบโฟโตลิโทกราฟีที่มีใช้ อุปกรณ์กระจกขนาดไมครอนแบบดิจิทัลในการสร้างลวคลายค้นแบบที่ต้องการสร้างแทนการใช้ มาส์กแสงและนำระบบที่ได้มาต่อยอดในการสร้างแม่พิมพ์ที่สามารถนำไปสร้างลวคลายบนวัสดุที่มี ความหยึดหยุ่นสูง ได้แก่ พีคีเอ็มเอส เพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นตัวรับรู้ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ในการตรวจวัคกลื่นอัลตราซาวค์ได้ ผู้วิจัยขอสรุปผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

5.1.1 ระบบการทำโมดูเลชันของความเข้มแสงบนระนาบภาพที่ถูกพัฒนาขึ้นประกอบไป ด้วย แหล่งกำเนิดแสงยูวี ระบบส่องสว่างแบบโคเลอร์ เลนส์ใกล้วัตถุสำหรับฉายภาพและย่อภาพให้ มีขนาดในระดับไมครอน ระบบบันทึกภาพที่สามารถทำให้เห็นถวดลายที่ต้องการฉาย รวมถึงทำให้ ระบบที่ถูกพัฒนาสามารถใช้งานในโหมดของกล้องจุลทรรศน์แบบสะท้อนได้ และมีการใช้อุปกรณ์ กระจกขนาดไมครอนแบบดิจิทัลในการสร้างถวดลายต้นแบบ ระบบดังกล่าวสามารถสร้างลวดลาย ได้มีขนาดเล็กที่สุด 60 ไมครอนซึ่งเป็นความละเอียดสูงสุดที่สารไวแสงชนิดฟิล์มสามารถสร้างได้ ระบบการทำโมดูเลชันของความเข้มแสงบนระนาบภาพทำให้การออกแบบและสร้างถวดลายมี ความสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมถึงประหยัดเวลาและงบประมาณในการผลิตมาส์กแสง

5.1.2 งานวิจัยนี้ได้มีการศึกษาการจำลองผลการตรวจวัดคลื่นอัลตราซาวด์ที่มีความถี่ 1 MHz โดยการใช้เทคนิคเชิงแสงและการใช้วัสดุหยืดหยุ่นพีดีเอ็มเอสในการเป็นตัวรับรู้ การสร้าง ลวดลายเกรตติงบนวัสดุหยืดหยุ่นทำให้การตรวจวัดคลื่นอัลตราซาวด์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้ง ในความไวในการตอบสนองเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 4.76 เท่า ก่าความเป็นเซนเซอร์ที่ดีเพิ่มขึ้นเป็น จำนวน 1.16 เท่าและมีช่วงการตอบสนองมากขึ้น 3.55 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้พีดีเอ็มแบบ เรียบ 5.1.3 ระบบการทำโมดูเลชันของความเข้มแสงบนระนาบภาพที่ถูกพัฒนาขึ้นสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างแม่พิมพ์สำหรับการสร้างลวดลายเกรตติง ซึ่งลวดลายที่ได้มีค่า เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยอยู่ที่ 5.42% ค่าเฉลี่ยของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสร้าง ลวดลายมีค่าเท่ากับ 2.47 และค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนอันเกิดจากการเอียงของระบบแสงมีค่า เท่ากับ 3.20% จากการวิเคราะห์ผลสามารถสรุปได้ว่าระบบการทำโมดูเลชันของความเข้มแสงบน ระนาบภาพสามารถนำมาใช้ในการสร้างลวดลายด้วยกระบวนการโฟโตลิโทกราฟีได้ดี ทั้งในส่วน ของความถูกต้องตามลวดลายต้นแบบและความสามารถในการทำซ้ำ

5.2 ข้อเสนอแนะ

ระบบการทำโมดูเลชันของความเข้มแสงบนระนาบภาพที่ถูกพัฒนาขึ้นสามารถนำใช้ในการ สร้างลวดลายสำหรับสร้างแม่พิมพ์เกรตติงได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ในการสร้างลวดลายอื่น ๆ ที่มีขนาดในระดับไมรอนได้อย่างหลากหลาย เช่น การสร้างช่องทางไหลจุลภาคในการตรวจวัด สารที่มีปริมาณในระดับไมโครลิตรหรือลวดลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น รวมถึงการเลือกใช้ สารไวแสงในกระบวนการโฟโตลิโทกราฟีชนิดอื่น ๆ โดยใช้สารไวแสงที่สามารถสร้างลวดลายที่มี ขนาดเล็กมาก ๆ ทำให้สามารถสร้างลวดลายที่มีขนาดเล็กลงได้

ในส่วนของการศึกษาประสิทธิภาพของการตรวจวัดของการใช้พีดีเอ็มเอสแบบเกรตติง โดย ศึกษาช่วงของเกรตติงที่กว้างขึ้นหรือมีขนาดคาบที่เล็กลงเพื่อหาปรากฏการณ์ที่น่าสนใจที่สามารถ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดได้รวมถึงต่อยอดในส่วนของทำการทดลองจริงเพื่อศึกษาผลและ เปรียบเทียบกับผลที่ทำการจำลองเชิงทฤษฎี

บรรณานุกรม

มนต์ศักดิ์ พิมสาร.(2564). *ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์*. สืบค้นจาก

http://eng.sut.ac.th/me/box/2_54/435301/IntroductionFEM.pdf

- Abazari, A. M., Safavi, S. M., Rezazadeh, G., & Villanueva, L. G. (2015). Modelling the Size Effects on the Mechanical Properties of Micro/Nano Structures. *Sensors*, 15(11), 28543-28562.
- Abu-Taha, M., & Jabr, A. (2014). Photoacoustic Detection in the Michelson Interferometer Cavity. *Journal of Modern Physics*, 05. doi:10.4236/jmp.2014.59086
- Ahmed, R., Aoni, R. A., Yetisen, A., Salem, M., Yun, S.-H., & Butt, H. (2016). Optical Microring Resonator Based Corrosion Sensing. RSC Advances, 6, 56127–56133. doi:10.1039/c6ra11538a
- Al-Hadeethi, Y., Al-Mujtabi, A., Al-Marzouki, F. M., Mahmoud, A. Y., Umar, A., Abdel-Daiem,
 A. M., & Ansari, M. S. (2021). Investigating the optimum parameters of a negative photoresist to prepare a V-grooved diffraction grating on Si using photolithography and reactive ion etching techniques. *Ceramics International*, 47(8), 10705-10715. doi:https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.12.185
- Ali, M. A., Srivastava, S., Solanki, P., Venu, R., Agrawal, V., Kim, C., . . . Malhotra, B. (2013).
 Highly Efficient Bienzyme Functionalized Nanocomposite-Based Microfluidics
 Biosensor Platform for Biomedical Application. *Scientific Reports, 3*, 2661.
 doi:10.1038/srep02661
- Beard, P. C., Perennes, F., & Mills, T. N. (1999). Transduction mechanisms of the Fabry-Perot polymer film sensing concept for wideband ultrasound detection. *IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 46*(6), 1575-1582. doi:10.1109/58.808883
- Bellah, M., Christensen, S., & Iqbal, S. (2012). Nanostructures for Medical Diagnostics. *Journal of Nanomaterials*, 2012. doi:10.1155/2012/486301
- Bermúdez-Aguirre, D., Mobbs, T., & Barbosa-Cánovas, G. V. (2011). Ultrasound applications in food processing. *In Ultrasound technologies for food and bioprocessing*. New York :Springer.

- Bjorkholm, J. E. (1998). EUV lithography—the successor to optical lithography. *Intel Technology Journal, 3*, 98.
- Chávez, M., Sosa, V., & Tsumura, R. (1985). Speed of sound in saturated pure water. Journal of The Acoustical Society of America - J ACOUST SOC AMER, 77, 420-423. doi:10.1121/1.391861
- COMSOL Inc.(2017). *Structural Mechanics Module User's Guide*. Retrieved from https://doc.comsol.com/5.4/doc/com.comsol.help.sme/StructuralMechanicsModuleUsers Guide.pdf.
- COMSOL Inc. (2018). Acoustics Module User's Guide. Retrieved from https://doc.comsol.com/5.4/doc/com.comsol.help.aco/AcousticsModuleUsersGuide.pdf
- Das, P., & Sandstrom, R. L. (2002). Advances in excimer laser technology for sub-0.25-/spl mu/m lithography. *Proceedings of the IEEE, 90*(10), 1637-1652. doi:10.1109/JPROC.2002.803665
- Deng, Q., Yang, Y., Gao, H., Zhou, Y., He, Y., & Hu, S. (2017). Fabrication of Micro-Optics Elements with Arbitrary Surface Profiles Based on One-Step Maskless Grayscale Lithography. *Micromachines*, 8(10), 314. https://doi.org/10.3390/mi8100314
- Ding, S., Wang, C., Shi, X., Zou, J., Cheng, Q., Zhu, J., . . . Cui, Z. (2019). Directly written photocrosslinked fluorinated polycarbonate photoresist materials for second-order nonlinear optical (NLO) applications. *Journal of Materials Chemistry C*, 7(16), 4667-4672.
- Ding, X.-Y., Ren, Y.-X., & Lu, R.-D. (2013). Maskless Microscopic Lithography through Shaping Ultraviolet Laser with Digital Micro-mirror Device. *Optics and Photonics Journal, Vol.03No.02*, 5. doi:10.4236/opj.2013.32B053
- Dogru, S., Aksoy, B., Bayraktar, H., & Alaca, B. E. (2018). Poisson's ratio of PDMS thin films. *Polymer Testing*, 69, 375-384. doi:https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2018.05.044
- Dong, B., Sun, C., & Zhang, H. F. (2017). Optical Detection of Ultrasound in Photoacoustic Imaging. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 64(1), 4-15. doi:10.1109/TBME.2016.2605451

- Dudley, D., Duncan, W. M., & Slaughter, J. (2003). Emerging digital micromirror device (DMD) applications. *MOEMS display and imaging systems*, 4985, 14-25. doi: 10.1117/12.480761
- Efron, U. (2001). Spatial light modulators: Technology and applications. Spatial Light Modulators: Technology and Applications. Florida: CRC Press.
- Elmesery, H., Mao, H., & Abomohra, A. E.-F. (2019). Applications of Non-destructive Technologies for Agricultural and Food Products Quality Inspection. *Sensors*, 19, 846. doi:10.3390/s19040846
- Eternal Materials Co., L. (2019). *ETERTEC® HT-115 DRY FILM PHOTORESIST*. Retrieved from https://voron.ua/files/pdf/photores/photoresist_film_ht-115.pdf
- Fuller, G. (2017). Future lithography technology. Single Frequency Semiconductor Lasers, 10321, 1032105. doi:10.1117/12.2284084
- Gong, C., & Hogan, T. (2014). CMOS Compatible Fabrication Processes for the Digital Micromirror Device. *IEEE Journal of the Electron Devices Society*, 2(3), 27-32. doi:10.1109/JEDS.2014.2309129
- Guevara, J., Jones, M., Mullner, P., & Jankowski, E. (2020). Development of a Molecular Model for Understanding the Polymer-metal Interface in Solid State Pumps. *The Journal of Computational Science Education*, 11, 12-22. doi:10.22369/issn.2153-4136/11/2/3
- Hale, G. M., & Querry, M. R. (1973). Optical Constants of Water in the 200-nm to 200-μm Wavelength Region. *Applied Optics*, 12(3), 555-563. doi:10.1364/AO.12.000555
- Hassler, C., Boretius, T., & Stieglitz, T. (2011). Polymers for neural implants. *Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics*, 49(1), 18-33.
- Hsu, C.-W., Su, F.-C., Peng, P.-Y., Young, H.-T., Liao, S., & Wang, G.-J. (2016). Highly sensitive non-enzymatic electrochemical glucose biosensor using a photolithography fabricated micro/nano hybrid structured electrode. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 230, 559-565.

- Indutnyi, I., Ushenin, Y., Hegemann, D., Vandenbossche, M., Myn'ko, V., Lukaniuk, M., . . . Khrystosenko, R. (2016). Enhancing Surface Plasmon Resonance Detection Using Nanostructured Au Chips. Nanoscale research letters, 11(1), 535-535. doi:10.1186/s11671-016-1760-7
- Izadifar, Z., Izadifar, Z., Chapman, D., & Babyn, P. (2020). An introduction to high intensity focused ultrasound: systematic review on principles, devices, and clinical applications. *Journal of clinical medicine*, 9(2), 460.
- Jain, K. (2005). U.S. Patent No. 6,870,554. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.
- Kudo, S., Nagase, K., Kubo, S., Sugihara, O., & Nakagawa, M. (2011). Optically Transparent and Refractive Index-Tunable ZrO2/Photopolymer Composites Designed for Ultraviolet Nanoimprinting. *Japanese Journal of Applied Physics*, 50. doi:10.1143/JJAP.50.06GK12
- Kuncova-Kallio, J., & Kallio, P. J. (2006). PDMS and its suitability for analytical microfluidic devices. Paper presented at the 2006 International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society.
- Lan, C., Zhou, W., & Xie, Y. (2018). Detection of Ultrasonic Stress Waves in Structures Using 3D Shaped Optic Fiber Based on a Mach–Zehnder Interferometer. Sensors, 18(4), 1218.
- Learkthanakhachon, S., Pechprasarn, S., & Somekh, M. G. (2018). Optical detection of ultrasound by lateral shearing interference of a transparent PDMS thin film. *Optics Letters*, 43(23), 5797-5800. doi:10.1364/OL.43.005797
- Lee, D.-H. (2010). Optical System with 4 μm Resolution for Maskless Lithography Using Digital Micromirror Device. *Journal of the Optical Society of Korea*, *14*(3), 266-276.
- Li, W.-D., Wu, W., & Stanley Williams, R. (2012). Combined helium ion beam and nanoimprint lithography attains 4 nm half-pitch dense patterns. *Journal of Vacuum Science & Technology B, Nanotechnology and Microelectronics: Materials, Processing, Measurement, and Phenomena, 30*(6), 06F304.

- Li, Z., Ligthart, L., Huang, P., Lu, W., & Van Der Zwan, W. (2008). Trade-off between sensitivity and dynamic range in designing digital radar receivers. Paper presented at the 2008 International Conference on Microwave and Millimeter Wave Technology.
- Lin, Q. (2007). Properties of photoresist polymers. In J.E. Mark, *Physical Properties of Polymers Handbook* (pp. 965-979). New Yoke, NY: Springer.
- Liu, K., Avouris, P., Bucchignano, J., Martel, R., Sun, S., & Michl, J. (2002). Simple fabrication scheme for sub-10 nm electrode gaps using electron-beam lithography. *Applied Physics Letters*, 80(5), 865-867.
- Love, J. C., Wolfe, D. B., Jacobs, H. O., & Whitesides, G. M. (2001). Microscope Projection Photolithography for Rapid Prototyping of Masters with Micron-Scale Features for Use in Soft Lithography. *Langmuir*, 17(19), 6005-6012. doi:10.1021/la010655t
- Ma, G., Wang, Y., Qin, W., Zhou, H., Yan, C., Jiang, J., & Ju, Y. (2020). Optical sensors for power transformer monitoring: A review. Retrieved from https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1049/hve2.12021
- Mack, C. A. (2004). *The Rayleigh depth of focus*. Retrieved from http://w.lithoguru.com/scientist/litho_tutor/Tutor44%20(Feb%2004).pdf
- Madou, M. (2002). Fundamentals of Microfabrication: The Science of Miniaturization (2nd ed.). Florida: CRC Press.
- Magnusson, R. (2017). Light Sources and Optics. In J. C. Lindon, G. E. Tranter, & D. W.
 Koppenaal (Eds.), *Encyclopedia of Spectroscopy and Spectrometry* (3rd ed.) (pp. 586-594). Oxford: Academic Press.
- Manbachi, A., & Cobbold, R. S. C. (2011). Development and Application of Piezoelectric
 Materials for Ultrasound Generation and Detection. *Ultrasound*, 19(4), 187-196.
 doi:10.1258/ult.2011.011027
- Manwar, R., Zafar, M., & Xu, Q. (2021). Signal and Image Processing in Biomedical Photoacoustic Imaging: A Review. *Optics*, 2(1), 1-24.

- Melngailis, J., Mondelli, A., Berry iii, I., & Mohondro, R. (1998). A review of ion projection lithography. Journal of Vacuum Science & Technology B: Microelectronics and Nanometer Structures, 16, 927-957. doi:10.1116/1.590052
- Mohamad, H. (2020). Development of the differential method associated with the Fast Fourier Factorization for the modelization of photonic device: from complex optical diffraction grating to guided integrated optic structure. Retrieved from https://tel.archivesouvertes.fr/tel-03102609
- Mohammed, M. E., & Alhajhoj, M. R. (2019). Importance and applications of ultrasonic technology to improve food quality. Retrieved from https://www.intechopen.com/books/food-processing/importance-and-applications-ofultrasonic-technology-to-improve-food-quality
- Mohammed, Z. H. (2019). *The Fresnel Coefficient of Thin Film Multilayer Using Transfer Matrix Method TMM.* Paper presented at the IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.
- Moharam, M. G., Grann, E. B., Pommet, D. A., & Gaylord, T. K. (1995). Formulation for stable and efficient implementation of the rigorous coupled-wave analysis of binary gratings. *Journal of the Optical Society of America A*, 12(5), 1068-1076. doi:10.1364/JOSAA.12.001068
- Nakamura, K. (2014). *Photopolymers: Photoresist materials, processes, and applications*. Florida: CRC Press.
- Nivedita, N., & Papautsky, I. (2013). Continuous separation of blood cells in spiral microfluidic devices. *Biomicrofluidics*, 7(5), 54101-54101. doi:10.1063/1.4819275
- Paltauf, G., Nuster, R., Haltmeier, M., & Burgholzer, P. (2007). Photoacoustic tomography using a Mach-Zehnder interferometer as an acoustic line detector. *Applied Optics*, 46, 3352-3358. doi:10.1364/AO.46.003352

- Pechprasarn, S., Learkthanakhachon, S., Zheng, G., Shen, H., Lei, D. Y., & Somekh, M. G. (2016). Grating-coupled Otto configuration for hybridized surface phonon polariton excitation for local refractive index sensitivity enhancement. Optics express, 24(17), 19517-19530.
- Rantanen, N., & Ewing III, R. (1981). Principles of ultrasound application in animals. Veterinary Radiology, 22(5), 196-203.
- Ronse, K. (2006). Optical lithography—a historical perspective. Comptes Rendus Physique, 7(8), 844-857. doi:https://doi.org/10.1016/j.crhy.2006.10.007
- Sangworasil, M., Pechprasarn, S., Learkthanakhachon, S., Ittipornnuson, K., Suvarnaphaet, P., & Albutt, N. (2016, 7-9 Dec. 2016). *Investigation on feasibility of using surface plasmons resonance (SPR) sensor for ultrasonic detection: A novel optical detection of ultrasonic waves.* Paper presented at the 2016 9th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON).
- Sasivimolkul, S., Pechprasarn, S., & Somekh, M. (2021). Analysis of Open Grating-Based Fabry– Pérot Resonance Structures With Potential Applications for Ultrasensitive Refractive Index Sensing. *IEEE Sensors Journal*, PP, 1-1. doi:10.1109/JSEN.2021.3063136
- Schneider, F., Draheim, J., Kamberger, R., & Wallrabe, U. (2009). Process and material properties of polydimethylsiloxane (PDMS) for Optical MEMS. Sensors and Actuators A: *Physical*, 151(2), 95-99. doi:https://doi.org/10.1016/j.sna.2009.01.026
- Seo, J., & Kim, Y.-s. (2017). Ultrasound imaging and beyond: recent advances in medical ultrasound. *Biomedical engineering letters*, 7(2), 57-58.
- Sheu, T., Chiang, M. H., & Su, S. (1998). Fabrication of intermediate mask for deep x-ray lithography. *Microsystem Technologies*, 4(2), 74-76. doi:10.1007/s005420050099
- Smith, B. W. (2014). 1 Optical projection lithography. In M. Feldman (Ed.), Nanolithography (pp. 1-41): Woodhead Publishing.
- Strohm, E. M., Moore, M. J., & Kolios, M. C. (2016). High resolution ultrasound and photoacoustic imaging of single cells. *Photoacoustics*, 4(1), 36-42.

- Takano, T., Iwai-Takano, M., Tsuboko, Y., Shiraishi, Y., Yambe, T., Igarashi, T., & Yokoyama,
 H. (2021). Reflected wave intensity increases based on aortic diameter after
 endovascular aortic therapy in a goat model. Scientific Reports, 11. doi:10.1038/s41598-020-80920-y
- Thomson, L. F., Willson, C.G., & Bowden, M.J. (1983). *Introduction to Microlithography*. Washington DC: American Chemical Society.
- Vandergriff, L. J., & McLean, V. (2008). Nature and properties of light. in C. Roychoudhuri, Fundamentals of Phonetics. doi: 10.1117/3.784938
- Victor, A., Ribeiro, J., & Araújo, F. F. (2019). Study of PDMS characterization and its applications in biomedicine: A review. *Journal of Mechanical Engineering and Biomechanics*, 4(1), 1-9.
- Wang, J., Wang, M., Xu, J., Peng, L., Yang, M., Xia, M., & Jiang, D. (2014). Underwater blast wave pressure sensor based on polymer film fiber Fabry-Perot cavity. *Applied Optics*, 53(28), 6494-6502. doi:10.1364/AO.53.006494
- Wang, L. V., & Yao, J. (2016). A practical guide to photoacoustic tomography in the life sciences. *Nature methods*, 13(8), 627.
- Wang, S.-F., Chiu, M.-H., Chen, W.-W., Kao, F.-H., & Chang, R.-S. (2009). Small-displacement sensing system based on multiple total internal reflections in heterodyne interferometry. *Applied Optics*, 48(13), 2566-2573, doi:10.1364/AO.48.002566
- Wells, P. N. (2006). Ultrasound imaging. Physics in Medicine & Biology, 51(13), R83.
- Wiese, N. (2019). Coupling phenomena and scalability of CoFeB/Ru/CoFeB sandwiches. Retrieved from https://core.ac.uk/reader/15971620
- Wissmeyer, G., Pleitez, M. A., Rosenthal, A., & Ntziachristos, V. (2018). Looking at sound: optoacoustics with all-optical ultrasound detection. *Light: Science & Applications*, 7(1), 53. doi:10.1038/s41377-018-0036-7
- Wood, A. K. W., & Sehgal, C. M. (2015). A review of low-intensity ultrasound for cancer therapy. Ultrasound in medicine & biology, 41(4), 905-928. doi:10.1016/j.ultrasmedbio.2014.11.019

- Xiong, B., Ren, K., Shu, Y., Chen, Y., Shen, B., & Wu, H. (2014). Recent developments in microfluidics for cell studies. Advanced materials, 26(31), 5525-5532.
- Yang, S., Ündar, A., & Zahn, J. D. (2006). A microfluidic device for continuous, real time blood plasma separation. Lab on a Chip, 6(7), 871-880.
- Yao, J., Wang, L., Yang, J.-M., Maslov, K. I., Wong, T. T., Li, L., . . . Wang, L. V. (2015). Highspeed label-free functional photoacoustic microscopy of mouse brain in action. Nature methods, 12(5), 407-410.
- Yoon, W.-J., Lee, K. M., Evans, D. R., McConney, M. E., Kim, D.-Y., & Jeong, K.-U. (2019). Giant surfactants for the construction of automatic liquid crystal alignment layers. *Journal of Materials Chemistry C*, 7(28), 8500-8514. doi:10.1039/c9tc00422j
- Zanin, M., Atiya, N., Basílio, J., Baumach, J., Benis, A., Behera, C., . . . Schmidt, H. (2020). An Early Stage Researcher's Primer on Systems Medicine Terminology. *Expert Systems* with Applications. doi:10.1089/nsm.2020.0003
- Zhang, M., & Songjing, L. (2018). Low-cost and facile implementation of microfluidic colourchanging devices using dry film photoresist-based moulds. *Journal of Experimental Nanoscience*, 13, 220-229. doi:10.1080/17458080.2018.1509382

วิวัต_{ย 7}ลัยรังสิต Rangsit

ภาคผนวก ก

สิทธิบัตร

กล้องจุลทรรศน์สำหรับการฉายภาพในระบบต้นแบบโฟโตลิโทกราฟีแบบไม่ใช่ มาส์กแสงโดยอาศัยอุปกรณ์กระจกไมครอนดิจิทัลเพื่อสร้างลวดลายในระดับไมครอน



รายละเอียดการประดิษฐ์

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์

กล้องจุลทรรศน์ฉายภาพในระบบโฟโตลิโทกราฟีแบบไม่ใช้มาส์กแสงโดยอาศัยอุปกรณ์ กระจกดิจิตัลระดับไมโครสำหรับสร้างลวดลายบนวัสดุ

สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์

จุลทรรศนศาสตร์ (ฟิสิกส์), แสงและทัศนูปกรณ์, โฟโตลิโทกราฟี, การพิมพ์ลายวงจร อิเล็กทรอนิกส์

ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง

ในอุตสาหรรมการผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น แผงวงจร รวม ไอซีหรือทรานซิสเตอร์ รวมไปถึงถวดลายบนไมโครชิปในเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร์ อาศัย กระบวนการผลิตที่เรียกว่า โฟโตลิโทกราฟี (Photolithography) เป็นกระบวนการพิมพ์รูปแบบหรือ สร้างลวดลายวงจรที่ต้องการลงบนแผ่นรองรับเพื่อให้เกิดลวดลายต่างๆ โดยการใช้แสงในช่วงกวาม ยาวคลื่นแสงอัลตราไวโอเลตบนวัสดแผ่นรองรับ กระบวนการดังกล่าว จะมีลักษณะเหมือนการ แกะสลักลงบนผิวของวัสดุรองรับที่เป็นของแข็ง โดยทั่วไปในอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นวงจร วัสดุ แผ่นรองรับที่มักจะถูกนำมาสร้างถวดถายผลิตจากแผ่นโลหะกึ่งตัวนำบางจะใช้ ซิลิกอนที่นำไปผ่าน กระบวนการตัดขวางให้เป็นแผ่นบางเคลือบด้วยออกไซด์เพื่อให้พื้นผิวของโลหะกึ่งตัวนำมี คุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า แล้วนำมาเคลือบด้วยสาร ไวแสงซึ่งสามารถทำปฏิกิริยากับแสงในช่วง ้ความยาวคลื่นรังสีอัลตราไวโอเลต ส่งผลให้สารไวแสงเกิดการเปลี่ยนแปลงของพันธะเคมีและการ เรียงตัวโมเลกุล สารไวแสงนั้น แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ สารไวแสงชนิดบวก (Positive photoresist) และสารไวแสงชนิคลบ (Negative photoresist) กรณีสารไวแสงชนิคบวก เมื่อผ่านการฉายค้วยแสง ในช่วงรังสีอัลตราไวโอเลต และนำมาให้ความร้อนโมเลกุลจะสลายหายไป ส่วนกรณีสารไวแสง ้ชนิดลบเมื่อผ่านการฉายแสงและให้ความร้อนโมเลกุลจะจับตัวกันแน่นไม่สามารถล้างออกด้วยน้ำยา ้ถ้างเคมี (Develop solution) เนื่องคุณสมบัติคังกล่าวของสารไวแสง แสงในช่วงรังสีอัลตราไวโอเลต ที่ฉายผ่านแผ่นบางๆ ที่มีลักษณะเป็นแผ่นทึบและถูกเจาะรูตามลวดลายที่ต้องการ เรียกว่า มาส์กฉาย แสง (Photomask) แสงจะสามารถผ่านลวคลายที่เป็นช่องให้แสงผ่านเท่านั้น เมื่อเอาวัสคุแผ่นรองรับ มารับแสงที่ฉายผ่านมาส์กฉายแสง หลังจากการฉายแสงจึงนำไปให้ความร้อนและล้างค้วยน้ำยาล้าง ้เคมีจะทำให้เกิดถวดถายวงจรตามที่ต้องการ ที่แสงฉายผ่านช่องของมาส์กฉายแสงถงบนวัสดุแผ่น

รองรับและขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสารไวแสงที่ใช้ ถึงแม้ว่ากระบวนการโฟโตลิโทกราฟีจะเป็น กระบวนการที่ได้รับความนิยมในวงการอุตสาหกรรมการผลิตลวคลายวงจรต่างๆ แต่ยังมีข้อจำกัด ในเรื่องของความยืดหยุ่นในการสร้างลวดลายใหม่ๆ และด้นทุนการผลิต เนื่องจากในการสร้าง ลวดลายต้องมีการผลิตมาส์กฉายแสงของลวดลายนั้นๆ ทุกครั้ง ผู้ประดิษฐ์จึงออกแบบและสร้าง กล้องจุลทรรศน์สำหรับการฉายภาพในระบบของโฟโตลิโทกราฟี โดยอาศัยอุปกรณ์กระจกคิจิตัล ระดับไมโกร (Digital micromirror device) ซึ่งเป็นชิปขนาดเล็กที่ประกอบด้วยกระจกอลูมิเนียม ขนาดเล็กระดับไมโกรเรียงกันเป็นอาร์เรย์ 2 มิติหรือ พิกเซล (Pixel) ซึ่งเป็นระบบเชิงกลไฟฟ้า สามารถถูกควบคุมการทำงานของกระจกให้หมุนปรับเปลี่ยนองศา และ ควบคุมการเปิด-ปิด เพื่อการ ฉายภาพหรือลวดลายด่างๆ ผ่านการควบคุมของโปรแกรมทางคณิตศาสตร์บนคอมพิวเตอร์ สำหรับ การจัดเรียงระบบของกล้องจุลทรรศน์ที่ผู้ประดิษฐ์ออกแบบอาศัยหลักการการเรียงระบบเลนส์แบบ โกเลอร์ (Köhler illumination) เพื่อให้ลวดลายแสงที่ควบคุมผ่านอุปกรณ์กระจกดิจิตัลระดับไม โครฉายตกกระทบไปยังวัสดุแผ่นรองรับในระบบโฟโตลิโทกราฟีโดยไม่ต้องใช้มาส์ก และสามารถ สร้างลวดลายที่มีขนาดระดับไมโคร และมีระบบควบคุมตำแหน่งที่ถูกต้องในการพิมพ์ลวดลายผ่าน สายตาแบบระบบของกล้องจุลทรรศน์

ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์

ผู้ประดิษฐ์ออกแบบกล้องจุลทรรสน์สำหรับการฉายภาพในระบบโฟโตลิโทกราฟีแบบไม่ ใช้มาส์กแสงโดยอาศัยอุปกรณ์กระจกดิจิตัลระดับไมโครเพื่อสร้างลวดลายบนวัสดุรองรับ และเพื่อ เป็นอุปกรณ์ฉายภาพแทนการใช้มาส์กที่ต้องผลิตใหม่เมื่อออกแบบฉวดลายใหม่ และช่วยลดค้นทุน การผลิตส่วนของมาส์กในอุตสาหกรรม ในระบบประกอบด้วย ส่วนควบคุมการฉายภาพที่ได้จาก อุปกรณ์กระจกดิจิตัลระดับไมโครไปยังวัสดุแผ่นรองรับอาศัยการจัดเรียงระบบเชิงแสงแบบกล้อง จุลทรรสน์แบบโคเลอร์ฉายแสงขนานลงไปบนอุปกรณ์กระจกดิจิตัลระดับไมโคร ในการจัดเรียงเชิง แสงแบบโคเลอร์ ใช้หลอดแสงจันทร์ (Mercury Lamp) ที่ให้ความยาวคลื่นของแสงในช่วงรังสี อัลตราไวโอเลตและช่วงรังสีที่ตาสามารถมองเห็น ให้แสงที่มีกำลังแสงสูง ซึ่งเมื่อแสงจาก แหล่งกำเนิดผ่านระบบฉายแสงแบบโคเลอร์จะทำให้เป็นแสงขนาน และใช้ไดอะแฟรมในการปรับ ขนาดหน้าแสงให้มีขนาดเหมาะสมไปตกกระทบยังอุปกรณ์กระจกดิจิตัลระดับไมโคร ที่มีลักษณะ เป็นกระจกทำหน้าที่เป็นหน้าจอขนาดเล็ก หรือ พิกเซล ขนาด 5 – 10 ไมโครเมตร โดยแต่ละพิกเซล สามารถเลือกปรับมุมได้ จึงใช้ในการควบคุมและเลือกช่วงของความยาวกลิ่นของแสงที่ด้องการฉาย ใปยังวัสดุรองรับ การควบคุมการทำงานมุมของกระจกทำได้ด้วยการเปิด – ปิดพิกเซลผ่านโปรแกรม คำนวนทางกณิตศาสตร์บนคอมพิวเตอร์ ใช้เลนส์ไกล้วัตถุในการปรับขนาดของภาพหรือลวดลายที่ ด้องการฉายจากอุปกรณ์กระจกดิจิตัลระดับไมโครให้มีขนาดเล็กลงหรือใช้ขยายภาพให้เหมาะสมตก ลงบนวัสดุแผ่นรองรับ ใช้ตัวแยกลำแสงในการสะท้อนภาพจากเลนส์ใกล้วัตถุเข้ามายังเซนเซอร์รับ ภาพ เพื่อใช้ในการหาตำแหน่งในการพิมพ์ลวดลายที่ถูกต้อง ซึ่งสามารถสังเกตได้ผ่านคอมพิวเตอร์ เมื่อนำวัสดุแผ่นรองรับที่ถูกเคลือบด้วยสารไวแสงมารองรับการฉายลวดลายด้วยระบบกล้อง จุลทรรศน์นี้ และนำไปผ่านความร้อนหรือการล้างด้วยน้ำยาล้างสารเคมีจะทำให้ได้ลวดลายแกะสลัก ที่มีขนาดในระดับไมโคร

คำอธิบายรูปเขียนโดยย่อ

รูปที่ 1 แสดงส่วนประกอบและการจัดเรียงแสงของระบบกล้องจุลทรรศน์สำหรับการฉาย ภาพในระบบโฟโตลิโทกราฟีแบบไม่ใช้มาส์กแสงโดยอาศัยอุปกรณ์กระจกดิจิตัลระดับไมโคร

รูปที่ 2 แสดงการควบคุมการฉายภาพด้วยแสงจากกล้องจุลทรรศน์ผ่านโปรแกรมคำนวน ทางคณิตศาสตร์บนคอมพิวเตอร์

รูปที่ 3 แผนภาพหลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์สำหรับการฉายภาพในระบบโฟโตลิ โทกราฟีแบบไม่ใช้มาส์กแสงโดยอาศัยอุปกรณ์กระจกดิจิตัลระดับไมโกร

รูปที่ 4 แสดงถึงขั้นตอนที่ 1 ของวิธีการใช้หลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์สำหรับการ ฉายภาพในระบบโฟโตลิโทกราฟีแบบไม่ใช้มาส์กแสงโดยอาศัยอุปกรณ์กระจกดิจิตัลระดับไมโคร

รูปที่ 5 แสดงการทำงานของอุปกรณ์กระจกดิจิตัลระดับไมโครและการควบคุมแสงสะท้อน ออกมาจากอุปกรณ์ให้มีลวดลายตามต้องการ

รูปที่ 6 แสดงถึงขั้นตอนที่ 2 การวางวัสดุแผ่นรองรับที่ผ่านการเกลือบด้วยสาร ไวแสงบน ดำแหน่งที่ต้องการฉายภาพผ่าน

รูปที่ 7 แสดงถึงขั้นตอนที่ 4 การฉายภาพจากอุปกรณ์กระจกคิจิตัลระดับไมโครผ่านเลนส์ ใกล้วัตถุไปยังวัสดุแผ่นรองรับ

รูปที่ 8 แสดงผลการสร้างลวคลายด้วยกล้องจุลทรรศน์สำหรับการฉายภาพในระบบโฟโตลิ โทกราฟีแบบไม่ใช้มาส์กแสงโดยอาศัยอุปกรณ์กระจกดิจิตัลระดับไมโกร

การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์

จากรูปที่ 1 กล้องจุลทรรศน์สำหรับการฉายภาพในระบบโฟโตลิโทกราฟีแบบไม่ใช้มาส์ก แสงโดยอาศัยอุปกรณ์กระจกดิจิตัลระดับไมโกร เพื่อสร้างลวดลายที่มีขนาดในระดับไมครอน มีการ เรียงชุดแสง ซึ่งประกอบไปด้วยหลอดไฟ (1) เป็นแหล่งกำเนิดแสงให้กับอุปกรณ์ ซึ่งสามารถให้แสง ในช่วงความยาวกลื่นรังสีอัลตราไวโอเลต ความยาวคลื่น 285 – 400 นาโนเมตร และแสงในช่วงที่ตา มองเห็น ความยาวกลื่น 400 – 700 นาโนเมตร เลนส์กอนเดนเซอร์ (2) ทำหน้าที่เปลี่ยนแสงที่มีหน้า คลื่นแสงไม่เท่ากันให้มีหน้ากลื่นแสงที่เท่ากันทุกจุด เข้าสู่ไดอะแฟรม (3) สำหรับปรับขนาดลำแสง ที่มาจากเลนส์กอนเดนเซอร์ (2) ให้มีขนาดลำแสงเหมาะสมพอดีกับขนาดของชิปอุปกรณ์กระจกดิ จิตัลระดับไมโคร (5) เมื่อฉายผ่านแผ่นกรองแสง (4) ซึ่งมีหน้าที่เลือกกรองแสงที่มีความยาวกลื่น ในช่วงรังสีอัลตราไวโอเลตให้ผ่านไปยังอุปกรณ์กระจกดิจิตัลระดับไมโคร (5) ที่ถูกควบคุมด้วย โปรแกรมกำนวณทางกณิตศาตร์ผ่านคอมพิวเตอร์(14) ในการสร้างลวดลายผ่านการเปิด-ปิดพิกเซล ภาพที่ต้องการสร้างลงบนวัสดุแผ่นรองรับจะถูกกระจกขนาดเล็กบนอุปกรณ์กระจกดิจิตัลระดับไม โคร(5) สะท้อนไปยังถู่เลนส์(6)(7) เพื่อปรับขนาดให้พอดีกับเลนส์ใกล้วัตถุ(10)ก่อนถูกส่งไปยังตัว แยกแสง(8) หลังจากผ่านตัวแยกแสงภาพจะถูกส่งไปยังเลนส์หลอด(9) และเลนส์ใกล้วัตถุน์ กอนลำดับ ภาพที่เข้าสู่เลนส์ใกล้วัตถุ(10) จะถูกลดขนาดตามกำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุนั้น ๆ ก่อนลายลงบนแผ่นรองรับที่วางอยู่บนแท่นวางแผ่นรองรับ(11) ส่วนอื่น ๆ ได้แก่ เลนส์นูน(12) และ เซนเซอร์รับภาพ(13) ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์(14) ผ่านสายนำส่งข้อมูลเชื่อมต่อผ่านสายยูเอสบี

(USB) (15) จะถูกใช้งานเมื่อต้องการบันทึกภาพบนแผ่นรองรับผ่านโหมดของกล้องจุลทรรศน์ จากรูปที่ 2 กล้องจุลทรรศน์สำหรับการฉายภาพในระบบต้นแบบโฟโตลิโทกราฟีแบบไม่ใช้ มาส์กแสงโดยอาศัยอุปกรณ์กระจกดิจิตัลระดับไมโครเพื่อสร้างลวดลายในระดับไมโคร สามารถ นำมาใช้งานในโหมดของกล้องจุลทรรศน์แสงได้ จะมีการนำแผ่นกรองแสงออก(4) เพื่อให้แสง ในช่วงกวามยาวกลิ้นที่ตามองเห็นสามารถผ่านเข้าไปในระบบได้ ถ้าหากต้องการบันทึกหรือส่องดู ภาพบนแผ่นรองรับโดยไม่ต้องการฉายภาพ ให้เลือกให้กระจกเล็ก ๆ ของอุปกรณ์ดิจิตัลไมโครมิ เลอร์(5) อยู่ในโหมดใช้งานหรือเปิดพิกเซลทั้งหมด หลังจากแสงผ่านคู่เลนส์(6)(7)ปรับขนาด ตัว แยกแสง(8) เลนส์หลอด(9)และเลนส์ใกล้วัตถุ(10) ภาพบนแผ่นรองรับ(11) จะสะท้อนกลับมายัง เลนส์ใกล้วัตถุ(10) ผ่านเลนส์หลอด(11) ไปยังตัวแยกแสง(8) สะท้อนไปยังเลนส์นูนหน้าเซนเซอร์ รับภาพ(12)เพื่อรวมสร้างภาพลงบนเซนเซอร์รับภาพ(13) และภาพที่บันทึกได้จะถูกแสดงบน กอมพิวเตอร์(14) ผ่านการเชื่อมต่อผ่านสายนำส่งข้อมูลเชื่อมต่อผ่านสายยูเอสบี(USB) (15)

จากรูปที่ 3 กล้องจุลทรรศน์สำหรับการฉายภาพในระบบต้นแบบโฟโตลิโทกราฟีแบบไม่ใช้ มาส์กแสงโดยอาศัยอุปกรณ์กระจกดิจิตัลระดับไมโครเพื่อสร้างลวดลายในระดับไมโครหลักการ ทำงานดังที่อธิบายไว้โดยละเอียดในแผนภาพแสดงขั้นตอนการใช้งาน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ จากรูปที่ 4 แสดงขั้นตอนที่ 1 (S1) เป็นการออกแบบถวคถายที่ต้องการพิมพ์ถงบนแผ่น รองรับถงบนโปรแกรมคำนวนทางคณิตศาสตร์บนคอมพิวเตอร์(14) และเชื่อมต่ออุปกรณ์กระจกไม โครดิจิตอถกับคอมพิวเตอร์ผ่านไมโครคอนโทรถเถอร์ที่เชื่อมต่อผ่านสายนำส่งข้อมูลผ่านสายยูเอส บี(USB) (15) ซึ่งเราจะสามารถสร้างถวดถายต่าง ๆ (19)(20) ผ่านการควบคุมการเปิด(17)-ปิด(18) ของแต่ละพิกเซลของอุปกรณ์กระจกดิจิตัถระดับไมโครได้

รูปที่ 5 แสดงการทำงานของอุปกรณ์กระจกดิจิตัลระดับไมโครที่ทำต่อแสงที่ตกกระทบลง บนผิวของกระจก จากการออกแบบลวดลายผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมคำนวณทางคณิตศาสตร์ ในส่วนบริเวณที่เราไม่ต้องการสร้างภาพ(18) กระจกพิกเซลของอุปกรณ์กระจกดิจิตัลระดับไมโคร (5) จะมีการเอียงมุมเพื่อให้แสงที่มาตกกระทบ(21)สะท้อนไปยังทิศทางอื่นหรือออกจากระบบ ออกไป(23) แต่ส่วนที่เราต้องการสร้างภาพ(19) แสงที่ตกกระทบบนอุปกรณ์กระจกดิจิตัลระดับไม โคร(5) จะถูกสะท้อนออกไปยังเลนส์ในระบบต่อไป(22)ทำให้เราสามารถควบคุมแสงที่จะสะท้อน ออกมาจากอุปกรณ์กระจกดิจิตัลระดับไมโครให้มีลวดลายตามที่เราต้องการได้

จากรูปที่ 6 แสดงขั้นตอนที่ 2 (S2) เป็นการนำแผ่นรองรับ(24)ที่ผ่านการเคลือบด้วย สารไวแสงมาวางบนแท่นวางตัวอย่างหรือแผ่นรองรับ (11) และขยับแผ่นรองรับให้อยู่ในตำแหน่งที่ ต้องการสร้างลวดลาย เพื่อทำการฉายภาพจากอุปกรณ์กระจกดิจิตัลระดับไมโครลงบนตำแหน่งที่ ถูกต้องก่อนทำการเปิดแหล่งกำเนิดแสงในระบบเพื่อเริ่มทำการฉายภาพในขั้นตอนที่ 3 (S3) และทำ การฉายภาพในขั้นตอนที่ 4 (S4)

จากรูปที่ 7 แสดงขั้นตอนที่ 4 (S4) กล้องจุลทรรศน์ฉายภาพจากอุปกรณ์กระจกดิจิตัลระดับ ใมโครผ่านเลนส์ใกล้วัตถุ(10) ไปยังแผ่นรองรับ(24) เพื่อเป็นการลดขนาดภาพที่ฉายให้มีขนาดเล็ก ลงในระดับไมโครแล้วนำไปอบร้อนและล้างด้วยน้ำยาเกมีต่อไปในขั้นตอนที่ 5

จากรูปที่ 8 แสดงผลการสร้างลวดลายด้วยกล้องจุลทรรศน์สำหรับการฉายภาพในระบบ ด้นแบบโฟโตลิโทกราฟีแบบไม่ใช้มาส์กแสงโดยอาศัยอุปกรณ์กระจกดิจิตัลระดับไมโครเพื่อสร้าง ลวดลายในระดับไมโครด้วยลวดลายตัวอย่าง(25)และการเปรียบเทียบการเคลือบสารไวแสงประเภท ชนิดบวกและลบ แผ่นรองรับที่ถูกเคลือบด้วยสารไวแสงชนิดบวก(26) บริเวณที่ถูกฉายแสงจะ ละลายหายไปเมื่อถูกความร้อน ส่วนสารไวแสงประเภทลบ(27) บริเวณที่ถูกฉายแสงจะยึดติดแน่น เมื่ออบด้วยความร้อนและไม่สามารถล้างออกได้ด้วยสารเกมี ทำให้บริเวณที่ไม่ถูกฉายแสงสลาย หายไป

้ วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด

้ดังที่ได้เปิดเผยไว้แล้วในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์

ข้อถือสิทธิ

- กล้องจุลทรรสน์สำหรับการฉายภาพในระบบต้นแบบโฟโตลิโทกราฟีแบบไม่ใช้มาส์กแสงโดย อาศัยอุปกรณ์กระจกดิจิตัลระดับไมโครเพื่อสร้างลวดลายในระดับไมโคร อาศัยหลักการจัดเรียง ระบบแสงแบบกล้องจุลทรรสน์ชนิดใช้แสงสะท้อนในการสร้างลวดลายลงบนวัสดุแผ่นรองรับ ในกระบวนการโฟโตลิโทกราฟี ประกอบด้วย แหล่งกำเนิดแสงเป็นหลอดไฟแสงจันทร์ มีความ ยาวคลื่นตั้งแต่ช่วงแสงอัลตราไวโอเลตถึงช่วงที่ตามองเห็น คือ 285 – 700 นาโนเมตร ระบบการ จัดเรียงเลนส์แบบโคเลอร์ ทำหน้าที่รวบรวมแสงที่ไร้ทิสทางจากหลอดไฟ และสร้างลำแสงที่มี ความสม่ำเสมอและมีหน้าคลื่นแสงเท่ากัน ปรับขนาดภาพให้มีความเหมาะสมกับอุปกรณ์ ภายในระบบ ใช้อุปกรณ์กระจกดิจิตัลระดับไมโครในการสร้างลวดลายผ่านการควบคุมด้วย โปรแกรมคำนวนทางคณิตสาสตร์บนคอมพิวเตอร์ และเลนส์ใกล้วัตถุทำหน้าที่ย่อขนาดลวดลาย ที่ต้องการพิมพ์ลงบนวัสดุแผ่นรองรับ และ ขยายภาพเพื่อการมองเห็นผ่านเซนเซอร์รับภาพที่รับ ภาพมาจากตัวแยกแสงและแสดงผลบนกอมพิวเตอร์
- 2. ระบบการสร้างลวดลายด้วยอุปกรณ์กระจกดิจิตัลระดับไมโคร ในระบบของกล้องจุลทรรศน์ สำหรับการฉายภาพในระบบต้นแบบโฟโตลิโทกราฟีแบบไม่ใช้มาส์กแสงโดยอาศัยอุปกรณ์ กระจกดิจิตัลระดับไมโคร เพื่อสร้างลวดลายในระดับไมโคร ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ในการสร้าง ลวดลายผ่านการควบคุมด้วยโปรแกรมคำนวณทางคณิตศาตร์บนคอมพิวเตอร์ ควบคุมการ ทำงานของกระจกขนาดเล็กที่เรียงตัวกันเป็นพิกเซล ควบคุมการปรับเอียงองศา การเปิด-ปิดของ พิกเซล และควบคุมการสร้างภาพที่จะฉายออกไปยังวัสดุแผ่นรองรับ
- 3. ระบบแบ่งแยกแสงออกเป็นสองส่วน ในระบบของกล้องจุลทรรศน์สำหรับการฉายภาพใน ระบบต้นแบบโฟโตลิโทกราฟีแบบไม่ใช้มาสักแสงโดยอาศัยอุปกรณ์กระจกดิจิตัลระดับไมโด รเพื่อสร้างลวดลายในระดับไมโคร ตามข้อถือสิทธิที่ 1 เพื่อให้แสงสามารถส่องผ่านและสะท้อน ออกด้วยมุม 90 องศา เพื่อการสะท้อนภาพที่เกิดจากการมองเห็นผ่านเลนส์ใกล้วัตถุไปยัง เซนเซอร์รับภาพแสดงผลผ่านโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ และเพื่อการส่งผ่านภาพเข้าไปในเลนส์ ใกล้วัตถุและการย่อขนาดของลวดลายที่ถูกสร้างผ่านอุปกรณ์กระจกดิจิตัลระดับไมโคร
- วิธีการใช้งานกล้องจุลทรรศน์สำหรับการฉายภาพในระบบต้นแบบโฟโตลิโทกราฟีแบบไม่ใช้ มาส์กแสงโดยอาศัยอุปกรณ์กระจกดิจิตัลระดับไมโกรเพื่อสร้างลวดลายในระดับไมโคร ตามข้อ ถือสิทธิที่ 1 – 3 มีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ออกแบบและสร้างลวดลายผ่านโปรแกรมคำนวณทางคณิตศาสตร์บนคอมพิวเตอร์ และเชื่อมต่ออุปกรณ์กระจกดิจิตัลระดับไมโครกับคอมพิวเตอร์ และนำภาพเข้าสู่กระบวนการ พิมพ์ลวดลายด้วยกระบวนการโฟโตลิโทกราฟีแบบไม่ใช้มาส์กแสง

ขั้นตอนที่ 2 นำแผ่นรองรับที่ผ่านการเคลือบด้วยสารไวแสงไปวางยังตำแหน่งที่ต้องการฉายภาพ ผ่าน

ขั้นตอนที่ 3 ควบคุมแสงจากแหล่งกำเนิดแสงของระบบกล้องจุลทรรศน์แบบแสงสะท้อนไปยัง เซนเซอร์รับภาพแสดงผลในคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่ 4 ลดขนาดลวดลายที่ได้รับจากอุปกรณ์กระจกดิจิตัลระดับไมโคร โดยการเลือกใช้ เลนส์ใกล้วัตถุกำลังยายต่างๆ และฉายภาพจากอุปกรณ์กระจกดิจิตัลระดับไมโครไปยังวัสดุแผ่น รองรับ เพื่อทำให้เกิดลวดลายที่สามารถพิมพ์ผ่านกล้องจุลทรรศน์สำหรับการฉายภาพที่มีขนาด ในระดับไมโครได้

ขั้นตอนที่ 5 คือ นำแผ่นรองรับไปอบร้อนและล้างด้วยน้ำยาล้างเกมี

ขั้นตอนที่ 6 คือ ไค้แผ่นรองรับที่ถูกแกะสลักตามลวดลายที่ออกแบบ

 กล้องจุลทรรศน์สำหรับการฉายภาพในระบบต้นแบบโฟโตลิโทกราฟีแบบไม่ใช้มาส์กแสงโดย อาศัยอุปกรณ์กระจกดิจิตัลระดับไมโคร การใช้งาน และ ลวดลายที่ออกแบบได้จากระบบ ตาม ข้อถือสิทธิที่ 1 -4
พิศาลัยรับสิด Rongst รูปเขียน







รูปที่ 3



รูปที่ 4



รูปที่ 5







บทสรุปการประดิษฐ์

กล้องจุลทรรสน์สำหรับการฉายภาพในระบบต้นแบบโฟโตลิโทกราฟีแบบไม่ใช้มาส์ก แสงโดยอาศัยอุปกรณ์กระจกดิจิตัลระดับไมโกรเพื่อสร้างลวดลายในระดับไมโกร เป็นอุปกรณ์ที่ ออกแบบโดยอาศัยหลักการของกล้องจุลทรรสน์สองโหมด ได้แก่ ชนิดส่งผ่านแสงเพื่อฉายภาพไป ยังวัสดุแผ่นรองรับและพิมพ์ลวดลาย และชนิดสะท้อนแสงเพื่อใช้แสดงภาพของลวดลายด้วย เซนเซอร์บนคอมพิวเตอร์ทำให้เห็นภาพและระบุตำแหน่งที่ต้องการพิมพ์ได้ ระบบกล้องจุลทรรสน์ ประกอบไปด้วย แหล่งกำเนิดแสงที่ให้แสงในช่วงความยาวคลื่นรังสีอัลตราไวโอเลตและแสง ในช่วงที่ตามองเห็น เลนส์กอนเดนเซอร์แบบโกเลอร์ แผ่นกรองแสง คู่เลนส์ปรับขนาดลำแสง อุปกรณ์กระจกดิจิตัลระดับไมโกร ตัวแยกแสง เลนส์ใกล้วัตถุ และ เซนเซอร์รับภาพ มีหลักการของ การสร้างลวดลายด้วยกระบวนการโฟโตลิโทกราฟีแบบไม่ใช้มาส์กแต่ใช้อุปกรณ์กระจกดิจิตัลระดับ ใมโกรที่ประกอบไปด้วยกระจางนาดเล็กเป็นพิกเซลที่สามารถปรับเอียงมุม เพื่อกำหนดทิสทางและ รูปร่างของแสงที่สะท้อนออกไปได้ ทำให้สามารถควบคุมการสร้างลวดลายฉายผ่านระบบกล้อง จุลทรรสน์ ไปยังบริเวณวัสดุแผ่นรองรับที่เกลือบสารไวแสง เมื่อแสงที่มีลวดลายถูกฉายลงบนวัสดุ แผ่นรองรับที่เกลือบด้วยสารไวแสง นำไปอบร้อนและล้างออกด้วยน้ำยาล้างเกมี เกิดการ เปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารไวแสง ทำให้ได้ลวดลายที่สร้างขึ้น



ภาคผนวก ข สิทธิบัตร

อุปกรณ์แสงสำหรับตรวจวัดกลื่นเสียงความถี่สูงด้วยโครงสร้างเกรตติงระดับไมครอน บนวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นโดยอาศัยกลื่นเสียงที่ผิวและการแทรกสอดแบบ Rangsit Unive

ระ ราวมียาลัยรังสิต เฟอร์บี-พาร์โรท์

รายละเอียดการประดิษฐ์

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์

อุปกรณ์แสงสำหรับตรวจวัดคลื่นเสียงความถี่สูงด้วยโครงสร้างเกรตติงระดับไมครอนบน วัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นโดยอาศัยกลื่นเสียงที่ผิวและการแทรกสอดแบบเฟอร์บี-พาร์โรท์

สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์

การวัดคลื่นเสียงความถี่สูง, เซนเซอร์, ฟิสิกส์, จุลทรรศนศาสตร์ (ฟิสิกส์), แสงและ ทัศนูปกรณ์

ภูมิหลังของศิลปะ หรือ วิทยาการที่เกี่ยวข้อง

ในปัจจุบันการวิจัยในด้านต่าง ๆ เช่น ทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตเซนเซอร์ ได้มีการใช้ กล้องจุลทรรศน์ในการส่องหา ตรวจดูวัตถุหรือสร้างภาพของวัตถุที่มีขนาดเล็กๆ ในระดับไมครอน ซึ่งกล้องจุลทรรศน์มีอยู่หลายประเภท ขึ้นอยู่กับหลักการที่ใช้ในการถ่ายภาพหรือประเภทของ ตัวอย่างที่นำมาถ่ายภาพ เช่น กล้องจุลทรรศน์แบบฟลูออเรสเซนซ์ ที่ใช้หลักการการกระตุ้นสารเรือง แสงให้มีการดูดกลืนพลังงานและปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปของโฟตอน วิธีนี้ถูกนำมาใช้ใน การถ่ายภาพเพื่อตรวจหาเซลล์มะเร็งหรือความผิดปกติของเซลล์ได้ การใช้แสงในการถ่ายภาพเป็น ้วิธีการหนึ่งทางการแพทย์สำหรับชี้วัดตำแหน่งที่ผิดปกติ เมื่อกล้องจุลทรรศน์ได้ถูกพัฒนาให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อถ่ายภาพตัวอย่างลักษณะอื่น กล่าวคือ การถ่ายภาพตัดขวางด้วยโฟโตอะดู สติก (Photoacoustic tomography) [1] เป็นวิธีการถ่ายภาพที่อาศัยการดูดกลืนแสงเปลี่ยนเป็น พลังงานกวามร้อนแล้วทำให้เกิดการขนายตัวทางกวามร้อนและปลดปล่อยออกมาในรูปของกลื่นอะ ้ดูสติก นำไปสร้างเป็นภาพได้ ซึ่งใช้สำหรับการวินิจฉัยทางคลินิก เช่น การถ่ายภาพเส้นเลือดเพื่อให้ ้เห็นการเปลี่ยนแปลงของฮีโมโกลบินเมื่อมีการจับและปล่อยออกซิเจน การถ่ายภาพจากความเปรียบ ้ต่างของค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงของเนื้อเยื่อที่ถ่ายภาพ ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพลักษณะนี้จึง ้สามารถแยกความแตกต่างระหว่างเนื้อเยื่อที่มีความปกติและเนื้อเยื่อที่เป็น โรค ได้ เนื่องจากมีความ ้ละเอียดของภาพสูงกว่ารูปแบบการถ่ายภาพในลักษณะอื่นๆ ในปัจจุบัน จากมุมมองทางคลินิกการ ถ่ายภาพด้วยโฟโตอะดูสติกแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยและประสิทธิผลในการวินิจฉัยบริเวณ เนื้อเยื่อที่เป็นโรค โดยใช้ความเปรียบต่างของเนื้อเยื่อภายนอก แสดงการปลดปล่อยสารหรือยาเข้าสู่ ้ เส้นเลือดไปจนถึงการบำบัคและการติดตามระยะโรคได้ด้วย โดยหลักการถ่ายภาพด้วยกลื่นเสียงนี้ ้ใช้กล้องจุลทรรศน์แบบโฟโตอะคลูติคในการสร้างภาพตัวอย่างจากการตรวจวัดคลื่นเสียงที่เกิดขึ้น ้จากการกระตุ้น ตัวอย่างจะถูกยิ่งด้วยเลเซอร์แบบพัลส์ ความร้อนจากพลังงานของเลเซอร์จะทำให้

้ตัวอย่างเกิดการหดและขยายของตัวอย่าง ทำให้เกิดกลื่นเสียงที่มีความถี่สูง การตรวจวัดปริมาณกลื่น ้เสียงจากบริเวณต่างๆ ของตัวอย่างทำให้สามารถสร้างภาพจากปริมาณคลื่นเสียงที่เกิดขึ้นได้ ซึ่ง ้เทคนิคนี้สามารถถ่ายภาพลงไปได้ถึงความลึกระดับเซนติเมตร จึงนิยมนำมาใช้ในทางการแพทย์เพื่อ ้ถ่ายภาพเนื้อเยื่อที่มีความหนาค่อนข้างสง โดยทั่วไปการตรวจวัดคลื่นเสียง ใช้อปกรณ์วัดที่มีชื่อว่า เพียโซอิเล็กทริค (Piezoelectric detector)[2] เป็นการตรวจวัคการสั่นหรือพลังงานกลที่เกิดขึ้นจาก ้คลื่นเสียง อุปกรณ์นี้สามารถเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดของ ้อปกรณ์ชนิดนี้ในเรื่องของความละเอียดในการวัดและขนาดที่ก่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดของ ้ตัวอย่าง เทคนิกที่นำมาใช้ในการวัดกลื่นเสียงนี้จึงได้มีการถกพัฒนา รวมถึงการนำเทคนิกเชิงแสง ซึ่งเป็นเทคนิคที่ให้ความละเอียดในการวัดสูง เช่น การใช้วงแหวนสั่นพ้องของแสง และ โครงสร้าง เฟอร์บี-พาร์โรท์ที่ประกอบไปด้วยชั้นของโลหะ 2 ชั้นประกบกัน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามเทคนิค ้ต่างๆ ยังคงมีข้อจำกัดในตัวเอง เช่น การใช้วงแหวนสั่นพ้องของแสง ยังคงมีข้อจำกัดในเรื่องของ ช่วงการตอบสนอง โครงสร้างเฟอร์บี-พาร์โรท์ ซึ่งมีลักษณะที่ไม่โปรงใส ทำให้ไม่เหมาะสมในการ ้นำมาใช้ร่วมกับการถ่ายภาพ ผู้ประดิษฐ์จึงนำเสนอการตรวจวัดคลื่นเสียงความถี่สูงโดยการใช้วัสดุที่ ้มีสภาพยึดหยุ่นซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ตามแรงที่มากระทำ และการใช้ ้โครงสร้างเกรตติง การเพิ่มเกรตติงที่มีขนาดในระดับไมครอนเข้าไปในโครงสร้างจะทำให้เกิดคลื่น เสียงบนพื้นผิวของวัสดุที่มีสภาพยึดหยุ่น ทำให้วัสดุยึดหยุ่นมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลง ้ความหนาได้มากขึ้น รวมถึงการเพิ่มเกรตติงยังทำให้เกิดปรากฏการณ์การสั่นพ้องของเฟอร์บี-พาร์ โรท์ ในการตรวจวัดด้วยแสงซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการวัดกลื่นเสียงกวามถี่ดีขึ้นจากวิธีการวัดในรูป ..สนเสียง Rangsit ແบบเดิม วิ_{ทยาลัยรังสิต}

เอกสารอ้างอิง

Xia, J., Yao, J., & Wang, L. V. (2014). Photoacoustic tomography: principles and [1] advances. Electromagnetic waves (Cambridge, Mass.), 147, 1.

[2] Paltauf, G., Hartmair, P., Kovachev, G., & Nuster, R. (2017). Piezoelectric line detector array for photoacoustic tomography. Photoacoustics, 8, 28-36.

้ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์

ผู้ประดิษฐ์ได้ทำการออกแบบอุปกรณ์แสงสำหรับตรวจวัดคลื่นเสียงความถี่สูงด้วย ้โครงสร้างเกรตติงระดับไมครอนบนวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นโดยอาศัยคลื่นเสียงที่ผิวและการแทรก ้สอดแบบเฟอร์บี-พาร์โรท์เพื่อให้ได้อุปกรณ์แสงที่สามารถตรวจวัดคลื่นเสียงความถี่สูงได้อย่างมี

้ประสิทธิภาพ มีสภาพไวในการตรวจวัค และอุปกรณ์แสงที่ออกแบบสร้างขึ้นจากวัสคุที่มีความ ้ยึดหยุ่นและสภาพโปร่งใส ทำให้เหมาะสำหรับนำมาใช้ในการถ่ายภาพ การผลิตเกรตติงบนวัสดุที่มี ้สภาพยึดหยุ่น สามารถทำได้โดยการเคลือบวัสดุที่มีสภาพยึดหยุ่นบนแผ่นกระจกแก้วด้วยการเคลือบ ้ผิวแบบหมุนเหวี่ยง จากนั้นสร้างรูปร่างเกรตติงด้วยกระบวนการซอฟท์ลิโทกราฟี ในกระบวนนี้ ้จะต้องสร้างเกรตติงแม่พิมพ์ขึ้นมาก่อนด้วยกระบวนการโฟโตลิโทรกราฟี เนื่องด้วยเกรตติงที่สร้างมี งนาคเล็กในระดับไมโครเมตร แล้วนำแม่พิมพ์มากคลงบนวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่น นำกระจกที่มี ้โครงสร้างเกรตติงไปติดกับปริซึมและนำเข้าไปต่อกับระบบแสง ที่ประกอบไปด้วยเลเซอร์ที่เป็น แหล่งกำเนิคแสงแบบโคฮีเรนต์และตัวรับภาพ หลังจากนั้นจะใส่ตัวกลางของคลื่นเสียงลงบนเกรต ้ติง หลักการของอุปกรณ์นี้คือ แสงเลเซอร์จะถูกยิ่งเข้าไปยังปริซึม ผ่านไปยังโครงสร้างเกรตติงและ แสงที่ตกกระทบจะตัวสะท้อนกลับมายังเซนเซอร์รับภาพ แสงที่สะท้อนเข้ามาส่เซนเซอร์รับภาพจะ ้เกิดเป็นแถบมืด สลับกับแถบสว่าง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์เดียวกับแทรกสอดแบบเฟอร์บี-พาร์โรท์ ซึ่ง เกิดจากการแทรกสอดกันระหว่างแสงที่สะท้อนออกจากสองรอยต่อ ได้แก่ รอยต่อระหว่างปริซึมกับ วัสดุที่มีสภาพยึดหยุ่นและรอยต่อระหว่างวัสดุที่มีสภาพยึดหยุ่นกับตัวกลางของคลื่นเสียง โดย ้โครงสร้างของเกรตติงเป็นตัวช่วยให้ปรากฏการณ์นี้สามารถมองเห็นได้เนื่องจากการเลี้ยวเบนของ แสงที่ตกกระทบและสะท้อนออกจากเกรตติง หลังจากนั้นจะทำการติดตั้งโพรบสำหรับใช้เป็น แหล่งกำเนิดคลื่นเสียงความถี่สูงให้อยู่เหนือเกรตติง เมื่อปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูงให้ตกกระทบลง บนเกรตติง เกรตติงจะมีลักษณะเหมือนถูกกดและเมื่อคลื่นเสียงความถี่สูงตกกระทบลงบนเกรตติง จะเกิดคลื่นเสียงบนพื้นผิวเกรตติงและเกิดการกระเจิงของคลื่นพื้นผิวทำให้เกรตติงยุบตัวและมีการ เปลี่ยนแปลงความหนาอย่างมากและเมื่อความหนาเกรตติงเปลี่ยนแปลง สัญญาณของแสงที่สะท้อน ออกจากเกรตติงจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้แถบมืดและแถบสว่างที่เกิดขึ้นนั้นเกิดการเลื่อน ตำแหน่ง จากบริเวณที่เคยมืด กึกลายเป็นสว่างเมื่อความหนาเกรตติงเปลี่ยนแปลง ซึ่งการ เปลี่ยนแปลงของความเข้มแสงที่ตรวจวัดได้นั้นสามารถนำมาใช้วัดและแปลงเป็นปริมาณคลื่นเสียง ความถี่สูงได้

คำอธิบายรูปเขียนโดยย่อ

รูปที่ 1 แสดงแผนภาพขั้นตอนการประดิษฐ์

รูปที่ 2 แสดงถึงขั้นตอนที่ 1 ของการประดิษฐ์ การสร้างถวดถายเกรตติงถงบนวัสดุที่มี สภาพยึดหยุ่นด้วยกระบวนการซอฟท์ถิโทกราฟี รูปที่ 3 แสดงระบบและอุปกรณ์แสงสำหรับตรวจวัดคลื่นเสียงความถี่สูงด้วยโครงสร้าง เกรตติงระดับไมครอนบนวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นโดยอาศัยกลื่นเสียงที่ผิวและการแทรกสอดแบบ เฟอร์บี-พาร์โรท์

รูปที่ 4 แสดงการตรวจวัดกลื่นอัตราโซนิกด้วยด้วยโกรงสร้างเกรตติงระดับไมกรอนบน วัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นโดยอาศัยกลื่นเสียงที่ผิวและการแทรกสอดแบบเฟอร์บี-พาร์โรท์ โดยใช้ เซนเซอร์รับภาพเป็นตัวรับความเข้มแสงที่สะท้อนออกมาจากเกรตติงและปริซึมและการ เปลี่ยนแปลงของความเข้มแสงและการเลื่อนตำแหน่งของแถบมืดและแถบสว่างที่เกิดขึ้นจากการ แทรกสอดแบบเฟอร์บี-พาร์โรท์

รูปที่ 5 แสดงการเปลี่ยนแปลงความหนาของเกรตติงที่เกิดจากคลื่นเสียงความถี่สูงที่ทำให้ เกิดการเลื่อนตำแหน่งของแถบมืดและแถบสว่างที่ตกกระทบบนเซนเซอร์รับภาพ

การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์

จากรูปที่ 1 อุปกรณ์แสงสำหรับตรวจวัคคลื่นเสียงกวามถี่สูงด้วยโครงสร้างเกรตติงระดับ ใมครอนบนวัสดุที่มีสภาพยึดหยุ่นโดยอาศัยคลื่นเสียงที่ผิวและการแทรกสอดแบบเฟอร์บี-พาร์โรท์

มีขั้นตอนการประดิษฐ์ดังที่อธิบายไว้โดยละเอียดในแผนภาพแสดงขั้นตอนการประดิษฐ์ ดังนี้ จากรูปที่ 2 แสดงขั้นตอนที่ 1 (S1) การสร้างถวดถายเกรตติงที่มีขนาดในระดับไมครอนลง บนวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่น (1) ที่เคลือบอยู่บนแผ่นกระจกใส (2) โดยใช้วิธีการคลือบแบบใช้แรงหมุน เหวี่ยง การสร้างลวดลายบนวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นจะใช้วิธีที่มีชื่อว่า ซอฟท์ลิโทกราฟี เป็นการใช้ เกรตติงแม่พิมพ์ (3) ที่สร้างขึ้นจากกระบวนการโฟโตลิโทกราฟีกดลงบนวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่น เพื่อให้วัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นมีรูปร่างเป็นเกรตติง (4) ตามที่ต้องการ

จากรูปที่ 3 แสดงขั้นตอนที่ 2 (S2) หลังจากสร้างลวดลายเกรตติงบนวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่น (4) แล้วนำแผ่นกระจกที่มีเกรตดิงไปติดบนปริซึม (5) และนำปริซึมไปประกอบเข้าไประบบแสงที่ ประกอบไปด้วย เลเซอร์ (6) ที่ให้แหล่งกำเนิดแสงแบบโคฮีเรนต์และเซนเซอร์รับภาพ (7) เมื่อฉาย แสงเลเซอร์ (8) ตกกระทบไปยังปริซึม (5) ส่องผ่านไปยังวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นและโครงสร้างเกรต ดิง (4) และแสงสะท้อน (9) ออกมา โดยแสงที่สะท้อนกลับจะเกิดจากรอยต่อระหว่างปริซึมและวัสดุ ที่มีสภาพยืดหยุ่น (10) และรอยต่อระหว่างวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นกับตัวกลางของคลื่นเสียงความถี่สูง (11) แสงที่สะท้อนออกจากทั้งสองรอยต่อนี้เกิดการแทรกสอดกัน เรียกว่าการแทรกสอดแบบเฟอร์ บี-พาร์โรท์ ทำให้เกิดแถบมืด (12) และแถบสว่าง (13) เนื่องจากความแตกต่างระหว่างเฟสของแสงที่ สะท้อนออกมาจากทั้งสองรอยต่อและตกกระทบไปยังเซนเซอร์รับภาพ (7) ที่เชื่อมต่ออยู่กับ กอมพิวเตอร์ผ่านสายยูเอสบี (14) และฉายบนจอกอมพิวเตอร์ (15) จากรูปที่ 4 แสดงขั้นตอนที่ 3 (S3) และขั้นตอนที่ 4 (S4) การวางหัวโพรบแหล่งกำเนิดกลื่น เสียงความถี่สูง (17) ไว้เหนือเกรตติง (4) สำหรับการวัดกลิ่นเสียงความถี่สูง เมื่อกลิ่นเสียงความถี่ (18) สูงตกกระทบลงบนเกรตติงจะทำให้เกรตติงขุบตัวลงอย่างมาก เนื่องจากปรากฏการณ์การเกิด กลื่นเสียงบนพื้นผิวของเกรตติงและการกระเงิงของกลิ่นเสียงบนพื้นผิว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงความ หนาของเกรตดิง เนื่องจากการถูกกดด้วยกลิ่นเสียงความถี่สูงนั้นสามารถตรวจจับได้ด้วยแสงที่ตก กระทบระหว่างรอยต่อระหว่างปริซึมและวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่น (10) และรอยต่อระหว่างวัสดุที่มี สภาพยืดหยุ่นกับตัวกลางของกลิ่นเสียงกวามถี่สูง (11) ซึ่งเมื่อความหนาของวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงทำให้เฟสของแสงที่สะท้อนมาจากรอยต่อระหว่างเกรตดิงและตัวกลางของกลิ่นเสียง ความถี่สูง เกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้แสงที่แทรกสอดกันเกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้แถบมืด (12) และแถบสว่าง (13) เกิดการเลื่อนดำแหน่ง ทำให้จากเดิมบริเวณที่เคยเป็นแถบมืด กลายเป็น แถบสว่าง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเข้มแสงที่เปลี่ยนแปลงทำให้สามารถตรวจวัดกลิ่นเสียงความถี่ สูงที่ตกกระทบลงบนเกรตติงได้

จากรูปที่ 5 แสดงการเปลี่ยนแปลงความหนาของโครงสร้างเกรตติงซึ่งเกิดจากกระทบของ กลื่นเสียงความถี่สูงทำให้แถบมืดและแถบสว่างเปลี่ยนตำแหน่ง จากเดิมก่อนปล่อยคลื่นเสียงความถี่ สูงเกรตติงยังไม่ยุบตัว (4) แสงที่สะท้อนกลับออกมาจากรอยต่อระหว่างปริซึมกับวัสดุที่มีสภาพ ยึดหยุ่น (10) และรอยต่อระหว่างวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นกับตัวกลางของคลื่นเสียงความถี่สูง (11) แทรกสอดกันทำให้เกิดแถบมือแถบสว่างแล้วตกกระทบลงบนเซนเซอร์รับภาพและถูกฉายผ่านหน้า จอกอมพิวเตอร์ เมื่อปล่อยคลื่นเสียงกวามถี่สูง (18) ตกกระทบลงบนเซนเซอร์รับภาพและถูกฉายผ่านหน้า จอกอมพิวเตอร์ เมื่อปล่อยคลื่นเสียงกวามถี่สูง (18) ตกกระทบลงบนเซนเซอร์รับภาพและถูกฉายผ่านหน้า จอกอมพิวเตอร์ เมื่อปล่อยคลื่นเสียงกวามถี่สูง (18) ตกกระทบลงบนเซนเซอร์รับภาพและถูกฉายผ่านหน้า จอกอมพิวเตอร์ เมื่อปล่อยกลื่นเสียงกวามถี่สูง เกลา กวามหนา (19) ทำให้เฟสของแสงที่สะท้อนออกจากรอยต่อระหว่างวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นและ ตัวกลางของคลื่นเสียงความถี่สูง เปลี่ยนแปลง เนื่องจากระยะทางที่แสงเดินทางเปลี่ยนแปลง การ เปลี่ยนแปลงเฟสของแสงดังกล่าวเมื่อสะท้อนออกมาแทรกสอดกับแสงที่สะท้อนจากรอยต่อ ระหว่างปริซึมกับวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่น ทำให้ตำแหน่งของแถบมืดและแถบสว่างเลื่อนจากตำแหน่ง เดิม จากที่ตำแหน่งที่เคยเป็นแถบมืดจะสว่างขึ้นและแถบสว่างจะมืดลง

้ วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด

เหมือนที่ได้บรรยายในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์

ข้อถือสิทธิ

- อุปกรณ์แสงสำหรับตรวจวัคกลื่นเสียงความถี่สูงด้วยโครงสร้างเกรตติงระดับไมครอนบนวัสดุที่ มีสภาพยืดหยุ่นโดยอาศัยคลื่นเสียงที่ผิวและการแทรกสอดแบบเฟอร์บี-พาร์โรท์ อาศัยคุณสมบัติ ของวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่น สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างต่อแรงที่มากระทำได้ง่าย รวมถึงการเกิด คลื่นเสียงบนพื้นผิวของวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นและการกระเจิงของคลื่นเสียงบนพื้นผิว เมื่อคลื่น เสียงความถี่สูงตกกระทบทำให้เกรตติงเกิดการยุบตัวลงอย่างมาก สามารถนำมาใช้เป็นตัวรับรู้ใน การตรวจวัดคลื่นเสียงความถี่สูงได้และมีสภาพไวในการตรวจวัดอย่างมาก
- 2. อุปกรณ์แสงสำหรับตรวจวัดคลื่นเสียงความดี่สูงด้วยโครงสร้างเกรตติงระดับไมครอนบนวัสดุที่ มีสภาพยืดหยุ่นโดยอาศัยคลื่นเสียงที่ผิวและการแทรกสอดแบบเฟอร์บี-พาร์โรท์ ใช้หลักการ ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงความหนาของเกรตติงอาศัยการแทรกสอดแบบเฟอร์บี-พาร์โรท์ โดย การใช้แสงแบบโคยีเรนต์ฉายเข้าไปในปริซึมและผ่านไปยังเกรตติง และวัดความหนาของเกรต ดิงจากการแทรกสอดของแสงที่สะท้อนจากระหว่างรอยต่อปริซึมกับวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นและ รอยต่อระหว่างวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นกับตัวกลางของกลิ่นเสียงความถี่สูง เมื่อปล่อยคลื่นเสียง ความถี่สูงตกกระทบลงบนเกรตติง เกรตติงจะเปลี่ยนแปลงกวามหนาทำให้เฟสของแสงที่ สะท้อนออกจากรอยต่อระหว่างวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นกับตัวกลางของกลิ่นเสียงความถี่สูง เมื่อปล่อยคลื่นเสียง ความถี่สูงตกกระทบลงบนเกรตติง เกรตติงจะเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเฟสของแสงที่ สะท้อนออกจากรอยต่อระหว่างวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นกับตัวกลางของกลิ่นเสียงความถิ่สูง เปลี่ยนแปลงเนื่องจากระยะทางที่แสงเดินทางเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงเฟสของแสงดังกล่าว เมื่อสะท้อนออกมาแทรกสอดกับแสงที่สะท้อนจากรอยต่อระหว่างปริซึมกับ วัสดุที่มีสภาพ ยึดหยุ่น ทำให้ดำแหน่งของแถบมีดและแถบสว่างเลื่อนจากตำแหน่งเดิม จากที่ดำแหน่งที่เกตเป็น แถบมืดจะสว่างขึ้นและแถบที่สว่างจะมีคลง ซึ่งแถบมิดและแถบสว่างที่เกิดขึ้นสามารถถูก ครวจจับไว้ด้วยเซนเซอร์รับภาพและฉายบนจอกอมพิวเตอร์ การตรวจวัดกลิ่นอีตราโซนิกที่ตก กระทบลงบนเกรตดิงสามารถวัดด้วยการเปลี่ยนแปลงความเข้มแสงที่เกิดขึ้นในแต่ละตำแหน่ง ทั้งแถบมืดหรือแถบสว่างที่ตรวจรัดได้ด้วยเซนเซอร์รับภาพ







รูปที่ 3



114





บทสรุปการประดิษฐ์

อุปกรณ์แสงสำหรับตรวจวัดคลื่นเสียงความถี่สูงด้วยโกรงสร้างเกรตติงระดับไมครอนบน วัสดุที่มีสภาพยึดหยุ่นโดยอาศัยกลิ่นเสียงที่ผิวและการแทรกสอดแบบเฟอร์บี-พาร์โรท์ เป็นการ ออกแบบเทคนิคการตรวจวัดคลื่นเสียงความถี่สูงที่มีสภาพไวในการตรวจวัดสูง และสามารถ นำไปใช้จริงในการถ่ายภาพด้วยหลักการกล้องจุลทรรศน์ถ่ายภาพด้วยกลิ่นเสียง โดยโครงสร้างเกรต ดิงระดับไมครอนบนวัสดุที่มีสภาพยึดหยุ่นจะทำหน้าที่เป็นตัวรับรู้กลื่นเสียงความถี่สูง เมื่อกลื่นเสียง เดินทางผ่านตัวกลางและตกกระทบลงบนเกรตติงที่ทำจากวัสดุที่มีสภาพยึดหยุ่นที่สามารถเปลี่ยน รูปร่างได้ตามแรงที่มากระทำ การที่กลื่นเสียงตกกระทบลงบนวัสดุที่มีสภาพยึดหยุ่นที่สามารถเปลี่ยน รูปร่างได้ตามแรงที่มากระทำ การที่กลื่นเสียงตกกระทบลงบนวัสดุที่มีสภาพยึงหยุ่นที่สามารถเปลี่ยน เสียงพื้นผิวและเกิดการกระเจิงกลื่นเสียงพื้นผิวเนื่องจากเกรตดิงทำให้เกรตดิงเกิดการยุบตัวลงอย่าง มาก โดยการเปลี่ยนแปลงความหนาของเกรตติงตรวจจับได้ด้วยหลักการแทรกสอดของแสงแบบ เฟอร์บี-พาร์โรท์ ที่นำมาใช้ในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงความหนาที่อยู่ระหว่างสองรอยต่อที่เกิด การสะท้อนของแสงและเกิดการแทรกสอดกันเกิดเป็นแถบมืดและแถบสว่าง และเมื่อกวามหนาชั้น ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงทำให้ดำแหน่งของแถบมืดและแถบสว่างเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ซึ่งการ ตรวจวัดความเข้มแสงของแสงที่สะท้อนออกจากจะสามารถตรวจจับกลื่นเสียงความถี่สูงได้แม้กลื่น เสียงจะมีแอพลิจูดที่ต่ำมาก

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ ชญาณิศา สุขเกษม วัน เดือน ปีเกิด 3 พฤษภาคม 2539 สถานที่เกิด จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย ประวัติการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, 2560 **ทุนการศึ**กษาและทุนวิจัยที่ได้รับ 1. ทุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM 2. ทุนอุคหนุนจากสำนักงานประสานงานโครงการวิจัย ระหว่างการศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย รังสิต รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2561 4. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย รังสิต รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2562 2 นาวภายาลัยรังสิต ที่อยู่ปัจจุบัน 96/12 หมู่ 9 ตำบล บางนาง อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160

Rď

117